ใดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จในของเหลวสำหรับผลิตไฮโดรเจน

นายกอบชัย จันทร์ศรี

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทกัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE IN LIQUID FOR HYDROGEN PRODUCTION

Mr. Kopchai Jansee

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Nuclear Technology Department of Nuclear Engineering Faculty of Engineering Chulalongkorn University Academic Year 2012 Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ใดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จในของเหลวสำหรับผลิต	
	ไฮโครเจน	
โดย	นายกอบชัย จันทร์ศรี	
สาขาวิชา	นิวเคลียร์เทคโนโลยี	
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	อาจารย์ คร. พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์	
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปุณณชัยยะ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ นเรศร์ จันทน์ขาว)

...... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (อาจารย์ คร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปุณณชัยยะ)

.....กรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อนงค์นาฏ สมหวังธน โรจน์)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ดร. ปวีณา เครือนิล)

กอบชัย จันทร์ศรี: ใดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จในของเหลวสำหรับผลิตไฮโดรเจน. (DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE IN LIQUID FOR HYDROGEN PRODUCTION) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: อ.ดร. พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์, อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ผศ. สุวิทย์ ปุณณชัยยะ, 97 หน้า.

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการพลาสมารีฟอร์มมิงจากไอ เอทานอล โดยอาศัยกวามร้อนในการเปลี่ยนเอทานอลซึ่งมีสภาวะเป็นของเหลวภายใต้อุณหภูมิห้อง ให้กลายเป็นไอ และส่งผ่านบริเวณดิสชาร์จของชุดกำเนิดพลาสมาที่มีการจ่ายไฟฟ้าแรงสูงย่าน ความถี่ต่ำ ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงที่พัฒนาขึ้นให้สามารถปรับเปลี่ยนความถี่และแรงดันไฟฟ้า ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสสูงสุดได้ 10 kV และ 2.5 mA ตามลำดับ และ ตอบสนองได้ดีในย่านความถี่ 300-500 Hz เมื่อเอทานอลในสภาวะไอเกลื่อนผ่านบริเวณดิสชาร์จ จะแตกตัวและทำปฏิกิริยากับก๊าซอื่น ๆ ในอากาศและให้ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซ มีเทน และก๊าซการ์บอนมอนออกไซด์ ซึ่งจากการทดลองพบว่าสำหรับระบบที่ได้สร้างขึ้น แรงดันไฟฟ้าและความถิ่ไฟฟ้าที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน คือ 10 kV และ 350 Hz ตามลำดับ อัตราการผลิตเข้าสู่สภาวะคงที่หลังจากเริ่มผลิต 80 นาที นอกจากนี้ ได้ทำการทดลอง เพื่อหาความเข้มข้นของเอทานอลที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน พบว่า ที่ความเข้มข้นของ เอทานอล 25%, 50% และ 75% มีอัตราการผลิตไฮโดรเจนใกล้เคียงกันอยู่ประมาณ 1 µmol/ml/min ซึ่งมากกว่าอัตราการผลิตเมื่อใช้ความเข้มข้นของเอทานอลที่ 99.8% โดยปริมาตร อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น ปริมาณของไอน้ำที่ผสมกับเอทานอลจึงมีผลต่ออัตราการผลิตด้วยเช่นกัน

ภาควิชา วิศวกรรมนิวเคลียร์	ถายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา <u>นิวเกลียร์เทคโนโลยี</u>	ลายมือชื่อ อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ปีการศึกษา <u>2555</u>	ลายมือชื่อ อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

5270214021: MAJOR NUCLEAR TECHNOLOGY KEYWORDS : HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY, HYDROGEN PRODUCTION, PLASMA REFORMING, DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE

KOPCHAI JANSEE: DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE IN LIQUILD FOR HYDROGEN PRODUCTION. ADVISOR: PHONGPHAETH PENGVANICH, Ph.D., CO-ADVISOR: ASST.PROF.SUVIT PUNNACHAIYA, 97 pp.

This research focuses on the development of a hydrogen production system based on the plasma reforming method of biological ethanol in gaseous state. Ethanol, which is in liquid state at room temperature, is changed into its gaseous states by heating, and subsequently flowed through the discharge area of a plasma reactor powered by a low-frequency highvoltage power supply in continuous mode. The power supply has been designed for the maximum voltage and current of 10 kV and 2.5 mA respectively, with the operated frequency ranged between 300 and 500 kHz. The gaseous ethanol is ionized, reacts with other gases in the air, and produces several gaseous products including H_2 , CH_4 and CO. An applied voltage of 10 kV and an operated frequency of 350 Hz are found to be most suited for hydrogen production using our system. Steady rate of production is reached after 80 minutes. Effect of ethanol concentration on the hydrogen production was also investigated. At 25%, 50%, and 75% concentration by volume the rate of production was found to be very close to each other (1 μ mol/ml/min), and considerably higher than at 99.8% concentration.

Department : Nuclear Engineering Field of Study : Nuclear Technology Academic Year : 2012

Student's Signature
Advisor's Signature
Co-advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ อ.คร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ให้ความรู้ ทางด้านพลาสมาฟิสิกส์และทฤษฎีทางด้านพลาสมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปุณณชัยยะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือกล ตลอดจนหลักการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดงานวิจัยและ อ. จเด็จ เย็นใจ ที่ให้กำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทกนิกต่างๆ

ขอขอบคุณ ศ.คร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ และนายเจนวิทย์ พรหมประสิทธิ์ ศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางค้านกาตาไลซิสและวิศวกรรมปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ภากวิชาวิศวกรรมเกมี กณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กอยช่วยเหลือและอำนวยกวามสะดวกในการใช้เกรื่อง ก๊าซโกรมาโตรกราฟี (GC) ตลอดจนแนะนำการใช้เกรื่องมืออย่างถูกต้อง

ขอขอบคุณ น.ส.ลีดา มิตรายน นายพงศกร กองผัด นายเจตรจันทร์ จันทร์นุ้ย น.ส.วรีภรณ์ รัตนิสสัย คุณบัญชา อุนพานิช ตลอดจนบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และ อุปกรณ์นิวเคลียร์ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ คุณศุภศิลป์ ดาราสูรย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ศูนย์ เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยสนับสนุนการสร้าง เครื่องมือวิจัยต่างๆ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก "ทุนอุคหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต" (CU.GRADUATE SCHOOL THESIS GRANT) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้วิทยานิพนธ์สำเร็จไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระกุณ บิดา มารดา และพี่ชายที่คอยเป็นกำลังใจและให้การ สนับสนุนในทุกๆ ด้านด้วยความรักและห่วงใย จนกระทั่งการทำวิทยานิพนธ์สำเร็จการศึกษาใน หลักสูตรนี้ได้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	R
สารบัญตาราง	ណ
สารบัญภาพ	ល្ង
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.4 วิธีดำเนินการวิจัย	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 กระบวนการผลิตก๊าซไฮโครเจน	5
2.2 ทฤษฎีทางค้านพลาสมา	10
2.3 ใคอิเล็กทริกแบริเออร์คิสชาร์จในบรรยากาศ	14
2.4 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสคุไคอิเล็กทริก	16
2.5 คุณสมบัติพื้นฐานของเอทานอล	18
2.6 ก๊าซโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography)	21
2.7 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี	26
3. การออกแบบเครื่องมือวิจัย	28
3.1 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำถื่	29
3.2 การออกแบบชุคกำเนิคพลาสมาแบบไคอิเล็กทริกแบริเออร์คิสชาร์จ	34
4. วิธีดำเนินงานและผลการวิจัย	38
4.1 การทคสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำ	38
4.1.1 ทคสอบการทำงานแบบเปิควงจร	39

บทที่	หน้า
4.1.2 ทคสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลคตัวต้านทาน 10 MΩ ขนาค 10 W	39
4.1.3 ทคสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลคที่เป็นชุคกำเนิคพลาสมาแบบแบริ	
เออร์ดิสชาร์จที่มีโกรงสร้างเป็นแผ่นคู่ขนาน	40
4.1.4 ทคสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลคที่เป็นชุคกำเนิคพลาสมาแบบแบริ	
เออร์ดิสชาร์จที่มีโครงสร้างเป็นแบบทรงกระบอก	41
4.1.5 ทคสอบการใช้กำลังไฟฟ้าชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วคนโท	44
4.2 การทคสอบการกำเนิดพลาสมา	45
4.3 การทดสอบการผลิตก้ำซไฮโดรเจน	48
4.3.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	48
4.3.2 การเกีบก๊าซตัวอย่าง	51
4.3.3 การผลิตไฮโครเจนด้วยพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะ	
ของเหลว	51
4.3.4 การผลิตไฮโครเจนค้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงของเอทานอลในสถานะ	
ถ้าซ	53
4.4 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตก๊าซไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิง	55
4.4.1 ขนาดของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซ	
ไฮโครเจน	55
4.3.2 ช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสม (Sampling time)	60
4.3.3 ผลของความเข้มข้น โคยปริมาตรของเอทานอลที่เหมาะสม	63
5. สรุปวิจารณ์ผลการวิจัยและ ข้อเสนอแนะ	68
5.1 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย	68
5.2 ข้อเสนอแนะ	69
รายการอ้างอิง	71
ภาคผนวก	73
ภาคผนวก ก. ก๊าซโครมาโทกราฟี	74
ภาคผนวก ข. ความคันไอและความหนาแน่นของสาร	76
ภาคผนวก ค. ส่วนประกอบของวงจรกำเนิดความถี่ปรับก่าได้และอ่านความถี่	80
ภาคผนวก ง. วงจรขับสัญญาณย่านความถี่เสียง	95
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	97

สารบัญตาราง

ตารางที่

2.1	การจำแนกประเภทของพลาสมา	13
2.2	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	17
2.3	ค่าสภาพทนต่อสนามไฟฟ้าของสารไคอิเล็กทริกต่างๆ	18
2.4	คุณสมบัติเชิงฟิสิกส์และเชิงเคมีของเมทานอล เอทานอล และน้ำ	19
4.1	ผลการตอบสนองความถึ่งองแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับในภาวะ โหลดชนิด	
	ต่าง ๆ	44
4.2	เงื่อนไขของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมในการทคลอง	60
4.3	ผลของความเข้มข้นเอทานอลที่มีต่ออัตราการผลิตไฮโครเจน	65
4.4	เปรียบเทียบความเข้มข้นไฮโครเจนที่ได้จาก น้ำกลั่น เอทานอล 50% และเอทา	
	นอลบริสุทธิ์	66
4.5	เปรียบเทียบอัตราการผลิตของ H ₂ /CH ₄ และ H ₂ /CO	66
4.6	เปรียบเทียบ % Molar fraction ของ H_2 , N_2 , CH_4 and CO	67

หน้า

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	สถานะของสสารและอุณหภูมิ	11
2.2	โครงร่างภายนอก DBDs แบบแผ่นสี่เหลี่ยมคู่ขนาน (ก)-(ค) และแบบ	
	ทรงกระบอก (ง)-(ฉ)	14
2.3	แสดงลำดับขั้นของการเกิด Microdischarges ใน DBDs: (ก) การเกิดไอออไนเซ	
	ชันของก๊าซ (ข) กลุ่มอิเล็กตรอนมาถึงมาถึงวัสคุไคอิเล็กทริกที่ขั้วตรงข้าม (ค)	
	อิเล็กตรอนแผ่ออกไปตามพื้นผิวของวัสคุไคอิเล็กทริก	15
2.4	แสดง Microdischarges ที่มีขนาด 6 ซม×6 ซม เป็นเวลา 20 ms	16
2.5	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความคันไอและอุณหภูมิของสารแต่ละชนิค	20
2.6	หลักการแยกสารเนื้อเดียวด้วยก๊าซโครมาโทกราฟี	22
2.7	องค์ประกอบหลักของก๊าซโครมาโทกราฟี	23
2.8	เครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟี (SHIMADZU Gas Chromatograph รุ่น GC-8A)	24
2.9	ส่วนแสดงผลข้อมูล (C-R8A Chromatopac)	25
2.10	ความสัมพันธ์ระหว่าง % Abundance และ Retention time ในการวิเคราะห์ด้วย	
	ก๊าซโครมาโทกราฟี	26
3.1	แผนภาพระบบผลิตก๊าซไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมาฟอร์มมิงแบบแบริเออร์	
	ดิสชาร์จ	28
3.2	แผนภาพโครงสร้างของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงที่ออกแบบขึ้น	30
3.3	แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำที่ออกแบบขึ้น	30
3.4	วงจรสำหรับตรวจวัคค่า V-I ของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงคันสูง	31
3.5	วงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้และวงจรอ่านค่าความถี่ที่ออกแบบขึ้น	32
3.6	ส่วนประกอบภายในของเครื่องกำเนิคสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ	33
3.7	แสดงวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงคันต่ำ	33
3.8	โครงสร้างชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นกู่ขนาน (ก) ภาคตัดขวางของชุดกำเนิด	
	พลาสมาแบบแผ่นคู่ขนาน (ข) แผ่นทองแคงขนาค 8 ซม× 8 ซม ติคกับแผ่นกระจก	
	ด้านหนึ่ง (ค) แผ่นอะลูมิเนียมแบบกริดขนาด 8 ซม× 8 ซม ติดกับแผ่นกระจกด้าน	
	หนึ่ง	35

หน้า

ฎ

3.9	ชุดกำเนิดพลาสมา DBD แบบแผ่นกู่ขนานขนาด 12 ซม × 14 ซม	35
3.10	ชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วทรงกระบอก	36
3.11	ชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วคนโท	37
3.12	โครงสร้างชุดกำเนิดพลาสมาแบบทรงกระบอก (ก) ภาพตัดขวางของท่อแก้ว	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกเท่ากับ 1.405 และ 1.84 เซนติเมตร	
	ตามลำคับ (ข) ภาพตัดขวางของท่อแก้วขนาคเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและ	
	ภายนอกเท่ากับ 1.56 และ 1.81 เซนติเมตร ตามลำคับ (ค) ขนาดและ โครงสร้าง	
	ของชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้ว (ง) ขนาดและ โครงสร้างของชุดกำเนิด	
	พลาสมาแบบท่อแก้วคนโท	37
4.1	แผนภาพระบบทคสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงที่พัฒนาขึ้น	38
4.2	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อไม่ต่อโหลด	39
4.3	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงคันไฟฟ้าและความถี่เมื่อโหลดเป็นตัวต้านทาน	40
4.4	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมา	
	แบบแผ่นคู่ขนาน	41
4.5	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อโหลคเป็นชุคพลาสมา	42
4.6	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมา	
	แบบทรงกระบอกท่อแก้วคนโท	43
4.7	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงคันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คงที่ค่าหนึ่งของ	
	ชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วคนโท	44
4.8	การจัคระบบทคลองการกำเนิคพลาสมาแบริเออร์คิสชาร์จแบบแผ่นคู่ขนาน	45
4.9	ลักษณะของพลาสมาจากชุคกำเนิคแบบแผ่นคู่ขนานที่แรงคันไฟฟ้าและความถึ่	
	ไฟฟ้าต่างๆ (ก) 200 Hz 30 kVpp (ข) 300 Hz 30 kVpp (ค) 400 Hz 24 kVpp (ง)	
	500 Hz 15 kVpp (ን) 600 Hz 10 kVpp (ን) 700 Hz 9 kVpp (ን) 800 Hz 6 kVpp	
	(ช) 900 Hz 5kVpp	46
4.10	สัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่อ่านด้วยออสซิลโลสโคป (ก) กรณีไม่เกิดพลาสมา (ข)	
	กรณีไม่เกิดพลาสมา	47
4.11	ลักษณะของพลาสมาจากชุคกำเนิคแบริเออร์คิสชาร์จ (ก) แบบท่อแก้ว (ข) แบบ	
	ท่อแก้วคนโท	48

4.12	ถุงเก็บก๊าซขนาค 1 ลิตร	49
4.13	เครื่องแก้วสำหรับคักจับก๊าซหนัก	49
4.14	เตาไฟฟ้าสำหรับปรับอุณหภูมิของระบบ	50
4.15	เครื่องปั๊มอากาศขนาดเล็กและตัวปรับอัตราการใหลของอากาศ	50
4.16	การจัคระบบผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะ	
	ของเหลวโดยอาศัยอากาศเป็นก้ำซพา	52
4.17	การเกิดพลาสมาในชุดกำเนิดแบบแผ่นคู่ขนาน (ก) กรณีก๊าซพาอย่างเดียวไม่เติมเอ	
	ทานอลลงในช่องว่างแผ่นแก้ว (ข) กรณีที่เติมเอทานอลลงในช่องว่างแผ่นแก้ว	53
4.18	ระบบผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะก๊าซ	54
4.19	โครมาโทแกรมของการวิเคราะห์ก๊าซด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี	55
4.20	แผนผังการศึกษาขนาดของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการผลิตก้ำซ	
	ไฮโครเจน	56
4.21	ผลของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการผลิตก๊าซไฮโครเจน (ก) ไม่ป้อน	
	แรงคันไฟฟ้า (ข) ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp	57
4.22	ผลของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการผลิตก๊าซไฮโครเจน (ก) ความถี่	
	ใฟฟ้า 200 Hz แรงคันไฟฟ้า 24 kVpp (ข) ความถี่ไฟฟ้า 200 Hz แรงคันไฟฟ้า 30	
	kVpp	58
4.23	ผลของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ในการผลิตก๊าซไฮโครเจน (ก) ความถี่ 350 Hz	
	แรงคันไฟฟ้า 24 kVpp (ข) ความถี่ 350 Hz แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp (ค) ความถี่ 500	
	Hz แรงคันไฟฟ้า 24 kVpp	59
4.24	แผนผังการศึกษาช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสม (Sampling time) ในการผลิต	
	ก๊าซ ไฮโครเจน	61
4.25	กราฟช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสม (Sampling time) ในการผลิตก๊าซ	
	ไฮโครเจน (ก) เก็บก๊าซครั้งละ 5 นาที (ข) เก็บก๊าซครั้งละ 12 นาที (ค) เก็บก๊าซ	
	ครั้งละ 20 นาที	62
4.26	แผนผังการศึกษาความเข้มข้น โคยปริมาตรของเอทานอลในการผลิตก๊าซ	
	ไฮโครเจน	63
4.27	กราฟความเข้มข้นเอทานอล โดยปริมาตรที่มีผลต่อความเข้มข้นไฮ โดรเจน	64

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามการเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจโลก ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยัง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีผู้ให้ความสนใจเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากขึ้น เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือน กระจกอันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงมีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์ เพิ่มมากขึ้น เช่น เป็นเชื้อเพลิงในจรวดขับดันสำหรับส่งยานอวกาศ และเซลล์เชื้อเพลิงในรถยนต์ นอกจากนี้การเติมไฮโดรเจนผสมเข้าไปในเชื้อเพลิงรถยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องยนต์ และช่วยลดปริมาณการปล่อยในโตรเจนออกไซด์

การผลิตไฮโดรเจนกำลังได้รับความสนใจในการศึกษาและวิจัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งการผลิต ไฮโดรเจนนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น กระบวนการรีฟอร์มมิงเอทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของเอทานอล อุณหภูมิสูงในสถานะก๊าซและแยกไฮโดรเจนออกจากการ์บอนอะตอมในเอทานอลโดยอาศัยตัวเร่ง ปฏิกิริยาในการเข้าทำปฏิกิริยาให้เร็วขึ้น กระบวนการแยกไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) โดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำที่มืองค์ประกอบพื้นฐานของไฮโดรเจนและ ออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจนจะถูกเก็บที่แคโทดและก๊าซออกซิเจนถูกเก็บที่แอโนด และอีกวิธีหนึ่งคือ

กระบวนการ โฟโตอิเล็ก โทร ไลซิส (Photoelectrolysis) โดยใช้แสงอาทิตย์แยก โมเลกุลของน้ำ นอกจากวิธีผลิต ไฮ โดรเจนดังกล่าวแล้ว วิธีพลาสมารีฟอร์มมิงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับ กวามสนใจเพิ่มขึ้น โดยหลักการเบื้องต้นของการกำเนิดพลาสมา คือ การ ใส่พลังงานเข้าไปในก๊าซที่ เป็นกลางก่อให้เกิดการ ไอออ ในซ์ (Ionize) เป็นพาหะประจุประกอบด้วย อิเล็กตรอน ไอออน และ ยังกงมีอะตอมของก๊าซเป็นกลางที่แตกตัวไม่หมดปะปนอยู่ ด้วยหลักการนี้เมื่อนำไปทำพลาสมารี ฟอร์มมิงกับเอทานอล หลังการ ไอออ ในซ์จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างเอทานอลกับน้ำในสถานะก๊าซ ซึ่ง พลาสมาจะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ก๊าซ ไฮ โดรเจน ก๊าซ มีเทน และก๊าซการ์บอนมอนออกไซด์ เป็นต้น วิธีการนี้มีข้อดี คือ มีสมรรถนะสูงและเกิดปฏิกิริยา ได้ดีในช่วงเวลาอันสั้นๆ มีอัตราการเปลี่ยนของสารตั้งด้นที่สูง โดยไม่ต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาทาง เกมี ระบบมีขนาดเล็กกะทัดรัด

การออกแบบชุคกำเนิคพลาสมาสำหรับการผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเป็น แบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์คิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge) โดยใช้สนามไฟฟ้ากระแสสลับ แบบต่อเนื่อง (Continuous AC) สามารถสร้าง Non-equilibrium plasma ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำที่ความคัน บรรยากาศ และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาคของอุปกรณ์และกำลังไฟฟ้าให้ได้ปริมาตรของการทำ ปฏิกิริยาได้ตามต้องการอีกด้วย

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในชุดกำเนิดพลาสมา นำไปสู่การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิด พลาสมาในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยกระบวนการรีฟอร์มมิงไฮโดรคาร์บอนและแอลกอฮอล์ ภายใน DBD ที่อุณหภูมิต่ำและความดันบรรยากาศ จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Sarmiento และ Hu ได้ มีการศึกษาผลของขนาดของศักย์ไฟฟ้า อัตราการไหลของก๊าซและความถี่ไฟฟ้าต่อประสิทธิภาพใน การผลิตไฮโดรเจน [1] [2] พบว่าเมื่ออัตราการไหลของก๊าซที่เข้าทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจะทำให้อัตรา การผลิตก๊าซไฮโดรเจนลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาอัตราการไหลของก๊าซแต่ละชนิดที่เหมาะสม ก่อน การเพิ่มขนาดของศักย์ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลของความถี่ สนามไฟฟ้าที่ป้อนนั้นค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากจะมีค่าสูงเฉพาะบางความถี่เท่านั้น

ในทางปฏิบัติกระบวนการรีฟอร์มมิงเอทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา ก๊าซไฮโดรการ์บอนหรือ แอลกอฮอล์ต้องทำที่อุณหภูมิสูงเพื่อไม่ให้สารกลับมารวมตัวเป็นของเหลวอีกครั้ง แต่ในงานวิจัยนี้ จะทำการศึกษาการเกิดพลาสมารีฟอร์มมิงในเอทานอลที่อุณหภูมิต่ำและความดันบรรยากาศ โดย พลาสมาจะทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การออกแบบอุปกรณ์และการจ่ายแรงดันไฟฟ้าใน ย่านความถี่ไฟฟ้าที่เหมาะสม จะทำให้เอทานอลในสถานะของเหลวหรือก๊าซเกิดการแตกตัวและ ก่อให้เกิดกระบวนการรีฟอร์มมิง นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตไฮโดรเจน

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบผลิตพลาสมาแบบใคอิเล็กทริกแบริเออร์คิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge หรือ DBD) ภายในของเหลวสำหรับนำไปใช้ในการผลิตก๊าซไฮโครเจน

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1. ออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดพลาสมาแบบ DBD ในของเหลวที่ความดันบรรยากาศ
- สึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพลาสมา เช่น ชนิดของก๊าซ ความถี่และแรงดันไฟฟ้าของ แหล่งจ่ายไฟฟ้า
- สึกษาผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไฮโดรการ์บอนกับของเหลว ได้แก่ น้ำ

1.4 วิชีดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- 2. ออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดพลาสมาแบบ DBD ในของเหลวที่ความคันบรรยากาศ
- 3. เลือกก้าชและของเหลวที่ใช้ในการทดลอง
- 4. หาความถึ่งองแหล่งจ่ายไฟที่สามารถผลิตพลาสมาที่มีความหนาแน่นสูง
- 5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติของของเหลวที่ใช้หลังทำปฏิกิริยากับพลาสมา
- 6. วิเคราะห์ผลการทคลองและประเมินผลการทคลอง
- 7. สรุปผลงานทคลองและเขียนวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. สามารถผลิตพลาสมาแบบ DBD ที่เกิดขึ้นภายในของเหลวที่ความคันบรรยากาศมากขึ้น
- 2. สามารถออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดพลาสมาที่สามารถปรับความถี่ได้
- สามารถผลิตก๊าซไฮโครเจนจากปฏิกิริยาระหว่างพลาสมาและของเหลวได้

1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- ในปี 1995 K. Okazaki, S. Hirai, T. Nozaki, K. Ogawa, and K. Hijikata ใด้ทำการศึกษา เรื่อง Plasma Chemical Reaction at Atmospheric Pressure for High Efficiency Use of Hydrocarbon Fuels เป็นการนำพลาสมามาใช้ในการผลิตเมทานอลด้วยปฏิกิริยาโดยตรง ระหว่างมีเทนและออกซิเจน สามารถผลิตเมทานอลได้ที่ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ ต่ำ อาศัยการกำเนิดพลาสมาแบบ ใดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge) จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับรูปสี่เหลี่ยมแบบพัลส์ที่มีความถี่ 250 Hz และ แรงดันไฟฟ้าปรับได้ระหว่าง 3-17 kV ผลการทดลองพบว่าสามารถผลิตเมทานอลที่ ประสิทธิภาพ 32.6% ของผลผลิตทั้งหมด เมื่อป้อนออกซิเจนที่มีความเข้มข้น 5%
- 2. ในปี 2007 Belen Sarmiento, J.Javier Brey, Inmaculada G. Viera, Agustin R. Gonzalez-Elipe, Jose Cotrino, Victor J. Rico ได้ทำการศึกษาเรื่อง Hydrogen Production by Reforming of Hydrocarbons and Alcohols in a Dielectric Barrier Discharge เป็นการนำ พลาสมามาใช้ในการผลิตก้าซไฮโดรเจนจากกระบวนการรีฟอร์มมิงของไฮโดรคาร์บอน หรือแอลกอฮอล์กับคาร์บอนไดออกไซด์หรือไอน้ำ สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ที่ความ ดันบรรยากาศและใช้อุณหภูมิที่ต่ำประมาณ 100 องศาเซลเซียส โดยพลาสมาที่ใช้เป็นแบบ ไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge) ซึ่งมีช่วงการทำงานที่กว้าง และต้นทุนต่ำ ผลจากการทดลองพบว่า ได้ทำการรีฟอร์มมิงของก๊าซมีเทนไปเป็น

การ์บอนมอนอกไซค์และไฮโครเจน 70% ส่วนรีฟอร์มมิงของเมทานอลและเอทานอลไป เป็นการ์บอนมอนอกไซค์และไฮโครเจน 100% โคยไม่มีก๊าซไฮโครการ์บอนตั้งต้นเหลืออยู่

- 3. ในปี 2008 H. Homma, H. Katayama, and K.Yasuoka ได้ทำการศึกษาเรื่อง Pulsed Dielectric Barrier Discharge of Argon Gas in Gas-Liquid Two-Phase Flow เป็นการศึกษา การกำเนิดพลาสมาในของเหลว ด้วยการป้อนก๊าซอาร์กอนเข้าไปในน้ำทำให้เกิด ฟองอากาศขึ้นภายในไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (Dielectric Barrier Discharge) แบบ แผ่นอิเล็กโทรดคู่ขนาน ซึ่งใช้แผ่นไดอิเล็กทริกบาง (แผ่นกระจก) มีขนาด 3x3 cm² มี ช่องว่างระหว่างแผ่นไดอิเล็กทริก 1 mm สามารถปรับความถิ่ได้ตั้งแต่ 3-20 kHz
- 4. ในปี 2010 D.S. Levko, A.I. Shchedrin, V.Ya. Chernyak and S.V.OI'shevskii ได้ ทำการศึกษาเรื่อง Efficiency of Ethanol Conversion in Equilibrium and Nonequilibrium Plasmas เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลในสถานะ ของเหลว โดยเปรียบเทียบระหว่าง Equilibrium and Nonequilibrium Plasmas ด้วยการจ่าย กระแสไฟฟ้า 300 mA และป้อนอากาศเข้าไปในสารละลายเอทานอล ภายในขั้วไฟฟ้าเกิด การไอออในซ์โมเลกุลเอทานอลและโมเลกุลน้ำเกิดแตกตัวเป็นอะตอมไฮโดรเจนและ อนุมูลอิสระ ผลการทดลองพบว่า ก่ายังผลการผลิตไฮโดรเจน(Hydrogen yield) กำนวณได้ 40 % แต่จากการทดลองจริงได้ 32 %
- 5. ในปี 2010 Guillaume Petitpas, Jose Gonzalez-Aguilar, Adeline Darmon and Laurent Fulcheri ใด้ทำการศึกษาเรื่อง Ethanol and E85 Reforming Assisted by a Non-thermal Arc Discharge เป็นการนำพลาสมามาใช้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยใช้กระแสไฟฟ้า ในช่วง 200-660 mA และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 15 kV เมื่อป้อนอากาศเข้าไปในเอทานอลจะ เกิดการดิสชาร์จระหว่างขั้วไฟฟ้าทำให้เกิดการแยกสลายโมเลกุลเอทานอลไปเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน และก๊าซการ์บอนมอนออกไซด์ เป็นต้น
- 6. ในปี 2012 Y.P. Hu, Gesheng Li, Yingduo Yang, Xiaohong Gao, Zhihong Lu ใด้ ทำการศึกษาเรื่อง Hydrogen generation from hydro-ethanol reforming by DBD-plasma เป็นการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลความเข้มข้น 75% โดยปริมาตรด้วยวิธีพลาสมารี ฟอร์มมิงแบบใดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ โดยการให้ความร้อนแก่เอทานอลที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ทำให้เอทานอลเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและควบคุมด้วยอัตราการไหล 5 มิลลิลิตรต่อนาที ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่ 11.2 kHz และแรงดันไฟฟ้า 18 kV ด้วยกำลังไฟฟ้า 100 W ผลการทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพของการรีฟอร์มมิงไฮโดรเจน สูงประมาณ 45%

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเนื้อหาของบทนี้จะกล่าวถึง กระบวนการผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น กระบวนการทางความร้อน กระบวนการทางไฟฟ้าและกระบวนการพลาสมารีฟอร์มมิง ทฤษฎี ทางด้านพลาสมา ประเภทของพลาสมา ไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (DBD) ลักษณะเฉพาะของ DBD ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ DBD คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กทริก คุณสมบัติ ของเอทานอล ก๊าซโครมาโทกราฟี และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยวิธีก๊าซโคร มาโทกราฟี

2.1 กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

กระบวนการผลิตก๊าซไฮโครเจนแบ่งเป็นหลายวิธี ได้แก่ กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยตัวเร่ง ปฏิกิริยา การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า การสลายโมเลกุลด้วยแสง และกระบวนการพลาสมารีฟอร์มมิง สำหรับกระบวนการผลิตก๊าซไฮโครเจนทางภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นกระบวนการรีฟอร์ม มิงด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา ปัจจุบันวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงนับว่าเป็นวิธีการใหม่ที่ได้รับความสนใจมาก ขึ้น [3]

2.1.1 กระบวนการทางความร้อน (Thermal Processes)

กระบวนการผลิตก๊าซไฮโครเจนด้วยความร้อนเป็นการให้ความร้อนกับสารประกอบกลุ่ม ไฮโครการ์บอน เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ น้ำมัน ถ่านหิน และเอทานอลเพื่อแยกไฮโครเจน ออกจากโมเลกุล แบ่งได้เป็นหลายประเภท คือ

 กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ (Steam reforming processes) เป็นกระบวนการที่อาศัย หลักการป้อนไอน้ำ (Steam) เข้าสู่ระบบเพื่อทำปฏิกิริยากับสารไฮโดรคาร์บอนในสถานะก๊าซ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน เมทานอล และเอทานอล กระบวนการนี้ต้องทำที่อุณหภูมิ ก่อนข้างสูงและต้องอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากต้องใช้พลังงานที่สูงมากในการดึงอะตอมของ ไฮโดรเจนจากโมเลกุลของไอน้ำและสารไฮโดรคาร์บอน ส่วนออกซิเจนที่เหลือจากไอน้ำและ การ์บอนที่เหลือจากไฮโดรคาร์บอนจะรวมตัวกันเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

 กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยก๊าซคาร์บอนใดออกไซด์ (Carbon dioxide reforming processes หรือ Dry reforming processes) เป็นกระบวนการที่ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้น้อยกว่า กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ และตัวเร่งปฏิกิริยาจะเสื่อมสภาพเร็วกว่า เนื่องจากปริมาณ คาร์บอนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะไปเกาะที่พื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้อายุการใช้งาน สั้น อย่างไรก็ตามการใช้ก๊าซการ์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิต จะช่วยลดปริมาณก๊าซ การ์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่เป็นก๊าซเรือนกระจกลงได้ [3] นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม ระบบการทำงานได้ง่ายกว่าวิธีการแรก

3. กระบวนการออกซิเคชันบางส่วน (Partial oxidation) เป็นกระบวนการทางเคมีระหว่าง สารไฮโครคาร์บอนกับก๊าซออกซิเจนที่ไม่ต้องใส่พลังงานจากภายนอกเข้าไป เนื่องจากเป็นปฏิกิริยา คายความร้อน ทำให้เกิดพลังงานขึ้นภายในระบบ กระบวนการนี้มีข้อจำกัด คือ ปริมาณออกซิเจนที่ เข้าสู่ระบบต้องมีปริมาณที่เหมาะสม และต้องมีระบบแยกก๊าซออกซิเจนออกจากอากาศก่อนเพื่อ ไม่ให้ก๊าซออกซิเจนกลับเข้าไปรวมกับก๊าซไฮโครเจนแล้วกลายเป็นน้ำ

4. กระบวนการร่วมระหว่างกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำกับออกซิเดชันบางส่วน หรือ เรียกว่า ออโตเทอร์มัลรีฟอร์มมิง (Auto thermal reforming) เป็นกระบวนการที่อาศัยหลักการป้อน ไอน้ำ (Stream) และก๊าซออกซิเจนรวมกันเพื่อทำปฏิกิริยากับสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสามารถผลิต ไฮโดรเจนได้ในอัตราส่วนที่มากกว่ากระบวนการออกซิเดชันบางส่วน และใช้พลังงานน้อยกว่า กระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอน้ำ วิธีการนี้กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและมีการใช้งานจริงในเชิง อุตสาหกรรมมากขึ้น

2.1.2 กระบวนการทางไฟฟ้า (Electrolytic Processes)

กระบวนการทางไฟฟ้าเป็นการแยกน้ำเพื่อที่จะผลิตก๊าซไฮโครเจนและก๊าซออกซิเจนด้วย ไฟฟ้า [4] โดยผ่านไฟฟ้ากระแสตรงไปที่ขั้วไฟฟ้าสองขั้ว คือ ขั้วแคโทคและขั้วแอโนคซึ่งจุ่มในน้ำ โดยที่ขั้วแกโทคต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่จะสร้างประจุไฟฟ้าลบขึ้น ซึ่งจะผลักอิเล็กตรอนออก จากขั้วนี้ ส่วนที่ขั้วแอโนคต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่จะสร้างประจุไฟฟ้าบวกขึ้นทำหน้าที่ในการ รับอิเล็กตรอน ทำให้การไหลของอิเล็กตรอนครบวงจร ซึ่งโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้ขั้วแคโทคจะถูก แยกออกเป็นไฮโครเจนไอออน (H⁺) และ ไฮครอกซิลไอออน (OH⁻) คังสมการที่ 2.1

$$H_2 O \to H^+ + O H^- \tag{2.1}$$

ไฮโครเจนไอออน (H⁺) จะจับอิเล็กตรอนจากขั้วแคโทคซึ่งจะกลายเป็นไฮโครเจนอะตอม ดังสมการที่ 2.2 และไฮโครเจนอะตอมนี้จะไปรวมกับไฮโครเจนอะตอมตัวอื่นเป็นโมเลกุลของก๊าซ ไฮโครเจนดังสมการที่ 2.3

$$H^+ + e^- \to H \tag{2.2}$$

$$H + H \to H_2 \tag{2.3}$$

ส่วนที่ขั้วแอโนด ไฮครอกซิลไอออน (OH) จะให้อิเล็กตรอนกับขั้วแอโนค และจะรวม กับไฮครอกซิลไอออน (OH) ตัวอื่นกลายเป็นโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนและน้ำคังสมการที่ 2.4

$$4OH^{-}(aq) \rightarrow O_{2}(g) + 2H_{2}O(l) + 4e^{-}$$
 (2.4)

ในกระบวนการผลิตก๊าซไฮโครเจนนี้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในปฏิกิริยาไค้มาจากแหล่ง พลังงานตั้งต้นอื่น ถ้าจะนำก๊าซไฮโครเจนนี้มาผลิตกระแสไฟฟ้า พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้นั้น ยังไม่กุ้มก่ากับต้นทุนในการแยกสลายน้ำด้วยไฟฟ้า เพราะรากาต้นทุนเกือบทั้งหมดของ กระบวนการนี้ขึ้นกับมูลก่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสลายน้ำ

2.1.3 กระบวนการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิง

วิธีพลาสมารีฟอร์มมิงสำหรับผลิตไฮโครเจนจากเอทานอลมีลักษณะเค่นกว่าวิธีรีฟอร์มมิง แบบคั้งเคิม อาศัยคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญของพลาสมาซึ่งประกอบค้วย พฤติกรรมร่วม พลังงาน ไอออไนเซชันของก๊าซ อุณหภูมิและความหนาแน่นของพลาสมา และความถี่พลาสมา

การผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ อาศัยการ ไอออในซ์ของก๊าซที่ความดันบรรยากาศ ภายใต้ขนาดของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่ป้อนเข้า สู่ขั้วไฟฟ้าสองขั้วที่กั่นกลางด้วยวัสดุไดอิเล็กทริก เพื่อช่วยให้สามารถใช้แรงคันไฟฟ้าสูงขึ้นโดยไม่ เกิดการ Arcing ระหว่างขั้วไฟฟ้า พลาสมาที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นกระจายทั่วบริเวณระหว่าง ขั้วไฟฟ้าซึ่งจัดเป็น Non-equilibrium plasma ที่มีอุณหภูมิของอิเล็กตรอนมากกว่าอุณหภูมิของ ไอออนหรือโมเลกุลก๊าซมาก โดยที่อุณหภูมิของอิเล็กตรอนอยู่ในช่วง 1-10 eV จากหลักการนี้ นำไปใช้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากเอทานอล และเป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตไฮโดรเจนที่มี ประสิทธิภาพในอนากต

วิธีการพลาสมารีฟอร์มมิงเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านการรีฟอร์มมิงไฮโครคาร์บอนแบบ ดั้งเดิม [8] [9] เพราะสามารถทำปฏิกิริยาได้สูงที่อุณหภูมิต่ำ โดยพลาสมาทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเร่ง ปฏิกิริยาในการรีฟอร์มมิงแทนความร้อน

กระบวนการพลาสมารีฟอร์มมิง จึงมุ่งเน้นไปที่ Non-equilibrium plasma การผลิตจะขึ้นอยู่ กับโครงสร้างของระบบกำเนิด ความดัน และแหล่งจ่ายไฟฟ้า ข้อดีของวิธีนี้ คือ มีสมรรถนะที่ดีและ เกิดปฏิกิริยาได้สูงในช่วงการเปลี่ยนแปลงสั้น ๆ มีอัตราการเปลี่ยนของสารตั้งต้นที่สูง โดยไม่ต้อง อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยา ขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ข้อเสียคือ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงที่มีรากาแพง

การผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์คิสชาร์จ จัดเป็น การผลิตพลาสมาแบบ Non-equilibrium plasma เริ่มจากให้พลังงานความร้อนกับเอทานอล จน ระเหยกลายเป็นไอ (Vapor) แล้วเคลื่อนที่ไปปนกับอากาศที่ประกอบด้วย ก๊าซออกซิเจน และก๊าซ ในโตรเจน เคลื่อนที่ผ่านบริเวณดิสชาร์จระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว ขนาดของแรงคันไฟฟ้าและ กวามถี่ไฟฟ้าที่ป้อนเข้าไปมีผลต่อการไอออในซ์ของก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจน เมื่อ อิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่เข้าชนโมเลกุลอากาศจะทำให้โมเลกุลออกซิเจนเกิดการแตกตัวเป็น อิเล็กตรอน ไอออนบวกของออกซิเจน อนุมูลและอะตอมของออกซิเจน เกิดพลาสมาเป็นเส้นสีตาม ชนิดของก๊าซที่เคลื่อนที่ผ่านและยังมีโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนที่เป็นกลางเนื่องจากแตกตัวไม่หมด ดังสมการที่ 2.5-2.8 [8] ส่วนโมเลกุลในโตรเจนเกิดการแตกตัวเป็นอิเล็กตรอน ไอออนบวกของ ในโตรเจน อนุมูลและอะตอมของในโตรเจน และยังมีโมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนที่เป็นกลางดัง สมการที่ 2.9-2.13 [8]

$$O_2 + e \to O + O + e \tag{2.5}$$

$$O_2 + e \to O_2({}^1D_g) + e \tag{2.6}$$

$$O_2 + e \to O_2(v) + e \tag{2.7}$$

$$O_2 + e \to O_2^+ + e + e \tag{2.8}$$

$$N_2 + e \to N_2(A^3 \Sigma_u^+) + e \tag{2.9}$$

$$N_2 + e \to N_2(a^1 \prod_g^+) + e \tag{2.10}$$

$$N_2 + e \to N_2(v) + e \tag{2.11}$$

$$N_2 + e \to N + N + e \tag{2.12}$$

$$N_2 + e \to N_2^+ + e + e \tag{2.13}$$

เมื่อปริมาณของเอทานอลในสถานะก๊าซเพิ่มขึ้น จะเกลื่อนที่ไปดันอากาศที่ก้างอยู่ในระบบ ออกมา มีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างเอทานอลกับอะตอมออกซิเจนและอนุมูลไฮดรอกซิลดัง สมการที่ 2.14-2.15 [8] [9]

$$C_2H_5OH + O \to C_2H_5O + OH \tag{2.14}$$

$$C_2H_5OH + OH \to C_2H_5O + H_2O \tag{2.15}$$

อิเล็กตรอนอิสระและอิเล็กตรอนที่เกิดจากการไอออไนซ์อากาศจะทำปฏิกิริยากับโมเลกุล ของเอทานอลทำให้เกิดการแตกตัวเป็นอิเล็กตรอน ไอออนบวกของเอทานอล อะตอมไฮโดรเจน อนุมูลไฮครอกซิล และโมเลกุลของเอทานอลที่แตกตัวไม่หมดคังสมการที่ 2.16-2.19 [8] [9]

$$C_2H_5OH + e \to CH_3 + CH_2OH + e \tag{2.16}$$

$$CH_3CH_2OH + e \to C_2H_5 + OH + e \tag{2.17}$$

$$CH_{3}CH_{2}OH + e \rightarrow CH_{3}CHOH + H + e$$
(2.18)

$$CH_3CH_2OH + e \to C_2H_5OH^+ + e + e \tag{2.19}$$

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าอิเล็กตรอนอิสระ อิเล็กตรอนที่เกิดจากการไอออไนซ์ อากาศหรือเอทานอลเข้าชนโมเลกุลของน้ำ ทำให้โมเลกุลของน้ำแตกตัวเป็นเป็นอิเล็กตรอน ไอออนบวกของน้ำ อะตอมไฮโดรเจน อนุมูลไฮครอกซิล และโมเลกุลของน้ำที่แตกตัวไม่หมดคัง สมการที่ 2.20-2.22 [8] [9]

$$H_2 O + e \to H_2 O + e \tag{2.20}$$

$$H_2O + e \to OH + H + e \tag{2.21}$$

$$H_2 O + e \to H_2 O^+ + e + e \tag{2.22}$$

ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาหลักสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริก แบริเออร์ดิสชาร์จ ที่ทำให้เอทานอลเกิดการสลายโมเลกุลด้วยกระบวนการพลาสมารีฟอร์มมิง ทำ ให้ได้ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน และก๊าซการ์บอนมอนออกไซด์ เป็นต้น แสดงได้ดังสมการที่ 2.23-2.27 [8]

$$CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2O + \frac{1}{2}H_2$$
 (2.23)

$$CH_3CH_2O \rightarrow CH_3CHO + \frac{1}{2}H_2$$
 (2.24)

$$CH_{3}CHO + O \rightarrow CH_{3}COO + \frac{1}{2}H_{2}$$
 (2.25)

$$CH_3CH_2O \rightarrow CH_4 + CO + \frac{1}{2}H_2$$
 (2.26)

$$OH + CH_3 COO \rightarrow CH_4 + CO + O \tag{2.27}$$

2.2 ทฤษฎีทางด้านพลาสมา

2.2.1 คำจำกัดความและคุณสมบัติที่สำคัญของพลาสมา

พลาสมา คือ สถานะที่สี่ของสสารที่แยกออกจากของแข็ง ของเหลว และก๊าซ [5] ดังภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดงช่วงอุณหภูมิหรือพลังงานของอนุภาค พลาสมาประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุทั้ง ประจุ บวกและลบ ในสัดส่วนที่ทำให้ประจุสุทธิเป็นศูนย์ การอยู่รวมกันของอนุภาคเหล่านี้เป็นแบบ ประหนึ่งเป็นกลาง (Quasineutral) ซึ่งหมายความว่าอิเล็กตรอนและ ไอออนในบริเวณนั้น โดยรวม แล้วมีความหนาแน่นเท่า ๆ กัน และแสดงพฤติกรรมร่วม (Collective behavior) ออกมา

พฤติกรรมร่วมของพลาสมามีหลายรูปแบบ เช่น การเกลื่อนที่ของอนุภาคในพลาสมา ซึ่งไม่ เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในบริเวณนั้น ๆ เท่านั้น แต่ผลโดยรวมจากพลาสมาส่วนใหญ่ซึ่งมาจาก กุณสมบัติทางไฟฟ้าและการชนกันของอนุภาคที่อยู่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากอนุภาคในพลาสมาที่ สถานะสมคุลจะมีการสั่นด้วยความถี่ที่สูงกว่าความถี่ในการชนกันของอนุภาคสองตัวที่อยู่ใกล้กัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมร่วมเป็นพฤติกรรมที่กลุ่มพลาสมาแสดงออกมาร่วมกัน



เมื่อก๊าซได้รับพลังงานสูงกว่าพลังงานที่ทำให้เกิดการไอออไนซ์จะมีผลทำให้ก๊าซเกิดการ แตกตัวเป็น อิเล็กตรอน ไอออน และยังมีอะตอมของก๊าซบางตัวที่เป็นกลางเนื่องจากยังแตกตัวไม่ หมดรวมอยู่ ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับการรวมตัวกลับของอิเล็กตรอนและ ไอออนกลายเป็นอะตอมที่เป็นกลางหรือโมเลกุล (Recombination)

อิเล็กตรอนเป็นตัวแปรหลักที่มีผลต่อการถ่ายโอนพลังงานจากสนามไฟฟ้าภายนอกแล้วทำ ให้ก๊าซเกิดการแตกตัว และเนื่องจากอิเล็กตรอนมีมวลที่เบาที่สุดในพลาสมา ดังนั้นจึงถูกเร่งและ ดูดกลืนพลังงานจากสนามไฟฟ้าภายนอกได้ง่ายที่สุด เป็นผลทำให้อิเล็กตรอนถ่ายโอนพลังงาน ให้กับโมเลกุลของก๊าซด้วยการชน เป็นสาเหตุทำให้ก๊าซเกิดการไอออไนซ์ การไอออไนซ์จะมาก หรือน้อยเพียงใดนั้นสามารถอธิบายด้วยระดับของไอออไนเซชัน

ระดับของใอออในเซชัน

ตัวแปรหนึ่งที่นิยามจากความหนาแน่นของอนุภาคมีประจุในพลาสมา คือ ระดับไอออไน-เซชันของก๊าซ ซึ่งเป็นสัดส่วนของอนุภาคในสถานะก๊าซที่แตกตัวกับความหนาแน่นของก๊าซ ทั้งหมดดังสมการที่ 2.28

$$\alpha = \frac{n_i}{n} \tag{2.28}$$

- lpha คือ ระดับไอออในเซชันของก๊าซ
- n_i คือ ความหนาแน่นของก๊าซที่แตกตัว
- *n* คือ ความหนาแน่นของก๊าซทั้งหมด

อุณหภูมิและความหนาแน่นของพลาสมา

ก๊าซในเชิงสมดุลความร้อนมือนุภาคที่มีความเร็วหลายค่า และการแจกแจงความเร็วเหล่านี้ เรียกว่า Maxwellian velocity distribution เกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์ของอนุภาคที่สัมพันธ์กับ อุณหภูมิของพลาสมา ในฟิสิกส์พลาสมา อุณหภูมิของพลาสมามีหน่วยเคียวกับพลังงาน เช่น KT= 1eV = 1.6x10⁻¹⁹ J ≈ 11,600 K อุณหภูมิสูงนั้นมิได้หมายความว่าต้องร้อนมาก เช่น อุณหภูมิของ อิเล็กตรอนในหลอดฟลูออเรสเซนต์มีค่าสูงประมาณ 20,000 K แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่รู้สึกร้อน เพราะความหนาแน่นของอิเล็กตรอนภายในหลอดฟลูออเรสเซนต์นั้นน้อยกว่าความหนาแน่นของ ก๊าซที่ความคันบรรยากาศและปริมาณความร้อนในหลอดไฟถูกถ่ายโอนไปยังผนังของหลอดไฟ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนาแน่นของพลาสมาสามารถบอกคุณสมบัติของพลาสมา ได้หลายอย่างตามหัวข้อต่อไปนี้

Debye Length

ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญของพลาสมาคือ Debye Length เมื่อสนามไฟฟ้าถูก สร้างขึ้นในพลาสมา อนุภาคมีประจุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิเล็กตรอนซึ่งมีมวลเบาและเคลื่อนที่ได้ ดีกว่าไอออน จะปรับตัวเพื่อตอบสนองต่ออิทธิพลของสนามไฟฟ้า โดยจะเคลื่อนที่เพื่อสร้าง สนามไฟฟ้าภายในขึ้นมาหักล้างสนามไฟฟ้านั้น ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Debye shielding ปรากฏการณ์นี้ทำให้ประจุที่อยู่ห่างจากบริเวณที่สนามไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นเป็นระยะทางหนึ่งไม่เห็น สนามไฟฟ้านั้น เสมือนว่าไม่มีสนามไฟฟ้านั้นอยู่ ระยะทางคังกล่าวเรียกว่า Debye Length ซึ่งขึ้นอยู่ กับอุณหภูมิของอิเล็กตรอนและความหนาแน่นของอิเล็กตรอนตามสมการที่ 2.29

$$\lambda_D = \left(\frac{\varepsilon_0 k T_e}{n_e e^2}\right)^{1/2} \tag{2.29}$$

 $\varepsilon_0 =$ ค่าสภาพยอมผ่านได้ของสุญญากาศ = 8.854 $\times 10^{-12}$ ฟารัคต่อเมตร e = 15ะจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน = 1.602 $\times 10^{-19}$ ลูลอมบ์

ความถี่พลาสมา

ความถี่ของการสั่นของอิเล็กตรอนนั้นเรียกว่า ความถี่พลาสมา ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และมวลของอิเล็กตรอน เป็นผลมาจากอิเล็กตรอนที่มีมวลเบาและวิ่งได้เร็วกว่าไอออนพยายามที่จะ เคลื่อนที่เพื่อรักษาสภาพความเป็นกลางของพลาสมาเอาไว้ โดยแรงเฉื่อยทำให้อิเล็กตรอนไม่ สามารถหยุด ณ จุดสมดุลได้ แต่กลับมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแทนด้วยความถี่ที่แสดงตาม สมการที่ 2.30

$$\omega_p = \left(\frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}\right)^{1/2} \tag{2.30}$$

m_e = มวลของอิเลี้กตรอน
 n_e = ความหนาแน่นของอิเลี้กตรอน

2.2.2 ประเภทของพลาสมา [6]

การแบ่งประเภทของพลาสมามีหลายวิธี เช่น แบ่งตามระดับการเกิดไอออไนเซชันหรือแบ่ง ตามอุณหภูมิของอนุภาค สำหรับการแบ่งตามระดับการไอออไนเซชัน พลาสมาที่อยู่ในระดับไอออ ในเซชันต่ำมีความหนาแน่นของอนุภาคมีประจุที่แตกตัวน้อยกว่าความหนาแน่นของก๊าซ เรา เรียกว่า Weakly-ionized gas แต่ถ้าก๊าซเกิดการแตกตัวเป็นอนุภาคมีประจุทั้งหมดหรือเกือบหมดซึ่ง มีความหนาแน่นของอนุภาคมีประจุที่แตกตัวเกือบเท่ากับความหนาแน่นของก๊าซ เราเรียกว่า Fullyionized gas สำหรับการแบ่งตามอุณหภูมิของพลาสมา หากอุณหภูมิของอิเล็กตรอนมากกว่า อุณหภูมิของไอออนหรือโมเลกุลก๊าซมาก เราเรียกว่า Non-equilibrium plasma ซึ่งอุณหภูมิของ อิเล็กตรอนอาจสูงถึง 10⁴-10⁵ K (1-10 eV) ขณะที่ก๊าซอยู่ในระดับอุณหภูมิต่ำคืออุณหภูมิห้อง แต่ถ้า อุณหภูมิของอิเล็กตรอนเท่ากับอุณหภูมิของไอออนหรือโมเลกุลก๊าซเราเรียกว่า Equilibrium plasma ดังตารางที่ 2.1

Plasma	State	Example	
High temperature plasma	$T_e \approx T_i \approx T_g,$	Laser fusion plasma	
(Equilibrium plasma)	$Tg = 10^6 - 10^8 K$		
	$n_e \ge 10^{20} m^{-3}$		
Thermal plasma	$T_e \approx T_i \approx T_g,$	Arc plasma, plasma torches, RF	
(Quasi-equilibrium plasma)	$Tg \leq 2x10^4 K$	inductively coupled discharges	
	$n_e \ge 10^{20} m^{-3}$		
Non thermal plasma	$T_e >> T_i \approx T_g,$	Glow, Corona, APPJ, DBD,	
(Non-equilibrium plasma)	$Tg = 30010^3 K$	MHCD,	
	$n_e \approx 10^{10} m^{-3}$	OAUGDP, plasma needle etc	

ตารางที่ 2.1 แสดงการจำแนกประเภทของพลาสมา [6]

2.3 ใดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จในบรรยากาศ

Atmospheric Dielectric barrier discharges (DBDs) สามารถทำงานที่ความคันบรรยากาศ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานภายหลังปีคริสต์ศักราช 1860 โครงสร้างของ DBD ประกอบค้วย อิเล็กโทรค ช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรคและกั้นค้วยฉนวนที่เป็นวัสคุไคอิเล็กทริก สามารถป้อน แหล่งจ่ายแรงคันไฟฟ้าทั้งกระแสตรง (DC) กระแสสลับ (AC) หรือเป็นแบบพัลส์ผ่านขั้วอิเล็กโทรค

2.3.1 การใช้งานของ DBD

การใช้งาน DBD อย่างกว้างขวางครั้งแรก คือ การผลิตโอโซน สำหรับการทำน้ำประปา [11] สิทธิบัตรต่าง ๆเหล่านี้ตีพิมพ์ในเยอรมนีในปีคริสต์ศักราช 1860 ในปัจจุบัน DBD ได้ถูก นำมาใช้งานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติพื้นผิวของวัสดุ ฟิล์มบาง และพอลิเมอร์อย่างแพร่หลาย

2.3.2 ลักษณะเฉพาะของ DBD

โดยปกติแล้ว DBD อาจจะมีโครงสร้างเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมคู่ขนานหรือทรงกระบอกดังภาพที่ 2.2 แบบแผ่นสี่เหลี่ยมคู่ขนานมักใช้ในงานเกี่ยวกับการปรังปรุงพื้นผิววัสดุ ฟิล์มโลหะบาง หรือพอ ลิเมอร์ ส่วนแบบทรงกระบอกจะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ เช่น การผลิตโอโซนเชิง อุตสาหกรรมที่ความดันบรรยากาศโดยใช้อากาศหรือออกซิเจนเป็นก๊าซในการทำปฏิกิริยา



ภาพที่ 2.2 โครงร่างภายนอก DBDs แบบแผ่นสี่เหลี่ยมคู่ขนาน (ก)-(ค) และแบบทรงกระบอก (ง)-(ฉ) [11]

2.3.3 ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ DBDs

การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน DBD นั้นอาจเริ่มจากการอธิบายลำดับขั้นของ การเกิด Microdischarge ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกเมื่อป้อนไฟฟ้าแรงสูงระหว่างอิเล็กโทรดและมี พลังงานเพียงพอที่จะทำให้ก๊าซเกิดการไอออในซ์ ซึ่งอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะถูกเร่งในสนามไฟฟ้า ให้มีพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับพลังงานไอออในเซชันของก๊าซตามภาพที่ 2.3 (ก) และก่อไอออ ในซ์ต่อไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังป้อนแรงคันไฟฟ้าให้อยู่ ทำให้มีจำนวนอิเล็กตรอนมากขึ้น การ เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนั้นเร็วกว่าการเคลื่อนที่ของไอออน ทำให้กลุ่มอิเล็กตรอนข้ามช่องว่างมาถึง อิเล็กโทรดขั้วแอโนดได้ในช่วงระดับนาโนวินาทีตามภาพที่ 2.3 (ข) และเมื่อกลุ่มอิเล็กตรอนบ้ามช่องว่างมาถึง อิเล็กโทรดขั้วแอโนด กลุ่มอิเล็กตรอนจะแผ่ขยายไปเหนือพื้นผิวและพบกับประจุบวกที่ขั้วแอโนด ตามภาพที่ 2.3 (ค) ส่วนไอออนยังคงเคลื่อนที่อยู่ภายในช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรดและก่อให้เกิด สนามไฟฟ้าภายในระหว่างอิเล็กตรอนที่ผิวใดอิเล็กทริกที่แอโนดกับกลุ่มของไอออนช้า ปัจจัยนี้เอง ที่มีผลต่อการลดลงของสนามไฟฟ้า [12] และพบว่าพื้นผิวของวัสดุไดอิเล็กทริกแต่ละแบบมีผลต่อ การฟอร์มตัวของ Current filament หรือ Microdischarges การเริ่มต้นของจำนวน Current filament แสดงได้ตามลำดับขั้นในภาพที่ 2.4 และจากการทดลองกำเนิดพลาสมาในห้องมืด โดยเริ่มจับภาพ ของช่องว่างอากาศ 1 mm ผ่านอิเล็กโทรดแผ่นกู่ขนานโปร่งใส ใช้แก้วเป็นวัสดุไดอิเล็กทริก หลัง จ่ายศักย์ใฟฟ้าแรงสูง และคาดว่าขนาด Filament Radius ประมาณ 0.1 mm ตามภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.3 แสดงลำดับขั้นของการเกิด Microdischarges ใน DBDs: (ก) การเกิด ไอออ ในเซชัน ของก๊าซ (ข) กลุ่มอิเล็กตรอนมาถึงมาถึงวัสดุ ไดอิเล็กทริกที่ขั้วตรงข้าม (ค) อิเล็กตรอนแผ่ออก ไปตามพื้นผิวของวัสดุ ไดอิเล็กทริก [11]



ภาพที่ 2.4 แสดง Microdischarges ที่มีขนาด 6 ซม×6 ซม เป็นเวลา 20 ms [13]

2.4 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กทริก

ในการเลือกใช้วัสดุไดอิเล็กทริกเป็นชุดกำเนิดพลาสมาแบบ DBD จะต้องกำนึงถึง ชนิด ของวัสดุ สภาพความทนต่อสนามไฟฟ้าแรงสูง ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และการสูญเสียพลังงานในรูป ของความร้อน ดังนี้

ค่าคงที่ใดอิเล็กทริก (Dielectric constant)

เมื่อพิจารณาแผ่นโลหะขนานกันสองแผ่นที่มีพื้นที่ A และวางห่างกันเป็นระยะ d ในกรณีที่ ช่องว่างระหว่างแผ่นโลหะเป็นอากาศ [14] เมื่อใส่ศักย์ไฟฟ้า V₀ ให้กับแผ่นโลหะโดยแผ่นโลหะ ด้านหนึ่งมีประจุ +Q และอีกด้านหนึ่งมีประจุ –Q จะสามารถคำนวณหาก่ากวามจุไฟฟ้าก่อนใส่วัสดุ ไดอิเล็กทริก C₀ ได้ดังสมการที่ 2.31

$$C_0 = \frac{Q}{V_0} \tag{2.31}$$

C₀ คือ ค่าความจุไฟฟ้าก่อนใส่วัสดุไดอิเล็กทริก (ฟารัด)
 V₀ คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าก่อนใส่วัสดุไดอิเล็กทริก (โวลต์)
 Q คือ ค่าประจุไฟฟ้า (คูลอมบ์)

เมื่อใส่แผ่นไดอิเล็กทริกในช่องว่างระหว่างแผ่นโลหะ พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าลดลงเป็นค่า V ซึ่งมีผลทำให้ค่าความจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังสมการที่ 2.32

$$C = \frac{Q}{V} \tag{2.32}$$

C คือ ค่าความจุไฟฟ้าหลังใส่วัสคุไคอิเล็กทริก (ฟารัค)
 V คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าหลังใส่วัสคุไคอิเล็กทริก (โวลต์)
 Q คือ ค่าประจุไฟฟ้า (คูลอมบ์)

ดังนั้นหลังใส่วัสดุไดอิเล็กทริก ศักย์ไฟฟ้ามีค่าลดลง ส่งผลทำให้ค่าประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือ เก็บประจุได้มากขึ้นนั้นเอง นอกจากนี้ค่าความจุไฟฟ้า (C) ยังแปรผันโดยตรงกับค่าคงที่ไดอิเล็ก-ทริก (K) คือ วัสดุใดที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงแสดงว่ามีความสามารถในการเก็บประจุได้ดี แต่วัสดุ ใดมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่ำมีความสามารถในการเก็บประจุต่ำตามสมการที่ 2.33

$$C = KC_{0} = K\varepsilon_{0} \frac{A}{d} = \varepsilon \frac{A}{d}$$
โดยที่ A คือ พื้นที่หน้าตัดของโลหะที่เป็นขั้วไฟฟ้า
d คือ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตัวเก็บประจุไฟฟ้ามักจะมีวัสดุไดอิเล็กทริกกั้นระหว่างขั้วไฟฟ้า ซึ่ง วัสดุแต่ละชนิดนั้นมี ก่ากงที่ไดอิเล็กทริกที่แตกต่างกัน ตามตารางที่ 2.2

วัสดุ	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก	วัสคุ	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก
สุญญากาศ	1	พอถิไวนิลคลอไรค์	3.18
อากาศ (1 atm)	1.00059	เพล็กซิกลาส	3.4
อากาศ (100 atm)	1.0548	ยาง	3
ก้ำซอาร์กอน	1.00051	ควอตซ์	4.3
ก๊าซออกซิเจน	1.00049	แก้ว	5-10
เทฟลอน	2.1	เอทานอล	24.3
พอลิเอทิลิน	2.25	น้ำ	80.4

ตารางที่ 2.2 แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส [14]

ค่าความสามารถทนต่อสนามไฟฟ้า (Dielectric strength)

เป็นปริมาณที่บอกถึงความสามารถของวัสดุในการที่จะเก็บพลังงานไว้ได้ที่ความต่างศักย์ สูงๆหรือปริมาณสนามไฟฟ้าสูงสุดที่วัสดุยังคงรักษาความเป็นฉนวนไว้ได้ [15] ซึ่งแสดงในหน่วย ของความต่างศักย์ต่อหน่วยความยาว ดังตารางที่ 2.3 หากวัสดุไดอิเล็กทริกถูกป้อนด้วยสนาม ไฟฟ้าแรงสูง อาจทำให้ความเค้นของอิเล็กตรอนหรือไอออนในการที่จะพยายามไหลผ่านวัสดุไดอิ-เล็กทริกมีค่าเกินกว่าค่าสภาพทนต่อสนามไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้วัสดุไดอิเล็กทริกถูกทำลาย ทำให้เกิด การไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้น และทำให้เสียสมบัติความเป็นฉนวนของวัสดุ

การสูญเสียของไดอิเล็กทริก (Dielectric loss)

ถ้ำความต่างศักย์ไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุเป็นไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นซายน์ และมีเฟสของ กระแสไฟฟ้านำหน้าเฟสของความต่างศักย์ไฟฟ้า 90° จะไม่มีการสูญเสียพลังงานระหว่างแผ่นโลหะ แต่ในความจริงแล้วเฟสกระแสไฟฟ้าจะนำหน้าเฟสความต่างศักย์อยู่ 90° -δ ซึ่งเป็นผลจากความไม่ สมบูรณ์ของตัวนำ เรียก δ ว่า dielectric loss angle และผลคูณของ K tan δ คือ ปริมาณที่บอกถึง พลังงานที่สูญเสียในรูปของพลังงานความร้อนของตัวนำ ซึ่งค่า K คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก

วัสคุ	(kV/mm)	วัสคุ	(kV/mm)
อากาศ	1.181-2.756	เพล็กซิกลาส	17.716-38.976
น้ำกลั่น	3.149	พอลิเอทิลิน	17.716-47.244
แก้ว	3.585	พอลิพอไพลีน	19.685
ควอตซ์	5.905-7.874	พอลิสไตรีน	19.685
พอลิคาร์บอเนต	14.960-37.992	พอลิไวนิลคลอไรด์	28.543
ในลอน	15.748	เทฟลอน	39.370

ตารางที่ 2.3 แสดงค่าความสามารถทนต่อสนามไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กทริกต่าง ๆ [15]

2.5 คุณสมบัติพื้นฐานของเอทานอล

เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) คือ สารประกอบ ใฮโครคาร์บอนจำพวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง เอทานอลเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วย การ์บอน ไฮโครเจน และออกซิเจน สามารถละลายทั้งน้ำและสารละลายอินทรีย์อื่น ๆ เอทานอลอาจ อยู่ในรูปของ เอทานอลไร้น้ำ (Anhydrous ethanol) ที่มีความบริสุทธิ์สูง และเอทานอลที่มีน้ำ (Hydrous ethanol) เอทานอลมีสูตรเคมี C₂H₅OH ลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความ ไวไฟสูง มีน้ำหนักโมเลกุล 46.07 กรัม/โมล ความหนาแน่น 0.789 กรัมต่อมิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จุดหลอมเหลว -114.1 องศาเซลเซียส จุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการของเมทานอล เอทานอล และน้ำ

2.5.1 คุณสมบัติที่สำคัญของเอทานอล [17]

1. การเดือดของเอทานอล

การเดือด คือ การเกิดฟองอากาศขึ้นภายในของเหลวที่พยายามดันขึ้นมาที่ผิวหน้าของเหลว ทำให้ โมเลกุลของเหลวที่เคยอยู่บริเวณนั้นถูกฟองอากาศผลักไป ทำให้ระดับของเหลวขยายตัวขึ้น ในขณะเดียวกันก็ถูกกดด้วยความดันบรรยากาศ ดังนั้นการเดือดจะเกิดขึ้นได้เมื่อความดันไอของ ของเหลวมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศซึ่งสำหรับเอทานอลจะเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิเท่ากับ 78 องศา เซลเซียส

ความดันไอของเอทานอล

ความคันไอของเอทานอลขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เมื่อเอทานอลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความคันไอของ เอทานอลจะสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในสาร เช่น แรง ลอนดอน แรงดึงดูคระหว่างพันธะไฮโดรเจน เป็นด้น สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อย สามารถระเหยเป็นไอได้ง่าย มีความคันไอสูง และมีจุดเดือดต่ำ เช่น เอทานอล เป็นต้น ส่วนสารที่มี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากจะกลายเป็นไอได้ยาก มีความคันไอต่ำ และจุดเดือดสูง เช่น น้ำ เป็นต้น ซึ่งกราฟความสัมพันธ์ของความคันไอกับอุณหภูมิของเอทานอลและน้ำแสดงดังภาพที่ 2.5 (ดูรายละเอียดของกวามคันไอ ความหนาแน่นที่อุณหภูมิใดๆ ของเอทานอลและน้ำในภาคผนวก ข)

9			E 3	
คุณสมบัติ	เมทานอล	เอทานอล	น้ำ	
สูตรเคมี	CH ₃ OH	C ₂ H ₅ OH	H_2O	
ນວລໂນເລກຸລ (ກຮັນ/ໂນລ)	32.04	46.67	18.02	
ลักษณะ	ของเหลวไม่มีสี	ของเหลวไม่มีสี	ของเหลวไม่มีสี	
ความหนาแน่น (กรัม/มิลลิลิตร)	0.7918	0.789	1	
จุคเคือค (องศาเซลเซียส)	65	78	100	
จุควาบไฟ (องศาเซลเซียส)	11-12	13-14	-	
ความคันไอ (kPa) 20 องศาเซลเซียส	13.02	5.95	2.33	

a		مى	9	a			ő _	_
ตารางท่ 2.4 คณ	สมบตเชงฟสก	ิสเ	และเชงเ	คมขอ	งเมทานอล	เอทานอล	และนำ 16	4
· 9							L -	-





2.5.2 การเจื้อจางสารละลายเอทานอล [17]

วิธีเตรียมสารละลายเจือจาง ทำได้โดยเติมน้ำลงไปในสารละลายเข้มข้นมาตรฐานเพื่อให้ได้ กวามเข้มข้นและปริมาตรที่ต้องการก่อนนำไปกวนให้เข้ากัน ดังนั้นสารละลายก่อนและสารละลาย ที่ทำให้เจือจางจะมีเนื้อของตัวถูกละลายเท่ากัน นอกจากนี้ผลของการเจือจางสารละลายจะทำให้ จำนวนอนุภากของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในสารละลายนั้นลดลงและมีผลต่อจุดเดือดและกวามดันไอ ดังนี้

1. การลดต่ำลงของความดันใอ (Vapor pressure lowering)

ความดัน ไอของสารละลายต่ำกว่าความดัน ไอของเอทานอลบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน เพราะที่ผิวหน้าของสารละลายมีจำนวน โมเลกุลของตัวทำละลายน้อยลง เนื่องจากมี โมเลกุลของตัว ถูกละลายปะปนอยู่บ้าง จึงทำให้กลายเป็น ไอได้น้อยลงตามกฎของราคูลท์ ดังนี้

$$P_{solution} = X_1 P_1^0$$
 (2.34)

 $P_{solution} =$ ความคันไอของสารละลาย
 (2.34)

 $X_1 =$ เศษส่วนโมลของตัวทำละลาย
 (2.34)

 $P_1^0 =$ ความคันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์
 (2.35)

X ₂ = เศษส่วนโมลของตัวถูกละลาย

แทนค่า X_1 จากสมการที่ 2 ลงในสมการที่ 1 จะได้

$$P_1^0 - P_{solution} = X_2 P_1^0 \tag{2.36}$$

2. การสูงขึ้นของจุดเดือด (Boiling point elevation)

การที่ความคัน ไอของสารละลายลดต่ำลง มีผลทำให้จุดเดือดสารละลายสูงกว่าจุดเดือดของ เอทานอลบริสุทธิ์ และจุดเยือกแข็งของสารละลายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของเอทานอลบริสุทธิ์ดังนี้

จุดเดือดของสารละลายสูงขึ้น
$$=T_b^0-T_b$$

 $T_b=$ จุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์ $T_b^0=$ จุดเดือดของสารละลาย

Δ*T*_bเป็นค่าที่งื้นกับงำนวนอนุภาคของตัวทำละลายในสารละลายและชนิดของตัวทำ ละลาย แต่ไม่งื้นกับชนิดของตัวถูกละลาย

ละลายในตัวทำละลาย 1 kg

2.6 ก๊าซโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography)

ก๊าซโครมาโทกราฟี เป็นเทคนิคการแยกสารเนื้อเดียวออกจากกันโดยอาศัยหลักการที่สาร แต่ชนิดมีความสามารถในการละลายและถูกดูดซับต่างกัน จึงทำให้สารแต่ละชนิดแยกตัวออกจาก กันได้

2.6.1 หลักการของก๊าซโครมาโทกราฟี

ก๊าซโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคการแยกสารเนื้อเดียวออกจากกัน โดยสารตัวอย่างที่จะ นำเข้าสู่ระบบจะต้องสามารถระเหยกลายเป็นไอได้และมีความเสถียรเมื่อถูกความร้อน [18] [19] สารตัวอย่างที่เป็นไอจะถูกพาด้วยก๊าซพา (Mobile phase) ไปยังคอลัมน์ (Stationary phase) สาร ตัวอย่างจะกระจายอยู่ในก๊าซพาและคอลัมน์ ทำให้องค์ประกอบของสารผสมแยกตัวออกจากกัน เมื่อเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์เฟสคงที่ด้วยเวลาที่เข้าสู่เครื่องตรวจวัดสัญญาณที่ต่างกัน สัญญาณการ ตรวจวัดที่ได้จากเครื่องตรวจวัดสัญญาณจะถูกบันทึกและแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาทั้งในเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ ดังภาพที่ 2.6



ภาพที่ 2.6 หลักการแยกสารเนื้อเดียวด้วยก๊าซโครมาโทกราฟี

ที่มา : รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์. <u>เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง " ก๊าซ โครมาโทกราฟี "</u> [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.docstoc.com/docs/45375250/Gas-Chromatography-GC--squalane [18]

2.6.2 ชนิดของก๊าซโครมาโทกราฟี

สามารถแบ่งได้ 2 ชนิดตามชนิดของ Stationary phase ดังนี้

- Gas-Liquid: Stationary phase เป็นของเหลวที่ถูกดูดซับอยู่บนของแข็งซึ่งนำไปละลายใน ดัวทำละลายที่ระเหยง่ายแล้วเคลือบบน Solid supports ที่ไม่มีผลกระทบต่อการแยกสาร เมื่อสารตัวอย่างที่เป็นก๊าซของสารที่ผสมกันอยู่ สารตัวอย่างผ่านคอลัมน์จะแยกออกจากกัน ได้ด้วยการกระจายตัวที่ต่างกันระหว่างเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) กับเฟสคงที่ (Stationary phase) ถ้าก๊าซใดที่ละลายใน Liquid phase ได้ดีจะถูกจับไว้นานกว่าก๊าซที่ออก จากคอลัมน์ก่อนเพราะถูกจับไม่ดี
- Gas-Solid: Stationary phase เป็นของแข็ง มักใช้วิเคราะห์ Atmospheric gases (O₂, N₂, Ar, CO₂, H₂S, CO) ดังนั้นใช้แยกสารที่เป็นก๊าซหรือสารที่มีโมเลกุลเล็ก ๆ มักจะบรรจุด้วย Active solids เช่น Molecular sieves, silica gel และ Activated carbon เป็นต้น

2.6.3 องค์ประกอบหลักของก๊าซโครมาโทกราฟี

ส่วนสำคัญของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี คือ คอลัมน์ที่ทำหน้าที่แยกสารเนื้อเคียวออกจาก กัน โดยสารตัวอย่างที่จะนำเข้าสู่ระบบจะถูกฉีดเข้าอินเจกเตอร์และผสมกับก๊าซพา (Carrier gas) ใน เฟสเคลื่อนที่ เพื่อนำสารตัวอย่างไปยังคอลัมน์ (Stationary phase) แล้วตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัด สัญญาณ สัญญาณการตรวจวัดที่ได้จากเครื่องตรวจวัดสัญญาณจะถูกบันทึกและแสดงผลการ วิเคราะห์ ดังแผนภาพที่ 2.7 ซึ่งส่วนประกอบหลักของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี ได้แก่ อินเจกเตอร์, กอลัมน์โครมาโทกราฟี และ เตาอบ ประกอบอยู่ภายในตัวเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี ดังภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.7 องค์ประกอบหลักของก๊าซโครมาโทกราฟี ที่มา : รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์. <u>เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง " ก๊าซโครมาโทกราฟี "</u> [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.docstoc.com/docs/45375250/Gas-Chromatography-GC--squalane [18]

1. ก๊าซพา

ก๊าซพาที่ใช้เป็น Mobile phase นั้นต้องเป็นก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำปฏิกิริยาสารตัวอย่างที่ทคสอบ ใด้แก่ N₂, He, Ar, CO₂ หน้าที่ของก๊าซพา คือ นำก๊าซตัวอย่างจากจุคฉีค (Sample injection port) ไป ยังหัววัดสัญญาณ ซึ่งก๊าซพาต้องผ่าน Filter หรือ Gas Traps ก่อน และต้องควบคุมให้อัตราการไหล ของก๊าซคงที่ สำหรับ Packed column อัตราการไหลของก๊าซพาอยู่ในช่วง 25-150 มิลลิลิตรต่อนาที ส่วน Capillary column อัตราการไหลของก๊าซพาอยู่ในช่วง 1-25 มิลลิลิตรต่อนาที

2. อินเจคเตอร์

การนำสารเข้าสู่ระบบจะใช้การฉีด โดยเพิ่มอุณหภูมิภายในของอินเจคเตอร์ ให้สูงกว่าใน เตาอบ ประมาณ 50 °C เพื่อทำให้ตัวอย่างกลายเป็นไอและส่งเข้าสู่คอลัมน์ด้วยก๊าซพาในเฟส เคลื่อนที่

3. คอลัมน์โครมาโทกราฟี

ตัวอย่างที่กลายเป็นไอจะเข้าสู่คอลัมน์ซึ่งเป็นเฟสคงที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิคคือ ก. Packed column ประกอบไปด้วย Solid material ที่เฉื่อย มีเนื้อละเอียดเคลือบด้วย Stationary phase ความยาวของ Packed column จะอยู่ประมาณ 1.5-10 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4 มิลลิเมตร

บ. Capillary column เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.2 มิลลิเมตร ประกอบด้วย Wall coated open tubular เคลือบผนังภายในด้วย Liquid stationary phase และ Support coated tubular เคลือบผนัง ภายในด้วย Solid stationary phase

4. เตาอบ

เป็นส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์ การควบคุมอุณหภูมิมีความละเอียคถึง 0.1 องศา เซลเซียส การตั้งค่าอุณหภูมิขึ้นอยู่กับจุคเดือดของตัวอย่าง โดยปกติแล้วอุณหภูมิของคอลัมน์จะตั้ง ไว้สูงกว่าจุคเดือดของตัวอย่างขณะที่ตัวอย่างเคลื่อนที่ผ่าน Stationary phase ถ้าสารประกอบแต่ละ ชนิดในตัวอย่างมีจุดเดือดใกล้เคียงกัน จะตั้งค่าอุณหภูมิเพียงก่าเดียว แต่ถ้าสารประกอบแต่ละชนิด ในตัวอย่างมีช่วงจุดเดือดช่วงกว้างจะใช้ก่าจุดเดือดของสารประกอบแต่ละตัวในการแยก กล่าวคือ อุณหภูมิของคอลัมน์จะก่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งการแยกเสร็จสิ้น



ภาพที่ 2.8 เครื่องก๊าซโครมาโตรกราฟี (SHIMADZU Gas Chromatograph รุ่น GC-8A) [20] ที่มา : SHIMADZU. Accessories and Supplies for Shimadzu Gas Chromatographs [Online]. Available from: http://www.chemshow.cn/UploadFile/datum/1003/ shjohntec_2008218115733800771.pdf


ภาพที่ 2.9 ส่วนแสดงผลข้อมูล (C-R8A Chromatopac) ที่มา : SHIMADZU. Accessories and Supplies for Shimadzu Gas Chromatographs [Online]. Available from: http://www.chemshow.cn/UploadFile/datum/1003/ shjohntec_2008218115733800771.pdf [20]

5. เครื่องตรวจวัคสัญญาณ

การเลือกใช้หัววัดสัญญาณในการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับความจำเพาะของตัวอย่าง คือ (1) Nonselective detectorใช้งานได้กว้างขวาง (2) Selective detector จะใช้กับสารประกอบต่าง ๆที่มี คุณสมบัติทางเคมีหรือทางฟิสิกส์เหมาะกับหัววัดนั้นๆ (3) Specific detector จะเหมาะกับ สารประกอบที่สนใจเท่านั้น ซึ่งลักษณะการแสดงผลจะแสดงออกทางตัวแสดงผลข้อมูล (Recorder) ดังภาพที่ 2.9

เมื่อสารถูกแยกและทำการวิเคราะห์ หน่วยประมวลผลจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาใน รูปของโครมาโทแกรม ซึ่งจะแสดง % Abundance และ Retention time เครื่องจะสามารถวิเคราะห์ หากวามสูงของพีก และพื้นที่ใต้พีกได้ โดยปรับเทียบกับปริมาณสารมาตรฐานแสดงดังภาพที่ 2.10



C-R8A CHROMATOPAC CH=1 Report No.=4 DATA=1:@CHRM1.C00 12/08/03 14:17:1
** CALCULATION REPORT **

CH	PKNO	TIME	AREA	HEIGHT	MK	I DNO	CONC	NAME
1	1	0.342	3134	119			0.1202	
	2	1.046	2239454	340305	SV		85.9062	
	3	1.796	49243	5634	Т		1.889	
	4	2.667	162450	10759	Т		6.2317	
	5	5.213	111270	3685	Т		4.2684	
	6	6.88	41308	992	ΤV		1.5846	
						-	N	
		TOTAL	2606860	361493			100	

ภาพที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่าง % Abundance และ Retention time ในการวิเคราะห์ ด้วยก๊าซโครมาโทกราฟี

2.7 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี [19]

ก๊าซโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการแยกสารตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ นำไปใช้เพื่อการตรวจสอบชนิคของสารหรือหาปริมาณสารได้ ซึ่งมีข้อมูล 3 ประการคือ

- เวลาที่สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ด้วยก๊าซพาผ่านคอลัมน์จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสูงสุดของพีก เรียกว่า Retention time มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
- 2. ขนาดของพีก คือ พื้นที่ใต้พึกและความสูงพึก สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- ลักษณะของพีคที่ได้จากโครมาโทแกรมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณได้

2.7.1 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยก๊าซโครมาโทกราฟี

เป็นการตรวจสอบชนิดของสารในตัวอย่างโดยทำการวิเคราะห์พีคของตัวอย่างเปรียบเทียบ ก่า Retention time ของสารมาตรฐานที่ภาวะต่าง ๆ อย่างเดียวกันและสามารถระบุแต่ละพีคว่าเป็น พีคของสารใด การวัด Retention time ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องที่ใช้ควบคุมภาวะต่าง ๆ ถ้า มีการควบคุมไม่คงที่ ทำให้ผลที่ได้เปลี่ยนไป เช่น การควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์ ถ้าต้องการให้ Retention time อยู่ในช่วง ±1% อุณหภูมิของคอลัมน์ต้องควบคุมให้อยู่ในช่วง ±0.3 องศา-เซลเซียส นอกจากนี้ขนาดของสารตัวอย่างที่ฉีดเข้าเครื่อง มีความสำคัญมาก เพราะถ้าฉีดสารเข้าไป มาก ทำให้เกิด Column overloaded พืกที่ตรวจวัดเปลี่ยนไปทำให้ค่า Retention time ผิดไป

2.7.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยก๊าซโครมาโทกราฟี

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ได้มาจากการเตรียมสาร มาตรฐานให้มีความเข้มข้นต่างกันและต้องทำการวิเคราะห์ภายใต้ภาวะเดียวกัน แล้วนำมาสร้าง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใต้พีคกับความเข้มข้นของสารมาตรฐาน ซึ่งจะได้สมการเส้นตรง แล้วนำพื้นที่ใต้พีคของสารตัวอย่างไปอ่านค่าในสมการเส้นตรงจะได้ความเข้มข้นของสารตัวอย่าง ออกมา แต่เทคนิคนี้มีข้อจำกัด คือ (1) ปริมาณของสารตัวอย่างที่วิเคราะห์ต้องอยู่ในช่วง Calibration curve (2) สารตัวอย่างที่วิเคราะห์ต้องไม่ฉีดเข้าไปมากจนเกิด Overloaded (3) สารมาตรฐานและสาร ตัวอย่างที่ใช้ต้องทราบปริมาณแน่นอน

บทที่ 3 การออกแบบเครื่องมือวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาระบบกำเนิดพลาสมาสำหรับใช้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดย แบ่งแผนงานวิจัยออกเป็นสี่ส่วนคือ การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงย่านความถี่ต่ำ การ ออกแบบและสร้างชุดกำเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ อุปกรณ์สำหรับการ ทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงย่านความถี่ต่ำและการทดลองผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยมีแผนภาพ ของระบบดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 แผนภาพระบบผลิตก๊าซไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมาฟอร์มมิงแบบแบริเออร์คิสชาร์จ

การออกแบบเครื่องมือสำหรับคำเนินงานวิจัยตามภาพที่ 3.1 เริ่มจากการพัฒนาแหล่งจ่าย ใฟฟ้าแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำที่สามารถปรับขนาคแรงคันไฟฟ้าและความถิ่ได้ สำหรับจ่าย กำลังไฟฟ้าให้แก่ชุคกำเนิคพลาสมาแบบไคอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ (DBD reactor) ทั้งแบบ แผ่นกู่ขนานและแบบโคแอ็กเซียล ซึ่งภายในบรรจุเอทานอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เพื่อศึกษาการผลิต ก๊าซไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงจากเอทานอลในสถานะของเหลวและการให้ความร้อน เพื่อเปลี่ยนเป็นไอระเหย โดยควบคุมอุณหภูมิคงที่ก่าหนึ่งพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนขนาคแรงคันไฟฟ้า และความถิ่ ในแต่ละเงื่อนไขจะเก็บก๊าซตัวอย่างที่ออกจากชุดกำเนิคพลาสมาด้วยเครื่องแก้วคักจับ ก๊าซหนักและต่อเข้าถุงเก็บก๊าซ (Gas Sampling Bag) เพื่อนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องก๊าซ โครมาโทก ราฟี (Gas Chromatography) เพื่อหาขนาดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ให้ประสิทธิภาพในการผลิต ก๊าซไฮโครเจนได้สูง

3.1 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงย่านความถี่ต่ำ

จากการศึกษาข้อมูลความต้องการด้านเทคนิคของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง ได้นำมาออกแบบโครงสร้างของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงที่แปรเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า และความถิ่ได้ดังแผนภาพในภาพที่ 3.2 ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง วงจรขับหม้อ แปลงไฟฟ้า วงจรกำเนิดความถิ่ปรับค่าได้ วงจรนับความถิ่ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ วงจรสำหรับตรวจวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของโหลด (Load)

การทำงานของระบบเริ่มจากวงจรกำเนิดความถี่ผลิตสัญญาณที่มีความถี่และขนาดตามค่า ซึ่งปรับไว้ ป้อนเข้าวงจรขยายสัญญาณย่านความถี่เสียง (Audio power amplifier) เพื่อสร้าง สัญญาณขับผ่านหม้อแปลงขับ (Driving Transformer) แบบแยกฉนวนทนแรงคันสูงระหว่างขด ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ความถี่ที่ผลิตได้แสดงผลด้วยวงจรนับความถี่ สัญญาณขับนี้จะส่งเข้าขดปฐม ภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงคันสูงก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำเพิ่มแรงคันไฟฟ้าขึ้นตามอัตรารอบของ หม้อแปลงไฟฟ้าก่อนจ่ายให้แก่โหลดดังภาพที่ 3.3 ขั้วไฟฟ้าทางออกของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงลันไฟฟ้าแรงสูงได้ ออกแบบวงจรลดทอนแรงคันไฟฟ้า ทำให้สามารถวัด (Monitor) ขนาดของแรงคันไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าผ่านวงจรลดทอนและวงจรแปลงผันกระแสเป็นแรงคันไฟฟ้าได้ตามลำดับด้วยเครื่อง อ่านรูปสัญญาณ (Oscilloscope)



ภาพที่ 3.2 แผนภาพโครงสร้างของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงที่ออกแบบขึ้น



ภาพที่ 3.3 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำที่ออกแบบขึ้น

3.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง

งานวิจัยนี้เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงคันสูงสำหรับจุดหลอดนีออนป้ายโฆษณาของ บริษัท Senza Coltelli รุ่น 10.000/30CM เนื่องจากมีราคาประหยัด หม้อแปลงที่เลือกเป็นหม้อแปลง แกนเหล็กมีอัตรารอบ 1:45 สามารถแปลงแรงคันไฟฟ้าจาก 220 Vrms เป็น 10 kVrms หรือ คิดเป็น 2x √2 x 10 = 28 kVpp จ่ายกระแสได้มากกว่า 15 mA (rms) ทางเข้าขดปฐมภูมิจะรับสัญญาณขับ จากขดทุติยภูมิของหม้อแปลงขับ ส่วนขดทุติยภูมิจ่ายไฟฟ้าให้โหลดโดยมีวงจรสำหรับตรวจวัด แรงคันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าอ่านค่าด้วยเครื่องอ่านรูปสัญญาณ ได้แก่ วงจรลดทอน 1:1000 และ วงจรแปลงผันกระแสเป็นแรงคันไฟฟ้าที่สัดส่วน 0.5 mA /V ดังแสดงในภาพที่ 3.4 วงจรส่วนนี้ ทั้งหมดจะประกอบในโครงบรรจุที่เป็นวัสดุฉนวนไฟฟ้าและใช้สายไฟฟ้าที่ทนแรงคันสูง 30 kV เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ขับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ประกอบด้วย วงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้ วงจรอ่านก่าความถี่ และวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงคันต่ำ ซึ่งเป็น ส่วนประกอบที่อยู่ภายในตัวเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.4 วงจรสำหรับตรวจวัดค่า V-I ของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงคันสูง

3.1.2 วงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้และวงจรอ่านค่าความถี่

วงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้ที่ออกแบบขึ้นแสดงในภาพที่ 3.5 เลือกใช้ไอซีเบอร์ ICL 8038 สามารถกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือสัญญาณรูปคลื่นซายน์ สัญญาณรูปสี่เหลี่ยม และสัญญาณรูปสามเหลี่ยม แบ่งความถี่เป็น 2 ช่วง คือ 50 - 1999 Hz และ 2 – 5 kHz ตัวต้านทาน ปรับค่าได้ 5 kΩเป็นตัวต้านทานใช้ในการปรับค่าความถี่ ส่วนตัวต้านทานปรับค่าได้ 1 kΩ ใช้ใน การปรับค่า Duty Cycle = 50% และสัญญาณขาออกของไอซี ICL 8038 สามารถเลือกกำเนิด สัญญาณได้ 3 รูปแบบคือสัญญาณรูปคลื่นซายน์ สัญญาณรูปสี่เหลี่ยม และสัญญาณรูปสามเหลี่ยม โดยเลือกรูปสัญญาณที่ต้องการจากสวิตซ์ ขนาดของแรงคันไฟฟ้าปรับค่าได้ด้วยตัวต้านทานปรับค่า ได้ 100 kΩที่ขาเข้าของไอซี LM318 (A) ซึ่งเป็นออปแอมป์ขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส มี กำลังขยาย 1.4 เท่า สัญญาณขาออกของออปแอมป์ส่งไปยังวงจรขยายกำลังย่านความถี่เสียงขนาด กำลัง 100 W ส่วนสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมขาออกของไอซี ICL 8038 ส่งไปยังออปแอมป์ไอซี LM318 (B) ทำหน้าที่ขยายสัญญาณก่อนส่งไปยังไอซี NE555 ซึ่งเป็นวงจรโมโนสเตเบิลของวงจรเปลี่ยน ความถี่เป็นแรงคันไฟฟ้า (Ratemeter) เพื่ออ่านค่าความถี่ด้วย Digital Voltage Meter ที่ได้พัฒนาขึ้น ให้สามารถวัดแรงคันไฟฟ้าได้สองช่วง คือ 0-2 mV และ 0-20 V



ภาพที่ 3.5 วงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้และวงจรอ่านค่าความถี่ที่ออกแบบขึ้น

3.1.3 ระบบขับสัญญาณย่านความถี่เสียง

ระบบขับสัญญาณประกอบด้วย วงจรงยายกำลังย่านความถี่เสียงขนาดกำลัง 100 W (วงจร แสดงในภาคผนวก ง) และหม้อแปลงขับขนาด 70 W การกำเนิดสัญญาณขับเริ่มจากการป้อน สัญญาณจากวงจรกำเนิดความถี่เข้าวงจรงยายสัญญาณส่งให้หม้อแปลงไฟฟ้าขับที่ออกแบบแยก ฉนวนขดปฐมภูมิและทุติยภูมิเฉพาะเพื่อป้องกันการอาร์ก จากการเหนี่ยวนำผ่านสภาวะตัวเก็บประจุ (Capacitance induce) ของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงขณะขับสัญญาณ หม้อแปลงขับนี้มีอัตรารอบ 1:9 สามารถรับแรงดันทางเข้า 24 Vrms และแปลงแรงดันไฟฟ้าทางออกเป็น 220 Vrms จากการ ทดสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าของระบบขับสัญญาณให้โหลดที่เป็นหลอดไฟฟ้าชนิดจุดไส้ ขนาด 60 W, 220 V พบว่าสามารถขับโหลดได้ในย่านความถี่ระหว่าง 100 Hz -5 kHz ซึ่งเป็นย่านสัญญาณ รูปกลิ่นซายน์ (Sine wave) จากหม้อแปลงขับไม่ผิดเพี้ยน



ภาพที่ 3.6 ส่วนประกอบภายในของเครื่องกำเนิคสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ

3.1.4 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ใด้ออกแบบแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงกับวงจรย่อยสองแบบคือ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด ±43 โวลต์ 3 แอมแปร์ สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ดังภาพที่ 3.7 (ก) และ ขนาด +12 โวลต์ สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับพัดลมดังภาพที่ 3.7 (ค) ซึ่งทำหน้าที่ระบายความร้อน ให้กับระบบ อีกส่วนหนึ่งเป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ผ่านการควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ ด้วยไอซีเร็กกูเลเตอร์ขนาดแรงดันไฟฟ้า ±9 โวลต์สำหรับจ่ายวงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้ และ ขนาด +9 โวลต์ สำหรับจ่ายวงจรอ่านก่าความถี่ดังภาพที่ 3.7 (ข)



(ก) แหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด ± 43 โวลต์ สำหรับจ่ายเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์



(ข) แหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด ±9 โวลต์ สำหรับวงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้และวงจรอ่าน ค่าความถี่



(ก) แหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด +12 โวลต์ สำหรับพัดลมระบายความร้อน
 ภาพที่ 3.7 แสดงวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

3.2 การออกแบบชุดกำเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ

การออกแบบชุดกำเนิดพลาสมาจะต้องกำนึงถึง ความเข้มของสนามไฟฟ้า ช่วงกว้างของ ความถี่ที่สามารถปรับได้ ความสะควกและความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน ชุดกำเนิดพลาสมา แบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จที่พบเห็นบ่อยในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ แบบแผ่น คู่ขนานและแบบทรงกระบอก (โคแอ็กเซียล)

3.2.1 ชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นคู่ขนาน

ในการออกแบบชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นคู่ขนานที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้วัสดุไดอิเล็กทริกที่ ทำจากแก้ว ซึ่งการออกแบบได้กำนึงถึงสภาพความเข้มสนามไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ แผ่นทองแดงและแผ่นตะแกรงอะลูมิเนียมที่ใช้เป็นอิเล็กโทรด ระยะห่างระหว่างแผ่น และชนิดของ วัสดุไดอิเล็กทริก

วัสดุใดอิเล็กทริกที่เลือกใช้เป็นแผ่นกระจก 2 แผ่น มีขนาดพื้นที่ 12 ซม × 14 ซม หนา 2 มิลลิเมตร มีช่องว่างระหว่างกัน 1 มิลลิเมตร ประกบด้วยขั้วอิเล็กโทรดทำด้วยแผ่นทองแดงและ ตะแกรงอะลูมิเนียมขนาดพื้นที่ 8 ซม × 8 ซม ดังภาพที่ 3.8 ยึดประกบกันด้วยแผ่นอะคลีลิกทั้งสอง ด้านพร้อมใส่สกรูเพื่อยึดขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองไว้ให้แน่นเป็นการทำให้สนามไฟฟ้ากงที่ ส่วนล่าง ของชุดกำเนิดพลาสมาเชื่อมต่อท่อ สำหรับป้อนก๊าซไหลเข้าเพื่อทำให้ของเหลวที่อยู่ในชุดกำเนิด พลาสมาเกิดฟองขึ้นภายใน ส่วนด้านบนต่อท่อให้ก๊าซออกสู่ระบบเก็บก๊าซ ดังภาพที่ 3.9

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษา เปรียบเทียบชนิดของวัสดุไดอิเล็กทริก ความหนาของวัสดุไดอิเล็ก-ทริก ช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรด และขนาดพื้นที่ของแผ่นทองแดงและตะแกรงอะลูมิเนียม ที่มีผล ต่อความแรงของสนามไฟฟ้าสูงสุดและสภาพทนสนามไฟฟ้าสูงสุดของวัสดุ



ภาพที่ 3.8 โครงสร้างชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นกู่ขนาน (ก) ภาคตัดขวางของชุดกำเนิดพลาสมาแบบ แผ่นกู่ขนาน (ข) แผ่นทองแดงขนาด 8 ซม× 8 ซม ติดกับแผ่นกระจกด้านหนึ่ง (ก) แผ่น อะลูมิเนียมแบบกริดขนาด 8 ซม× 8 ซม ติดกับแผ่นกระจกด้านหนึ่ง



ภาพที่ 3.9 ชุดกำเนิดพลาสมา DBD แบบแผ่นกู่ขนานขนาด 12 ซม × 14 ซม

3.2.2 ชุดกำเนิดพลาสมาแบบทรงกระบอก

ในการออกแบบชุคกำเนิดพลาสมาแบบทรงกระบอกมีข้อได้เปรียบกว่าแบบแผ่นคู่ขนาน ซึ่งมีความเข้มสนามไฟฟ้าสูงกว่า และสภาพความเข้มสนามไฟฟ้าสูงสุดขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางของท่อทองแดงด้านในและเทปทองแดงด้านนอกซึ่งใช้เป็นอิเล็กโทรด ระยะห่างระหว่าง อิเล็กโทรด และความหนาของวัสดุไดอิเล็กทริก การออกแบบเลือกใช้ท่อแก้วหนา 2.2 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 1.84 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.405 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3.12 (ก) โดยแก้วทำหน้าที่เป็นวัสดุไดอิเล็กท ริกและชุดอุปกรณ์ทดลอง ซึ่งช่องว่างระหว่างแก้วและแท่งอิเล็กโทรดภายในห่างกันประมาณ 2.2 มิลลิเมตร แท่งอิเล็กโทรดภายในทำมาจากท่อทองแดง ส่วนอิเล็กโทรดภายนอกใช้เทปทองแดงที่มี งนาดพื้นที่ 27.71 ตารางเซนติเมตร ดังแบบโครงสร้างในภาพที่ 3.12 (ก) และรูปอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น ในภาพที่ 3.10

3.2.3 ชุดกำเนิดพลาสมาแบบทรงกระบอกที่ใช้ความร้อน

ใช้ท่อแก้วหนา 1.2 มิลลิเมตร เป่าเชื่อมกับแก้วคนโท เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.81 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.56 เซนติเมตร ดังภาพที่ 3.12 (ข) ใช้ท่อแก้วเป็นวัสดุไดอิ เล็กทริก ซึ่งช่องว่างระหว่างแก้วและแท่งอิเล็กโทรดภายในห่างกันประมาณ 1.5 มิลลิเมตร แท่ง อิเล็กโทรดภายในทำมาจากท่อทองแดง ทำหน้าที่เป็นท่อนำก๊าซจากภายนอกเข้าสู่ด้านล่างในตัว เพื่อสร้างฟองอากาศปริมาณมาก ฟุ้งผ่านบริเวณที่เกิดพลาสมาของ ส่วนอิเล็กโทรดภายนอกใช้เทป ทองแดงที่มีขนาดพื้นที่ 36.094 ตารางเซนติเมตร พันรอบท่อแก้วที่เป่าเชื่อมกับแก้วคนโท ดังแบบ โกรงสร้างในภาพที่ 3.12 (ง) ภายในแก้วคนโทบรรจุของเหลวปริมาตร 350 มิลลิลิตร ดังรูปอุปกรณ์ ที่สร้างขึ้นในภาพที่ 3.11



ภาพที่ 3.10 ชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วทรงกระบอก



ภาพที่ 3.11 ชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วคนโท



ภาพที่ 3.12 โครงสร้างชุดกำเนิดพลาสมาแบบทรงกระบอก (ก) ภาพตัดขวางของท่อแก้วขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกเท่ากับ 1.405 และ 1.84 เซนติเมตร ตามลำดับ (ข) ภาพตัดขวางของท่อแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกเท่ากับ 1.56 และ 1.81 เซนติเมตร ตามลำดับ (ก) ขนาดและ โครงสร้างของชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อ แก้ว (ง) ขนาดและ โครงสร้างของชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วกนโท

บทที่ 4

วิธีดำเนินงานและผลการวิจัย

การดำเนินงานวิจัยในการผลิตก๊าซไฮโครเจนด้วยกระบวนการพลาสมารีฟอร์มมิง ประกอบด้วยขั้นตอนการทคสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำที่พัฒนาขึ้น การทคสอบการกำเนิคพลาสมาของชุคพลาสมาที่สร้างขึ้น ทคลองผลิตก๊าซไฮโครเจนจากเอทานอล ในสถานะของเหลว และทคลองผลิตก๊าซไฮโครเจนจากเอทานอลด้วยการเปลี่ยนสถานะให้ กลายเป็นไอระเหย มีรายละเอียคการคำเนินงานดังนี้

4.1 การทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงย่านความถี่ต่ำ

การทดสอบสมรรถนะแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงที่พัฒนาขึ้น คำเนินการโดย จัดระบบทดสอบดังแผนภาพในภาพที่ 4.1 แบ่งการทดสอบเป็น 5 กรณี คือ 1) การทำงานแบบเปิด วงจร 2) จ่ายกำลังไฟฟ้าแก่โหลดตัวต้านทาน 10 MΩ ขนาด 10 W ในถังฉนวนน้ำมัน 3) จ่ายไฟฟ้า แก่ชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นกู่ขนาน 4) จ่ายไฟฟ้าแก่ชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้ว 5) จ่ายไฟฟ้า แก่ชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วกนโท



ภาพที่ 4.1 แผนภาพระบบทคสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงที่พัฒนาขึ้น

4.1.1 ทดสอบการทำงานแบบเปิดวงจร

การทคสอบเพื่อศึกษาย่านตอบสนองความถี่ (Frequency Bandwidth) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับแรงคันสูงที่พัฒนาในสภาวะไม่มีโหลด ด้วยการแปรเปลี่ยนความถี่รูปคลื่นซายน์ใน ย่าน 50 Hz-1 kHz ที่แรงคันไฟฟ้าทางออกสูงสุดที่ 10, 20 และ 30 kVpp ตามลำคับ แล้ววัคขนาด ของแรงคันไฟฟ้าทางออกจากวงจรลดทอนแรงคันไฟฟ้า ผลทดสอบความสัมพันธ์ของความถี่และ แรงคันไฟฟ้าเป็นไปตามกราฟภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อไม่ต่อโหลด

จากผลทดสอบย่านตอบสนองความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเมื่อไม่ต่อโหลด พบว่าสามารถ ตอบสนองความถี่ที่แรงคันไฟฟ้าสูงสุด 30 kVpp ได้ดีในย่าน 380-590 Hz และความถี่ที่ให้ แรงคันไฟฟ้าสูงสุด คือ 470 Hz นอกจากนี้พบว่าที่ขนาดแรงคันไฟฟ้าสูงสุด 10 kVpp, 20 kVpp และ 30 kVpp มีความถี่จำกัดค้านสูง (Corner Frequency, f_c) ที่ 710 Hz, 620 Hz และ 590 Hz ตามถำดับ ขีดจำกัดนี้มีผลมาจากค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุระหว่างชั้นขดลวดทุติยภูมิ สร้าง สภาพสมมูลเป็นตัวกรองความถี่ต่ำ (LC low pass filter) ส่งผลถึงการตอบความถี่ที่แคบลง

4.1.2 ทดสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลดตัวต้านทาน 10 MΩ ขนาด 10 W

การทดสอบเพื่อศึกษาย่านตอบสนองความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่พัฒนาใน สภาวะที่โหลดเป็นตัวต้านทาน 10 MΩ ขนาด 10 W บรรจุในถังฉนวนน้ำมัน ด้วยการแปรเปลี่ยน กวามถี่รูปคลื่นซายน์ในย่าน 50 Hz-1 kHz ที่แรงคันไฟฟ้าทางออกสูงสุดที่ 10, 20 และ 30 kVpp ตามถำคับ แล้ววัดขนาดของแรงคันไฟฟ้าทางออกจากวงจรลดทอนแรงคันไฟฟ้า ผลทคสอบ ความสัมพันธ์ของความถี่และแรงคันไฟฟ้าเป็นไปตามกราฟภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงคันไฟฟ้าและความถี่เมื่อโหลดเป็นตัวค้านทาน

จากผลทดสอบย่านตอบสนองความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเมื่อต่อโหลดตัวต้านทาน 10 MΩ พบว่าการตอบสนองของความถี่ไม่เปลี่ยนแปลงมาก สามารถตอบสนองความถี่ที่ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 30 kVpp ได้ดีในช่วง 290-590 Hz และความถี่ที่ให้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด คือ 440 Hz ขณะที่ขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 10 kVpp, 20 kVpp และ 30 kVpp มีความถี่จำกัดที่ 770 Hz, 650 Hz และ 590 Hz ตามลำดับ อย่างไรก็ตามแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าก่าสูงสุดในบริเวณย่าน ตอบสนองความถี่สามารถขับสัญญาณทางเข้าให้เพิ่มขึ้นได้แต่ต้องระมัดระวังแรงดันไฟฟ้าเกินก่าที่ กาดหวังขณะปรับเปลี่ยนความถี่

4.1.3 ทดสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลดที่เป็นชุดกำเนิดพลาสมาแบบแบริเออร์ดิสชาร์จที่มี โครงสร้างเป็นแผ่นคู่ขนาน

การทดสอบทำโดยจัดชุดกำเนิดพลาสมาที่มีโครงสร้างเป็นแผ่นคู่ขนานเป็นโหลดของ แหล่งจ่ายไฟฟ้าและป้อนอากาศผ่านชุดกำเนิดพลาสมาที่อัตราการไหล 2.6 มิลลิลิตรต่อนาที เพื่อ ศึกษาผลของย่านตอบสนองความถึ่ขณะมีโหลด ด้วยการแปรเปลี่ยนความถึ่รูปคลื่นซายน์ในย่าน 50 Hz-1 kHz ที่แรงดันไฟฟ้าทางออกสูงสุดที่ 10, 20 และ 30 kVpp ตามลำดับ แล้ววัดขนาดของ แรงดันไฟฟ้าทางออกจากวงจรลดทอนแรงดันไฟฟ้า ผลทดสอบความสัมพันธ์ของความถึ่และ แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามกราฟภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมา แบบแผ่นคู่ขนาน

จากผลทดสอบช่วงตอบสนองความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมาแบบ แผ่นคู่ขนาน พบว่ามีผลกระทบต่อย่านตอบสนองความถี่ แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้ายังสามารถ ตอบสนองความถี่ที่แรงคันไฟฟ้าสูงสุด 30 kVpp ได้ดีในช่วง 290-500 Hz ความถี่ไฟฟ้าที่ให้ แรงคันไฟฟ้าสูงสุด คือ 410 Hz แต่ที่ขนาดแรงคันไฟฟ้าสูงสุด 10 kVpp, 20 kVpp และ 30 kVpp พบว่ามีความถี่จำกัดที่เปลี่ยนไป คือ 500 Hz, 470 Hz และ 500 Hz ตามลำคับ จะเห็นว่าความถี่ที่ให้ แรงคันไฟฟ้าสูงสุดจะเลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งความถี่ต่ำกว่า เนื่องจากการตอบสนองความถี่ในกรณีนี้ นอกจากเป็นโหลดชนิดคาปาซิเตอร์แล้วยังขึ้นกับการไอออไนซ์ของก๊าซในแผ่นคู่ขนานด้วย

4.1.4 ทดสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลดที่เป็นชุดกำเนิดพลาสมาแบบแบริเออร์ดิสชาร์จที่มี โครงสร้างเป็นแบบทรงกระบอก

4.1.4.1 ทคสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลคชุคกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้ว

การทคสอบทำโดยจัดชุดกำเนิดพลาสมาที่มีโครงสร้างแบบทรงกระบอกทำค้วยท่อแก้วเป็น โหลดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าและป้อนอากาศผ่านชุดกำเนิดพลาสมาค้วยอัตราการไหล 2.6 มิลลิลิตรต่อ นาที เพื่อศึกษาผลของย่านตอบสนองความถึ่ขณะมีโหลด ด้วยการแปรเปลี่ยนความถึ่รูปคลื่นซายน์ ในย่าน 50 Hz-1 kHz ที่แรงดันไฟฟ้าทางออกสูงสุดที่ 10, 20 และ 30 kVpp ตามลำดับ แล้ววัดขนาด ของแรงดันไฟฟ้าทางออกจากวงจรลดทอนแรงดันไฟฟ้า ผลทดสอบความสัมพันธ์ของความถึ่และ แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามกราฟภาพที่ 4.5



ภาพที่ 4.5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมา แบบทรงกระบอก

จากผลทคสอบการตอบสนองความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมาแบบ ทรงกระบอก พบว่ามีผลกระทบต่อย่านตอบสนองความถี่มาก โดยมีย่านตอบสนองความถี่ที่แรงคัน สูงสุด 30 kVpp ได้ดีในช่วง 320-530 Hz ความถี่ไฟฟ้าที่ให้แรงคันไฟฟ้าสูงสุด คือ 410 Hz และที่ ขนาดแรงคันไฟฟ้าสูงสุด 10 kVpp, 20 kVpp และ 30 kVpp พบว่ามีความถี่จำกัดที่เปลี่ยนไป คือ 530 Hz, 560 Hz และ 590 Hz ตามลำคับ ในกรณีของโครงสร้างแบบทรงกระบอกจะให้ย่าน ตอบสนองความถี่ด้านสูงมากกว่า

4.1.4.2 ทคสอบการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลคชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วคนโท

การทคสอบทำโดยจัดชุดกำเนิดพลาสมาที่มีโครงสร้างทรงกระบอกแบบท่อแก้วคนโทเป็น โหลดให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าและป้อนอากาศผ่าชุดกำเนิดพลาสมาด้วยอัตราการไหล 2.6 มิลลิลิตรต่อ นาที เพื่อศึกษาผลของย่านตอบสนองความถึ่ขณะมีโหลด ด้วยการแปรเปลี่ยนความถึ่รูปคลื่นซายน์ ในย่าน 50 Hz-1 kHz ที่แรงดันไฟฟ้าทางออกสูงสุดที่ 10, 20 และ 30 kVpp ตามลำดับ แล้ววัดขนาด ของแรงดันไฟฟ้าทางออกจากวงจรลดทอนแรงดันไฟฟ้า ผลทดสอบความสัมพันธ์ของความถึ่และ แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามกราฟภาพที่ 4.6



ภาพที่ 4.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และแรงคันไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมา แบบทรงกระบอกท่อแก้วคนโท

จากผลการทดสอบการตอบสนองความถิ่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเมื่อโหลดเป็นชุดพลาสมา แบบทรงกระบอกท่อแก้วคนโท พบว่ามีผลกระทบต่อย่านตอบสนองความถิ่มาก โดยมีย่าน ตอบสนองความถิ่ที่แรงคันสูงสุด 30 kVpp ได้ดีในช่วง 320-500 Hz ความถิ่ไฟฟ้าที่ให้แรงคันไฟฟ้า สูงสุด คือ 380 Hz และที่ขนาดแรงคันไฟฟ้าสูงสุด 10 kVpp, 20 kVpp และ 30 kVpp พบว่ามีความถิ่ จำกัดที่เปลี่ยนไป คือ 680 Hz, 620 Hz และ 500 Hz ตามลำคับ ในกรณีของโครงสร้างแบบ ทรงกระบอกจะให้ย่านตอบสนองความถิ่ด้านสูงมากกว่าเช่นกัน

สรุปผลการตอบสนองความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับย่านความถี่ต่ำในภาวะโหลด ชนิดต่างๆ แสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่งขณะใช้งานทดลองในตำแหน่งแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าก่าสูงสุด บริเวณย่านตอบสนองความถี่สามารถขับสัญญาณทางเข้าให้เพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องระมัดระวัง แรงดันไฟฟ้าเกินก่าที่ควบกุมขณะปรับเปลี่ยนความถี่

ชนิดของโหลด	ช่วงกว้างความถื่	ความถี่ที่ทำให้ได้แรงดันสูงสุด (Hz)		ความถี่จำกัค, ${ m f}_{_{ m c}}$ (Hz)			
	(Hz)	10 kVpp	20 kVpp	30 kVpp	10 kVpp	20 kVpp	30 kVpp
เปิดวงจร	380-590	500	490	470	590	620	710
ตัวต้านทาน	290-590	590	500	440	770	650	590
แผ่นคู่ขนาน	290-500	470	410	410	500	470	500
ท่อแก้ว	320-530	500	440	410	590	560	530
ท่อแก้วคนโท	320-500	560	470	380	680	620	500

ตารางที่ 4.1 ผลการตอบสนองกวามถึ่งองแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับในภาวะโหลดชนิดต่างๆ

4.1.5 ทดสอบการใช้กำลังไฟฟ้าชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วคนโท

การทดสอบทำโดยจัดระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลด้วยชุดกำเนิด พลาสมาแบบท่อแก้วคนโท จากนั้นให้ความร้อนเอทานอลเหลวความเข้มข้น 99.8% โดยปริมาตร ให้เปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิ 83 องศาเซลเซียสและอาศัยแรงคันไอเคลื่อนก๊าซผ่านบริเวณ กำเนิดพลาสมาแบบ DBD เพื่อศึกษาการใช้กำลังไฟฟ้าขณะกำเนิดพลาสมาที่ขนาดของ แรงคันไฟฟ้า 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 kVpp และแปรเปลี่ยนความถี่ไฟฟ้าที่ 200, 350, 400, 450 และ 500 Hz ผลการทดลองได้กราฟกวามสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าและแรงคันไฟฟ้าที่ความถี่ กงที่ก่าหนึ่งๆ ดังภาพที่ 4.7



ภาพที่ 4.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คงที่ค่าหนึ่ง ของชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้วคนโท

ผลการทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นจะทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ กำลังไฟฟ้าของเครื่องเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าที่ความถี่ 350, 400, 450 และ 500 Hz พบว่าการใช้ กำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่ต่างกันมากเพราะช่วงความถี่นั้นมีค่าใกล้เคียงกัน เฉพาะที่ความถี่ 200 Hz พบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่สามารถขับแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่านี้

4.2 การทดสอบการกำเนิดพลาสมา

ในการทดสอบกำเนิดพลาสมาได้จัดระบบการทดสอบตามภาพที่ 4.8 โดยใช้ชุดกำเนิด พลาสมาแบบแผ่นคู่ขนาน ป้อนก๊าซอาร์กอนทางด้านล่างของชุดกำเนิดพลาสมาผ่านช่องว่าง ระหว่างแผ่นแก้วไดอิเล็กทริกสองแผ่นด้วยอัตราการไหล 2 ลิตรต่อนาทีและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโดย แปรเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้าจาก 10, 15, 20, 25 และ 30 kVpp ร่วมกับการทดลองแปรเปลี่ยน กวามถี่ไฟฟ้าจาก 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 และ 1000 Hz ตามลำดับในแต่ ละเงื่อนไขสังเกตลักษณะของพลาสมาที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นอิเล็กโทรดที่กั่นกลางด้วยแก้วพร้อม บันทึกรูปถ่าย ได้ผลทดลองดังภาพที่ 4.9 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาลักษณะสัญญาณรูปกลิ่นซายน์ที่อ่าน ด้วยออสซิลโลสโคป เปรียบเทียบระหว่างกรณีที่เกิดพลาสมาและกรณีไม่เกิดพลาสมา ที่กวามถี่ ไฟฟ้า 350 Hz แรงดันไฟฟ้าขนาด 30 kVpp ป้อนอากาศด้วยอัตราการไหล 2 ลิตรต่อนาที ได้ผลดัง ภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.8 การจัดระบบทคลองการกำเนิดพลาสมาแบริเออร์ดิสชาร์จแบบแผ่นคู่ขนาน



ภาพที่ 4.9 ลักษณะของพลาสมาจากชุดกำเนิดแบบแผ่นคู่ขนานที่แรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า ต่างๆ (ก) 200 Hz 30 kVpp (ข) 300 Hz 30 kVpp (ก) 400 Hz 24 kVpp (ง) 500 Hz 15 kVpp (ง) 600 Hz 10 kVpp (ฉ) 700 Hz 9 kVpp (ช) 800 Hz 6 kVpp (ซ) 900 Hz 5kVpp



ภาพที่ 4.10 สัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่อ่านด้วยออสซิลโลสโคป (ก) กรณีไม่เกิดพลาสมา (ข) กรณีไม่ เกิดพลาสมา

จากการทดลองในภาพที่ 4.9 การเกิดพลาสมาในชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นกู่ขนานจะเห็น ลักษณะการไอออไนซ์และปลดปล่อยแสงสีน้ำเงินเป็นเส้นๆ ระหว่างช่องว่างอิเล็กโทรด ซึ่งความ เข้มของกลุ่มพลาสมาขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ป้อนเข้าไป โดยแรงดันไฟฟ้า 30 kVpp ความถี่ไฟฟ้า 300 Hz จะเปล่งแสงสีน้ำเงินเข้มกว่าที่แรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าอื่น เมื่อเพิ่ม ความถี่ไฟฟ้าที่ 800 Hz แรงดันไฟฟ้า 6 kVpp การเกิดพลาสมาจะมีลักษณะเป็นเม็ด ๆ ซึ่งเรียกว่า ไม โครดิสชาร์จ และจากภาพที่ 4.10 เมื่อสังเกตุสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่อ่านด้วยออสซิลโลสโคป พบว่ากรณีที่เกิดพลาสมาบนเส้นสัญญาณจะมีลักษณะขอดพีกแตกเป็นเส้น ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงเกิดการ ไอออไนซ์ก๊าซ

นอกจากนี้ ได้ทดสอบชุดกำเนิดพลาสมาเป็นแบบท่อแก้วและท่อแก้วคนโท โดยต้ม แอลกอฮอล์ให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นสถานะก๊าซ ระเหยผ่านบริเวณขั้วอิเล็กโทรดของชุด พลาสมาด้วยแรงดัน ไอ เมื่อจ่ายแรงดัน ไฟฟ้าที่ 30 kVpp และความถี่ 350 Hz พบว่ามีลักษณะการ เกิดพลาสมารอบแกนกลางระหว่างขั้วไฟฟ้า ดังในภาพที่ 4.11



ภาพที่ 4.11 ลักษณะของพลาสมาจากชุดกำเนิดแบริเออร์ดิสชาร์จ (ก) แบบท่อแก้ว (ข) แบบท่อแก้ว คนโท

4.3 การทดสอบการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาชุดกำเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จเพื่อ ผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงกับเอทานอลที่ความดันบรรยากาศ ซึ่งสามารถทำ ปฏิกิริยารีฟอร์มมิงได้สูงที่อุณหภูมิต่ำ โดยพลาสมาทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจึงทำให้ได้ ประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนสูง ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ การ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง การเก็บก๊าซตัวอย่าง การทำพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะ ของเหลวหัวข้อที่ 4.3.3 และการทำพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะก๊าซหัวข้อที่ 4.3.4

4.3.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

อุปกรณ์การทคลองนอกจากชุดกำเนิดพลาสมาและแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงคันสูงแล้วชุด อุปกรณ์การเก็บก๊าซตัวอย่างหลังการกำเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ เป็นชุด อุปกรณ์ที่สำคัญในการนำผลิตภัณฑ์ก๊าซตัวอย่างที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์องก์ประกอบด้วย วิธีก๊าซโครมาโทกราฟี ซึ่งชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บก๊าซประกอบด้วย

4.3.1.1 ถุงเก็บก๊าซขนาด 1 ลิตร (Sampling bag)

ถุงเก็บก๊าซที่เลือกใช้มีขนาด 7 นิ้ว×7 นิ้ว ปริมาตร 1 ลิตร มีวาล์วเปิดปิดแบบ PP Screw Cap Combo Valve with Septum ดังแสดงในภาพที่ 4.12



ภาพที่ 4.12 ถุงเก็บก๊าซขนาด 1 ลิตร

4.3.1.2 เครื่องแก้วสำหรับดักจับก๊าซหนัก

เครื่องแก้วสำหรับคักจับโมเลกุลของเอทานอลและน้ำในสถานะของเหลว มีโครงสร้างคัง ภาพที่ 4.13 มีความยาว 23 เซนติเมตร กระเปราะกรองก๊าซมีความพรุนขนาค 100-160 mesh การคัก จับโมเลกุลของเอทานอลและน้ำอาศัยความเย็นจากน้ำแข็งเพื่อควบแน่น คังนั้นขณะใช้งานเครื่อง แก้วคักจับโมเลกุลของเอทานอลและน้ำจะแช่อยู่น้ำแข็งที่บรรจุในกระติกเทอร์มอส



ภาพที่ 4.13 เครื่องแก้วสำหรับคักจับก๊าซหนัก

4.3.1.3 เตาไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิชนิดปรับค่าได้

เตาไฟฟ้าทำหน้าที่ด้มเอทานอลเหลวให้เปลี่ยนเป็นเอทานอลสถานะก๊าซ โดยสามารถปรับ อุณหภูมิที่จุดเดือดและควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ตามต้องการ ในภาวะที่เอทานอลเดือดจะมีแรงดัน ใอระเหยเอทานอลให้เคลื่อนผ่านระบบพลาสมารีฟอร์มมิง เตาไฟฟ้าควบคุมอุณหภุมิชนิดปรับก่า ได้ที่ออกแบบขึ้นแสดงดังภาพที่ 4.14



ภาพที่ 4.14 เตาไฟฟ้าสำหรับปรับอุณหภูมิของระบบ

4.3.1.4 เครื่องปั้มอากาศขนาดเล็กและตัวปรับอัตราการไหลของอากาศ ชุดเครื่องปั้มอากาศที่สร้างขึ้นทำหน้าที่ป้อนอากาศเข้าสู่ระบบกำเนิดพลาสมาแบบใช้ อากาศเป็นตัวพา มีอัตราการไหลมากกว่า 2 ลิตรต่อนาที สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศและ ควบคุมอัตราไหลให้คงที่ มีลักษณะดังภาพที่ 4.15



ภาพที่ 4.15 เครื่องปั๊มอากาศขนาดเล็กและตัวปรับอัตราการไหลของอากาศ

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นในการจัคระบบผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารี ฟอร์มมิง ได้แก่ ชุดแคลมป์อุปกรณ์ ข้อต่อท่อ เทปพันเกลียว สายยางซิลิโคน จุกยาง วาล์ว บีกเกอร์ และเข็มฉีดยา เป็นต้น

4.3.2 การเก็บก๊าซตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างก๊าซในการทคลองเพื่อให้มีความคลาคเคลื่อนน้อยที่สุดมีขั้นตอนดังนี้ 4.3.2.1 ก่อนการเก็บก๊าซตัวอย่างไปวิเคราะห์ต้องดูดอากาศออกจากถุงเก็บก๊าซด้วยปั๊ม สุญญากาศทุกครั้งเพื่อไม่ให้ภายในถุงเก็บก๊าซมีก๊าซใดหลงเหลืออยู่

4.3.2. 2 ปีควาล์วถุงเก็บก๊าซก่อนนำไปเชื่อมต่อด้วยท่อสายยางซิลิโคนกับเครื่องแก้ว สำหรับดักจับก๊าซหนักเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปปะปนในถุงเก็บก๊าซ เพราะอาจทำให้ผลการทดลอง กลาดเกลื่อน

4.3.2.3 เมื่อเริ่มเดินเครื่องกำเนิดพลาสมา เปิดวาล์วถุงเก็บก๊าซเพื่อเริ่มเก็บก๊าซตัวอย่าง เมื่อ เก็บก๊าซตัวอย่างเสร็จปิดวาล์วถุงเก็บก๊าซ แล้วเปลี่ยนถุงเก็บก๊าซใหม่จนครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จึงนำถุงเก็บก๊าซที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟีเพื่อตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้นของ ก๊าซไฮโครเจน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ โดยไม่ทิ้งช่วงเวลานาน

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ก๊าซตัวอย่างด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี จะนำข้อมูลพื้นที่ใต้พีค ของแต่ละสเปกตรัมไปแทนค่าในสมการเส้นตรงของก๊าซมาตรฐานที่ได้ปรับค่ามาแล้วเพื่อหาความ เข้มข้นของก๊าซผลิตภัณฑ์ในหน่วยของโมลต่อมิลลิลิตร เปรียบเทียบช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่ แตกต่างกันที่มีผลต่อความเข้มข้นของก๊าซผลิตภัณฑ์และทำการทคลองซ้ำเพื่อยืนยันผลการทคลอง ในการผลิตก๊าซ

4.3.3 การผลิตไฮโดรเจนด้วยพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะของเหลว

จัคระบบการทคลองตามภาพที่ 4.16 โดยใช้ชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นคู่ขนาน ป้อน อากาศด้วยปั้มลมขนาดเล็กโดยควบคุมอัตราการใหลของอากาศคงที่ 2.6 มิลลิลิตรต่อนาที เข้าสู่ ด้านล่างของชุดกำเนิดพลาสมา เพื่อทำหน้าที่เป็นก๊าซพาให้ก๊าซผลิตภัณฑ์เข้าสู่ถุงเก็บตัวอย่างก๊าซ เงื่อนใขการทคลองเพื่อศึกษาระหว่างกรณีเติมเอทานอล 99.8%โดยปริมาตร ปริมาณ 15 ml ลงใน ช่องว่างระหว่างแก้วสองแผ่นและสร้างฟองอากาศด้วยก๊าซพา กับกรณีที่ใช้ก๊าซพาอย่างเดียวไม่เติม เอทานอล

ในการทดลองได้แปรเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ 10, 15, 20, 25 และ 30 kVpp และปรับ กวามถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงในช่วงกวามถี่ 50-500 Hz หลังกำเนิดพลาสมาเป็นเวลา 15 นาที เริ่มเก็บก๊าซถุงแรก โดยเก็บก๊าซถุงละ 5 นาทีอย่างต่อเนื่องจนกรบ 30 นาที แล้วนำถุงเก็บก๊าซ ไปวิเกราะห์ด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี บันทึกข้อมูลกวามเข้มข้นของก๊าซผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธี นี้

จากนั้นเปลี่ยนชุดกำเนิดพลาสมาแบบท่อแก้ว ใช้เงื่อนไขทคลองเช่นเดิมเพื่อเปรียบเทียบผล ของการผลิตก๊าซไฮโดรเจน และสังเกตลักษณะการเกิดพลาสมาในทั้งสองระบบ



ภาพที่ 4.16 การจัคระบบผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะของเหลว โดยอาศัยอากาศเป็นก๊าซพา

ผลของการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นคู่ขนาน

ผลการทดลองพบว่ากรณีก๊าซพาอย่างเดียวไม่เติมเอทานอลลงในช่องว่างระหว่างแผ่นแก้ว สองแผ่นจะเกิดพลาสมาสีน้ำเงินชัดเจน เนื่องจากมีการไอออไนซ์ของอากาศดังภาพที่ 4.17 (ก) แต่ กรณีที่เติมเอทานอลลงไปจะไม่เกิดพลาสมาขึ้นเนื่องจากกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะทำให้เอทานอล ในสถานะของเหลวแตกตัวได้ และจะเกิดพลาสมาเฉพาะบริเวณผิวนอกของขั้วไฟฟ้าซึ่งสัมผัสกับ อากาศเท่านั้นดังภาพที่ 4.17 (ข) ผลการวิเคราะห์ก๊าซตัวอย่างที่ได้จากวิธีนี้ พบว่าปริมานความ เข้มข้นของไนโตรเจนมีก่าประมาน 2 × 10⁻⁵ โมลต่อมิลลิลิตร ซึ่งปริมานดังกล่าวมีก่าเท่ากับ ปริมานความเข้มข้นไนโตรเจนที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่วนปริมานความเข้มข้นของไฮโครเจนมีก่า น้อยกว่าก่าต่ำสุดของเครื่องที่ตรวจวัดได้ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมานความเข้มข้นของมีเทนและ การ์บอนมอนออกไซด์ก็ไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วย



ภาพที่ 4.17 การเกิดพลาสมาในชุดกำเนิดแบบแผ่นกู่ขนาน (ก) กรณีก๊าซพาอย่างเดียวไม่เติมเอทา นอลลงในช่องว่างแผ่นแก้ว (ข) กรณีที่เติมเอทานอลลงในช่องว่างแผ่นแก้ว

ผลของการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากชุดกำเนิดพลาสมาแบบทรงกระบอก

เนื่องจากความเข้มของสนามไฟฟ้าที่ได้จากชุดกำเนิดพลาสมาแบบแผ่นคู่ขนานมีก่าน้อย กว่าแบบทรงกระบอก และการตอบสนองความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากแบบทรงกระบอกสูง กว่า จึงได้พัฒนาชุดกำเนิดพลาสมาแบบทรงกระบอกที่ทำจากท่อแก้วเพื่อลดข้อจำกัดดังกล่าว ซึ่ง ช่วยเพิ่มความเข้มสนามไฟฟ้าขึ้นไปอีก พบว่ากรณีก๊าซพาอย่างเดียวไม่เติมเอทานอลลงในช่องว่าง ระหว่างขั้วอิเล็กโทรดของท่อแก้วจะเกิดพลาสมาเป็นสีน้ำเงินชัดเจน เนื่องจากเกิดการไอออไนซ์ ของอากาศ และกรณีที่เติมเอทานอลลงไปจะไม่เกิดพลาสมาขึ้นเนื่องจากกำลังไฟฟ้ายังไม่เพียง พอที่จะทำให้เอทานอลในสถานะของเหลวแตกตัวได้ และเกิดพลาสมาเฉพาะบริเวณผิวนอกของ ขั้วไฟฟ้าที่สัมผัสกับอากาศเช่นกัน แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นก็ยังไม่สามารถทำให้เอทานอล แตกตัวได้เนื่องจากของเหลวต้องใช้พลังงานสูงมากกว่านี้ ผลการเก็บก๊าซที่ได้จากวิธีนี้ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของ ในโตรเจน มีก่าประมาณ 2 × 10⁻⁵ โมลต่อมิลลิลิตรซึ่งปริมาณดังกล่าวมี กำเท่ากับปริมาณความเข้มข้นในโตรเจนที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่วนปริมาณความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนมีก่าน้อยกว่าก่าต่ำสุดของเครื่องที่ตรวจวัดได้ นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณความเข้มข้นของ

4.3.4 การผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์่มมิงของเอทานอลในสถานะก๊าซ

จากข้อจำกัดของการกำเนิดพลาสมาแบบ DBD ประกอบกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงไม่ สามารถสร้างกระบวนการดิสชาร์จได้เพียงพอที่จะทำให้เอทานอลในสถานะของเหลวแตกตัวได้ จึงปรับโครงสร้างชุดกำเนิดพลาสมาเป็นแบบท่อแก้วกนโทและอาศัยความร้อนในการเปลี่ยน สถานะเอทานอลจากของเหลวเป็นก๊าซ เพื่อช่วยให้โมเลกุลของเอทานอลและโมเลกุลไอน้ำเกิดการ ไอออไนซ์ได้ง่ายด้วยพลาสมาแบบ DBD ที่ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ การทดลองนี้จัดระบบการทดลองตามภาพที่ 4.18 โดยใช้ชุดกำเนิดพลาสมาแบบไดอิเล็กทริก แบริเออร์ดิสชาร์จแบบท่อแก้วคนโท บรรจุเอทานอล ปริมาตร 350 มิลลิลิตร และต้มเอทานอลด้วย เตาไฟฟ้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ปรับอุณหภูมิของเอทานอลจนถึงจุดเดือด แรงคันไอระเหยจะเคลื่อน เอทานอลในสถานะก๊าซผ่านบริเวณอิเล็กโทรดของชุดกำเนิดพลาสมา ในการกำเนิดพลาสมาได้ ทดลองแปรเปลี่ยนขนาดแรงคันไฟฟ้าและความถิ่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงคันสูงย่านความถิ่ต่ำ ในช่วงความถิ่ 50-500 Hz ขนาดแรงคันไฟฟ้า 10, 15, 20, 25 และ 30 kVpp เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆที่ มีผลต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิงหลังการเกิดพลาสมาให้ได้ปริมาณสูงที่สุด ได้แก่ ขนาดของแรงคันไฟฟ้าและความถิ่ไฟฟ้าที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่ต่างกัน (Sampling time) และความเข้มข้นโดยปริมาตรของเอทานอลที่เหมาะสม



ภาพที่ 4.18 ระบบผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะก๊าซ

ในการศึกษาขั้นต้นพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถให้ก๊าซผลิตภัณฑ์และอากาศผ่านเครื่อง แก้วดักจับไปยังถุงเก็บก๊าซ รวมทั้งเอทานอลและอากาศที่ค้างในระบบเคลื่อนไปยังเครื่องแก้วดักจับ เช่น โมเลกุลของเอทานอลและน้ำ เมื่อนำก๊าซหลักไปวิเคราะห์ก๊าซด้วยเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี แสดงผลออกมาด้วยโครมาโทแกรมดังภาพที่ 4.19 พบว่ามีก๊าซผลิตภัณฑ์ เช่น ก๊าซไฮโครเจน ก๊าซ มีเทน และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ รวมทั้งก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจนแยกออกจากกัน ด้วย Retention Time ที่แตกต่างกัน



4.4 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิง

จากผลการศึกษาการผลิตไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะก๊าซใน ขั้นต้น นำไปสู่การศึกษาปัจจัยต่าง ๆที่มีผลต่อการผลิตก๊าซไฮโครเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิง ขนาด ของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า ช่วงเวลาในการเก็บก๊าซและความเข้มข้นโคยปริมาตรของเอทา นอล ดังนี้

4.4.1 ขนาดของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

ในการศึกษาขนาดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตก๊าซไฮโครเจน ได้ แปรเปลี่ยนที่ (ก) แรงดันไฟฟ้าคงที่ 30 kVpp แปรเปลี่ยนความถี่ที่ 50, 200 และ 350 Hz และ (ข) แรงดันไฟฟ้าคงที่ 24 kVpp แปรเปลี่ยนความถี่ที่ 200, 350 และ 500 Hz

การทดลองเริ่มจากการต้มเอทานอล โดยจับเวลาในตั้งแต่เริ่มต้มจนอุณหภูมิได้อุณหภูมิคงที่ 83 องศาเซลเซียส (Pre-stage time) จ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่ 30 kVpp ความถี่ 50 Hz ปล่อยให้ไอระเหย ของเอทานอลไล่อากาศที่มีอยู่ในระบบออกเป็นเวลา 15 นาที (Pre-sampling time) จากนั้นเริ่มเก็บ ก๊าซทันทีเมื่อครบนาทีที่ 15 การเก็บก๊าซแต่ละถุง (Sampling time) จนครบ 30 นาที แล้วจึงเปลี่ยน ขนาดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ ตามแผนผังในภาพที่ 4.20



ภาพที่ 4.20 แผนผังการศึกษาขนาดของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการผลิตก๊าซไฮโครเจน

ระหว่างการทดลองพบว่าขนาดของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าเป็นตัวแปรที่มี กวามสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตไฮโดรเจน จึงได้ทำการทดลองเปรียบเทียบผลของแรงดันไฟฟ้าและ กวามถี่ไฟฟ้าระดับต่าง ๆ ที่มีต่อปริมาณของก๊าซที่ผลิตได้ โดยแบ่งช่วงเวลาในการเก็บก๊าซช่วงละ 5 นาที

ผลการศึกษาพบว่าที่แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน 30 kVpp ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz มีอัตราการผลิต ไฮโครเจนต่ำ ทำให้ก๊าซเข้าถุงเก็บช้าและมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดักจับในปริมาณมาก ผลวิเคราะห์ ก๊าซสังเกตได้ว่าพีคของไฮโครเจนเริ่มปรากฎในช่วงเวลา 15-20 นาที และเพิ่มขึ้นไม่มากนักดังภาพ ที่ 4.21 (ข) เปรียบเทียบกับกรณีต้มเอทานอลอย่างเดียวไม่ปรากฏพีคของก๊าซไฮโครเจน ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ดังภาพที่ 4.21 (ก) แสดงว่าไม่เกิดการไอออไนซ์ของเอทานอล จะ ไม่มีพลาสมาที่ทำหน้าที่เสมือนตัวเร่งปฏิกิริยารีฟอร์มมิงได้



ภาพที่ 4.21 ผลของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการผลิตก้าซไฮโครเจน (ก) ไม่ป้อน แรงคันไฟฟ้า (ข) ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp

เมื่อปรับความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับเป็น 200 Hz แปรเปลี่ยนแรงคันไฟฟ้าระหว่าง 24 kVpp และ 30 kVpp พบว่าที่แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp มีอัตราการผลิตไฮโครเจนเพิ่มมากกว่า ซึ่งมีผลทำให้ ก๊าซเข้าถุงมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการที่พีคของไฮโครเจนเริ่มปรากฏในช่วงเวลา 10-15 นาทีใน กรณีแรงคันไฟฟ้าที่ 24 kVpp คังกราฟแสดงปริมาณก๊าซในภาพที่ 4.22 (ก) และพีคของไฮโครเจน ปรากฏช่วง 5 นาทีแรกในกรณีแรงคันไฟฟ้าที่ 30 kVpp คังกราฟแสดงปริมาณก๊าซภาพที่ 4.22 (ข)



ภาพที่ 4.22 ผลของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการผลิตก๊าซไฮโครเจน (ก) ความถี่ไฟฟ้า 200 Hz แรงคันไฟฟ้า 24 kVpp (ข) ความถี่ไฟฟ้า 200 Hz แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp

เมื่อเพิ่มความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับเป็น 350 Hz แปรเปลี่ยนแรงคันไฟฟ้าระหว่าง 24 kVpp และ 30 kVpp พบว่าที่แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp มีอัตราการผลิตไฮโครเจนเพิ่มมากกว่า ซึ่งมีผลทำให้ ก๊าซเข้าถุงมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการที่พีคของไฮโครเจนเริ่มปรากฏในช่วงเวลา 5-10 นาทีใน กรณีแรงคันไฟฟ้าที่ 24 kVpp คังกราฟแสคงปริมาณก๊าซภาพที่ 4.23 (ก) และพีคของไฮโครเจน ปรากฏช่วง 5 นาทีแรกในกรณีแรงคันไฟฟ้าที่ 30 kVpp คังกราฟแสคงปริมาณก๊าซภาพที่ 4.23 (ข) และเมื่อเพิ่มความถี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเป็น 500 Hz พบว่าที่แรงคันไฟฟ้า 24 kVpp มีอัตราการ ผลิตไฮโครเจนน้อยกว่า ความถี่ 350 Hz เนื่องจากความหนาแน่นในการเกิคพลาสมาน้อยกว่า สังเกตจากการใช้กำลังไฟฟ้าที่ต่ำกว่า คังกราฟแสคงปริมาณก๊าซในภาพที่ 4.23 (ก)



ภาพที่ 4.23 ผลของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ในการผลิตก๊าซไฮโครเจน (ก) ความถี่ 350 Hz แรงคันไฟฟ้า 24 kVpp (ข) ความถี่ 350 Hz แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp (ค) ความถี่ 500 Hz แรงคันไฟฟ้า 24 kVpp

เมื่อเปรียบเทียบความถี่ไฟฟ้าเท่ากัน เพิ่มแรงคันไฟฟ้าขึ้นทำให้ปริมาณไฮโครเจนเข้าถุง เก็บก๊าซมากขึ้น แสดงว่าแรงคันไฟฟ้ามีผลต่ออัตราการผลิตไฮโครเจนและสามารถสรุปเงื่อนไข ของแรงคันไฟฟ้าและความถี่บางช่วงเวลาคังตารางที่ 4.2

	ความเข้มข้นของไฮโครเจน(μ mol/ml)						
เงื่อนไขทคลอง	กำลังไฟฟ้า (W)	0-5 นาที	15-20 นาที	25-30 นาที			
ไม่จ่ายแรงคัน	-	-	-	-			
50 Hz 30 kVpp	*	-	0.98	2.01			
200 Hz 24 kVpp	*	-	2.00	4.11			
200 Hz 30 kVpp	*	0.69	8.04	10.80			
350 Hz 24 kVpp	16	-	3.13	4.33			
350 Hz 30 kVpp	25	1.75	8.72	12.00			
500 Hz 24 kVpp	20	2.24	7.84	11.10			

ตารางที่ 4.2 เงื่อนไขของแรงคันไฟฟ้าและความถี่ที่เหมาะสมในการทคลอง

* ไม่สามารถวัดขนาดของกระแสได้

ผลการศึกษาขนาดของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการผลิตก๊าซไฮโครเจนให้ได้ ปริมาณสูงที่สุด พบว่า ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ 350 Hz และแรงดันไฟฟ้า 30 kVpp ให้ผลดีที่สุด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ใช้กำลังไฟฟ้าในการกำเนิดพลาสมาความเข้มสูง ทำให้อัตราการผลิตก๊าซ ไฮโครเจนได้ประสิทธิภาพสูงและปริมาณก๊าซที่เข้าสู่ถุงเก็บก๊าซในปริมาณมากที่ช่วงเวลาเดียวกัน

4.4.2 ช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสม (Sampling time)

ในการศึกษาช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสมโดยใช้ขนาดแรงคันไฟฟ้าและความลี่ ไฟฟ้าที่ทำให้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้สูงสุด ด้วยการแปรเปลี่ยนช่วงเวลาในการเก็บก๊าซ (Sampling time) ที่ต่างกัน คือ 5, 12 และ20 นาที เพื่อที่จะหาเวลาอิ่มตัวของการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยสังเกต จากก๊าซไนโตรเจนที่ลดลงมากจนไม่สามารถลดลงได้อีก และความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนเริ่ม คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

การทคลองเริ่มจากการต้มเอทานอล โคยจับเวลาตั้งแต่เริ่มต้มจนใด้อุณหภูมิคงที่ 83 องศา เซลเซียส (Pre-stage time) ปรับขนาดแรงคันไฟฟ้า 30 kVpp และความถี่ไฟฟ้า 350 Hz ซึ่งเป็น เงื่อนไขที่ผลิตก๊าซไฮโครเจนได้สูงสุดตามหัวข้อที่ 4.4.1 ปล่อยให้ไอระเหยของเอทานอลไล่อากาศ ที่มีอยู่ในระบบออกทิ้งไว้ 15 นาที (Pre-sampling time) จากนั้นเริ่มเก็บก๊าซทันทีเมื่อครบนาทีที่ 15
ในการเก็บก๊าซแปรเปลี่ยนช่วงเวลาในการเก็บก๊าซถุงละ 5, 12 และ 20 นาที ตามลำคับ คังแผนผังใน ภาพที่ 4.24



ภาพที่ 4.24 แผนผังการศึกษาช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสม (Sampling time) ในการผลิตก๊าซ ไฮโดรเจน

ผลการศึกษาช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสม (Sampling time) ที่แรงคันไฟฟ้า 30 kVpp กวามถี่ไฟฟ้า 350 Hz ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ให้ผลผลิตก๊าซไฮโครเจนได้สูงสุด พบว่าผลผลิตก๊าซ ไฮโครเจนจะสูงขึ้นตามช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เพิ่มขึ้น ถ้าช่วงเวลาในการเก็บก๊าซน้อย เช่น เก็บ ก๊าซครั้งละ 5 นาที จะยังไม่เห็นความแตกต่างของปริมาณก๊าซไนโตรเจนกับปริมาณก๊าซไฮโครเจน เมื่อเพิ่มเวลาในการเก็บก๊าซครั้งละ 12 นาทีทำให้สัดส่วนของก๊าซไฮโครเจนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ สามารถระบุได้ว่าอัตราการผลิตก๊าซไฮโครเจนจะคงที่เมื่อไร ดังนั้นจึงต้องเพิ่มช่วงการเก็บก๊าซให้ นานขึ้นโดยเก็บก๊าซครั้งละ 20 นาที เพื่อทำให้ทราบอัตราการผลิตไฮโครเจนที่คงที่ได้แน่นอน จาก การขยายเวลาในการเก็บก๊าซพบว่าอัตราการผลิตไฮโครเจนเริ่มคงที่เวลา 80 นาที ดังกราฟแสดง ปริมาณสัดส่วนผลิตภัณฑ์ก๊าซในภาพที่ 4.25 และนำเงื่อนไขที่ได้จากหัวข้อที่ 4.4.1 และ 4.4.2 ไปใช้ ในการทคลองขั้นต่อไป



ภาพที่ 4.25 กราฟช่วงเวลาในการเก็บก๊าซที่เหมาะสม (Sampling time) ในการผลิตก๊าซไฮโครเจน (ก) เก็บก๊าซครั้งละ 5 นาที (ข) เก็บก๊าซครั้งละ 12 นาที (ค) เก็บก๊าซครั้งละ 20 นาที

4.4.3 ความเข้มข้นโดยปริมาตรของเอทานอลที่เหมาะสม

ใด้ศึกษาผลของความเข้มข้นโดยปริมาตรของเอทานอลที่มีต่ออัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจน โดยใช้ขนาดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่ทำให้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้สูงสุดจากหัวข้อ 4.4.1 และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บก๊าซจากหัวข้อ 4.4.2 ความเข้มข้นโดยปริมาตรของเอทานอลที่ ใช้ในการทดลอง คือ 25 %, 50 %, 75 % และ 99.8 % ในการทดลองแต่ละครั้งจะปรับอุณหภูมิโดย ใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิจนกระทั่งอุณหภูมิของเอทานอลคงที่ที่จุดเดือดซึ่งแตกต่างกันตามความ เข้มข้นของเอทานอล ปรับขนาดแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่ทำให้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้สูงสุด และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บก๊าซ ปล่อยให้ไอของเอทานอลไล่อากาศที่มีอยู่ในระบบออกทิ้ง ไว้ 15 นาที (Pre-sampling time) เริ่มเก็บก๊าซทันทีเมื่อครบนาทีที่ 15 เก็บก๊าซแต่ละถุง (Sampling time) โดยใช้ช่วงเวลาในการเก็บถุงละ 20 นาที จนครบ 200 นาที ดังแผนผังในภาพที่ 4.26



ภาพที่ 4.26 แผนผังการศึกษาความเข้มข้น โดยปริมาตรของเอทานอลในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

ผลการทคลองผลิตไฮโครเจนโคยใช้เอทานอลที่ความเข้มข้นของเอทานอล 25%, 50%, 75% และ 99.8% โดยปริมาตรเป็นวัตถุดิบ ให้ผลผลิตไฮโครเจนที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังกราฟแสดง ปริมาณความเข้มข้นไฮโครเจนในภาพที่ 4.27



ภาพที่ 4.27 กราฟความเข้มข้นเอทานอลโดยปริมาตรที่มีผลต่อความเข้มข้นไฮโครเจน

จากการทดลองยังพบว่า การให้ความร้อนแก่เอทานอลจนเดือดด้วยอุณหภูมิคงที่แล้วเริ่ม จ่ายไฟฟ้าให้ชุดกำเนิดพลาสมาจะเห็นประกายไฟกระจายทั่วบริเวณคอลัมน์แก้วในช่วงแรกเป็น ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่มีปริมาณออกซิเจนในอากาศที่เหมาะสมในการติดไฟ

อยู่ แต่เมื่อปริมาณออกซิเจนลดลงทำให้ประกายไฟฟ้าหายไป บริเวณการเกิดพลาสมาจะคงที่ จากกราฟในภาพที่ 4.27 พบว่า อัตราการผลิตไฮโดรเจนจะคงที่ ตั้งแต่ช่วงเวลา 80-100 นาที มีเปลี่ยนแปลงน้อยมากหลังจากช่วงเวลา 100-200 นาทีถัดไป หลังจากนั้นได้คำนวณหาอัตรา การผลิตไฮโดรเจนเฉลี่ย และหาอัตราการผลิตไฮโดรเจนสูงสุด ดังตารางที่ 4.3 ตามเงื่อนไขของ ความเข้มข้นเอทานอลต่าง ๆ

					อัตราการผลิ	ตไฮโครเจน
ความเข้มข้น	อุณหภูมิ	ปริมาตรา	เองเอทานอ	ถ(มิถถิถิตร)	$(\mu \text{ mol})$	/ml/min)
ของเอทานอล	(องศาเซลเซียส)	ก่อนต้ม	หลังต้ม	ดักจับ	สูงสุด	เฉลี่ย
25%	92	350	343	4	1.05 ± 0.047	1.01 ± 0.051
50%	87	350	339	8	1.06 ± 0.048	0.98 ± 0.067
75%	85	350	344	2	1.06 ± 0.020	0.99 ± 0.056
99.8%	83	350	273	66	1.00 ± 0.357	0.82 ± 0.127

ตารางที่ 4.3 ผลของความเข้มข้นเอทานอลที่มีต่ออัตราการผลิตไฮโครเจน

จากการกำนวณหาอัตราการผลิตไฮโดรเจนที่ความเข้มข้นของเอทานอลต่าง ๆ พบว่าอัตรา การผลิตไฮโดรเจนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.05 μ mol/ml/min ซึ่งไม่ต่างกันมากเมื่อเปลี่ยนความ เข้มข้น แต่อัตราการผลิตไฮโดรเจนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1.01 μ mol/ml/min เมื่อใช้ความเข้มข้นเอทา นอล 25% ที่อุณหภูมิ 92 องสาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาตรของเอทานอลที่เหลือหลังต้มกี ลดลงไม่มาก (ประมาณ 2-3%) สำหรับความเข้มข้น 25, 50 และ 75% ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับ กรณีของเอทานอลบริสุทธิ์ที่ปริมาตรลดลงถึง 22% ซึ่งเอทานอลบริสุทธิ์ มีอัตราการผลิตโฮโดรเจน เท่ากับ 0.82 μ mol/ml/min โดยมีเอทานอลหลงเหลืออยู่ในเครื่องแก้วคักจับประมาณ 66 มิลลิลิตร แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตน้อยกว่าเอทานอลความเข้มข้นต่ำ ซึ่งกาดว่าเป็นเพราะ ปริมาณความเข้มข้นเอทานอลบริสุทธิ์ที่สูง มีการระเหยรวดเร็วมาก กระแสไฟฟ้าจาก DBD ไม่เพียง พอที่จะทำให้เอทานอลในสถานะไอแตกตัวได้หมด จึงทำให้เอทานอลไปอยู่ที่เครื่องแก้วคักจับมาก ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตลง

นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองกับน้ำกลั่น โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันกับเอทานอล แต่ใช้ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเพื่อให้น้ำเดือดไปไอ พบว่า ก๊าซผลิตภัณฑ์คือ ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซ ออกซิเจนเข้าไปในถุงเก็บก๊าซด้วยอัตราการไหลที่ต่ำ ทำให้ปริมาตรอยู่ในถุงเก็บก๊าซปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับเอทานอลดังตารางที่ 4.4 ดังนั้นสัดส่วนเอทานอลในน้ำมีส่วนสำคัญมากในการเกิด ไฮโดรเจน

	อุณหภูมิ	ความเข้มข้นของไฮโครเจน (μ mol/ml)										
	(องศาเซลเซียส)	0-20 นาที	60-80 นาที	140-160 นาที	180-200 นาที							
น้ำกลั่น	105	-	5.13 ± 1.09	9.17 ± 3.03	12.20 ± 2.08							
เอทานอล 50%	87	8.19 ± 1.26	17.30 ± 0.045	20.00 ± 0.073	21.10 ± 0.062							
เอทานอลบริสุทธิ์	83	3.03 ± 1.94	11.60 ± 2.32	16.10 ± 1.87	20.00 ± 0.036							

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบความเข้มข้น ไฮโครเจนที่ได้จาก น้ำกลั่น เอทานอล 50% และเอทานอลบริสุทธิ์

นอกจากก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาพลาสมารีฟอร์มมิงแล้วยังพบ ก๊าซมีเทน และ ก๊าซการ์บอนมอนออกไซด์ ซึ่งแสดงอัตราการผลิตของไฮโดรเจนต่อมีเทน และอัตราการผลิตของ ไฮโดรเจนต่อการ์บอนมอนออกไซด์ ดังตารางที่ 4.5 พบว่าอัตราการผลิตไฮโดรเจนต่อมีเทน ประมาณ 4.5 เท่า และอัตราการผลิตไฮโดรเจนต่อการ์บอนมอนออกไซด์ประมาณ 5.5 เท่าของเอทา นอลเข้มข้น 25%, 50% และ 75% ดังนั้นอัตราการเกิดไฮโดรเจนจึงถือว่าก่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ

ความเข้มข้น		อัตราการผลิต (μ mol/ml/min)											
ของเอทานอล	H_2	CH_4	СО	H_2/CH_4	H ₂ /CO								
เอทานอล 25%	1.01 ± 0.051	0.21 ± 0.017	0.18 ± 0.033	4.81	5.61								
เอทานอล 50%	0.98 ± 0.067	0.22 ± 0.019	0.16 ± 0.034	4.45	6.12								
เอทานอล 75%	0.99 ± 0.056	0.21 ± 0.014	0.20 ± 0.025	4.71	4.95								
เอทานอลบริสุทธิ์	0.85 ± 0.127	0.22 ± 0.050	0.17 ± 0.050	3.86	5.00								

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบอัตราการผลิตของ H₂/CH₄ และ H₂/CO

จากการนำข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซที่เก็บได้จากถุงเก็บก๊าซมาคำนวณ % Molar fraction ของ ก๊าซไฮโครเจน ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซมิเทน และก๊าซการ์บอนมอนออกไซค์ พบว่า % Molar fraction ของก๊าซไฮโครเจนที่ความเข้มข้นเอทานอล 25 %, 50 % และ 75 % มีค่าประมาณ 60 % ของก๊าซทั้งหมดในถุงเก็บก๊าซ ส่วน % Molar fraction ของก๊าซไฮโครเจนที่ความเข้มข้น 99.8 % มี ค่าประมาณ 50 % ของก๊าซทั้งหมดในถุงเก็บก๊าซ เนื่องจากการเกิดดิสชาร์จจากชุดกำเนิดพลาสมา ไม่เพียงพอที่จะทำให้ความเข้มข้นเอทานอลบริสุทธิ์แตกตัวได้ทัน และสัดส่วนของน้ำอาจมีส่วน ช่วยทำให้เกิดการไอออไนซ์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอิเล็กตรอนซึ่งเป็นองก์ประกอบของพลาสมาจะไป กระตุ้นการสลายของโมเลกุลเอทานอล และน้ำ ไปเป็นอะตอมของไฮโครเจน และอนุมูล เช่น CH₃ และ OH จะเห็นได้ว่าอะตอมของไฮโครเจนส่วนหนึ่งมาจากน้ำ และอีกส่วนมาจากเอทานอล จึงมี ผลทำให้อัตราการผลิตไฮโครเจนที่ความเข้มข้นเอทานอลที่เจือจางมีประสิทธิภาพดีกว่าเอทานอล บริสุทธิ์ นอกจากนี้จากการคำนวณแสดงให้เห็นว่า % Molar fraction ของก๊าซมีเทนที่ความเข้มข้น เอทานอล 25 %, 50 %, 75 % และ 99.8% มีค่าประมาณ 13 % ของก๊าซทั้งหมดในถุงเก็บก๊าซ และ% Molar fraction ของก๊าซการ์บอนมอนออกไซค์ที่กวามเข้มข้นเอทานอล 25 %, 50 %, 75 % และ 99.8 % มีค่าประมาณ 10 % ของก๊าซทั้งหมดในถุงเก็บก๊าซ ดังตารางที่ 4.5

		2, 2, 4		
ความเข้มข้น	H ₂	N_2	CH_4	СО
ของเอทานอล	% Molar fraction	% Molar fraction	% Molar fraction	% Molar fraction
เอทานอล 25%	61.33	14.63	13.11	10.92
เอทานอล 50%	59.55	17.10	13.35	10.00
เอทานอล 75%	62.20	13.80	13.61	10.38
เอทานอลบริสุทธิ์	50.38	26.46	12.37	10.78

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบ % Molar fraction ของ H., N., CH4 and CO

หมายเหตุ ไม่รวมความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนเนื่องจากไม่ได้ทำการปรับเทียบกับสารมาตรฐาน

บทท 5 สรุปวิจารณ์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย

การพัฒนาระบบผลิตก๊าซไฮโครเจนอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำ ส่วนการ พัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาชนิดไคอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ และ ส่วนการผลิตก๊าซไฮโครเจน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

5.1.1 ในส่วนของการพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำได้นำ หม้อแปลงจุดหลอดนีออนมาประยุกต์ในงานวิจัย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเครื่องจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับแรงสูงมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงคัน สูงที่พัฒนาขึ้นมีสมรรถนะเพียงพอในการกำเนิดพลาสมาแบบแบริเออร์ดิสชาร์จ สามารถปรับ ขนาดของแรงคันไฟฟ้าในช่วง 0- 30 kVpp กระแสไฟฟ้าใช้งาน 2.5 mA กำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่าย ไฟฟ้าแรงสูง คือ 27 W สามารถปรับความถี่ไฟฟ้าในช่วง 50-850 Hz อย่างไรก็ตามพบว่าช่วงความถี่ ใฟฟ้าที่ตอบสนองต่อแรงคันไฟฟ้าได้ดี คือ 300-500 Hz เนื่องจากโครงสร้างของขดลวดทุติยภูมิ ของหม้อแปลงจุดหลอดนีออนมีก่ากวามเหนี่ยวนำและก่ากวามจุระหว่างชั้นขดลวดสูง ทำให้มี สภาพสมมูลเป็นตัวกรองกวามถี่ต่ำ (LC low pass filter) ส่งผลถึงการตอบความถี่ที่แคบลง

5.1.2 ในส่วนของการพัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาชนิดไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ และส่วนของการผลิตก๊าซไฮโครเจน ได้ทำการออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดเพื่อใช้ผลิตก๊าซ ไฮโครเจนโดยเฉพาะ และได้ทคลองผลิตก๊าซไฮโครเจนโดยใช้เอทานอลเป็นสารตั้งต้น ซึ่งพบว่า การผลิตก๊าซไฮโครเจนด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะของเหลวโดยอาศัยอากาศ เป็นก๊าซพา ไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากการทำให้เอทานอลในสถานะของเหลวจะเกิดการไอออ ในซ์ได้ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงมาก [11] ซึ่งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้มี กำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะทำให้เอทานอลแตกตัวได้

เนื่องจากข้อจำกัดด้วยวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะของเหลวที่ไม่สามารถทำ ได้จึงต้องเปลี่ยนเป็นวิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะก๊าซโดยอาศัยความร้อนเปลี่ยน สถานะเอทานอลเหลวให้มีสถานะเป็นก๊าซ อาศัยแรงดันไอเคลื่อนเอทานอลในสถานะก๊าซผ่าน บริเวณก่อพลาสมาแบบแบริเออร์ดิสชาร์จทรงกระบอกและได้ทำการปรับขนาดท่อแก้วเพื่อเพิ่ม ความเข้มสนามไฟฟ้า

บทที่ 5

5.1.3 เงื่อนไขของวิธีการพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลแบบแบริเออร์ดิสชาร์จทรงกระบอก ที่ออกแบบขึ้นและทำให้ได้ผลผลิตไฮโดรเจนมากที่สุด คือ แรงดันไฟฟ้า 30 kVpp ความถี่ไฟฟ้า 350 Hz และกำลังไฟฟ้าในการผลิต 25 W โดยพบว่า อัตราการผลิตไฮโดรเจนเริ่มคงที่หลังจากเวลา ผ่านไป 80 นาที และเมื่อทำการทดลองเพื่อหาอัตราการผลิตไฮโดรเจนที่ความเข้มข้นเอทานอลที่ ต่างกัน พบว่า อัตราการผลิตไฮโดรเจนที่ความเข้มข้นเอทานอล 25 %, 50 % และ 75 %โดยปริมาตร มีก่าเฉลี่ยประมาณ 1.00 μ mol/ml/min ซึ่งมากกว่าอัตราที่วัดได้เมื่อใช้ความเข้มข้นเอทานอล 99.8 %โดยปริมาตร เนื่องจากปริมาณของไอน้ำที่ผสมกับเอทานอลมีผลต่ออัตราการผลิต ทำให้เกิดการ ไอออไนซ์เป็นอะตอมของไฮโดรเจนและอนุมูล เช่น CH₃ และ OH ได้ง่ายขึ้น และยังไม่สามารถ สรุปได้ว่ากวามเข้มข้นของเอทานอลปริมาณเท่าไรที่เหมาะสมที่จะได้ปริมาณไฮโดรเจนมากที่สุด

5.2 ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนด้วยวิธี พลาสมารีฟอร์มมิงด้วยเอทานอล อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาและพัฒนาต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มากขึ้น และเพื่อให้เข้าใจถึงกลไกในการผลิต โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

5.2.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงคันสูงย่านความถี่ต่ำมีกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะทำให้เอทานอล ในสถานะของเหลวแตกตัวได้ จึงควรพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้มีกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สามารถ ตอบสนองย่านความถี่ที่กว้างขึ้นในระดับความถี่เสียงอยู่ในช่วง 50 Hz-20 kHz ซึ่งเป็นการพัฒนา แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงให้มีศักยภาพเทียบเท่าเชิงพาณิชย์

5.2.2 สำหรับงานวิจัยทางค้านพลาสมาในเอทานอลเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไฮโครเจนนั้น มีน้อยมาก เพราะเป็นการยากที่จะทำให้เอทานอลในสถานะของเหลวเปลี่ยนเป็นก๊าซและเป็น พลาสมาหรือเอทานอลในสถานะของเหลวให้กลายเป็นพลาสมาในขั้นเดียว เนื่องจากต้องอาศัย แหล่งกำเนิดพลาสมาแบบ DC discharge, Rf discharge และ Microwave discharge ซึ่งการกำเนิด พลาสมาแบบนี้มีกำลังไฟฟ้าสูงในระดับ kW ซึ่งมีความเหมาะสมในการประยุกต์ค้านพลาสมารี ฟอร์มมิงในเอทานอลสำหรับการผลิตไฮโครเจนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบไดอิเล็กทริกแบริ เออร์ดิสชาร์จ

 5.2.3 วิธีพลาสมารีฟอร์มมิงเอทานอลในสถานะก๊าซโดยอาศัยกวามร้อนเป็นตัวพาสำหรับ การผลิตไฮโครเจนเป็นวิธีที่ดี แต่ควรมีการปรับปรุงระบบที่สามารถวัดความเข้มเอทานอลขาเข้า ความเข้มข้นเอทานอลขาออก เพื่อนำไปสู่การคำนวณเปอร์เซ็นการเปลี่ยนค่าสารตั้งต้น (% Conversion) และระบบกำเนิดพลาสมาท่อขาออกควรนำไปต่อกับเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี โดยตรงจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดพลาดจากการเก็บก๊าซ อันจะนำไปสู่การคำนวณค่ายังผล ไฮโดรเจน (% Hydrogen yield) เพื่อที่จะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของการผลิตไฮโดรเจนของวิธีนี้ อย่างถูกต้องและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมพลังงาน ทดแทน ต่อไปในอนาคตของประเทศชาติ

รายการอ้างอิง

- Belen Sarmiento et al. Hydrogen production by reforming of hydrocarbons and alcohols in a dielectric barrier discharge. Journal of Power Source 169(2007) : 140-143.
- Y.P. Hu, Gesheng Li, Yingduo Yang, Xiaohong Gao, Zhihong Lu. Hydrogen generation from hydro-ethanol reforming by DBD-plasma. <u>International Journal of Hydrogen Energy</u> 37(2012) : 1044-1047.
- [3] สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. <u>เชื้อเพลิงไฮโครเจน [</u>ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://202.44.52.249/thaienergynews/EnNewsDetail.aspx?id=15 [22 สิงหาคม 2555]
- [4] New Mexico Solar Energy Association. <u>Electrolysis</u> [Online]. Available from : http://www.nmsea.org/Curriculum/7_12/electrolysis/electrolysis.htm [2012,August 22]
- [5] Alfred Grill. <u>Cold Plasma in Materials Fabrication.</u> The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York : IEEE Press, 1994.
- [6] Vijay Nehra, Ashok Kumar and HK Dwivedi. Atmospheric Non-Thermal Plasma Sources. <u>International Journal of Engineering</u> 2(2005) : 53-68
- [7] Part 2: On-board fuel reforming for a natural gas engine. <u>Plasma reforming</u> [Online].
 Available from : http://students.chem.tue.nl/ifp23/final_report/report2.pdf [2012,August 22]
- [8] Levko, D.S. Shchedrin, A.I. Chernyak, V.Ya. and Ol'shevskii, S.V. Efficiency of Ethanol Conversion in Equilibrium and Nonequilibrium Plasmas. <u>Technical Physics</u> 55 (2010) : 1699-1702.
- [9] Changming Du., et al. Hydrogen production by steam-oxidative reforming of bio-ethanol assisted by Laval nozzle arc discharge. <u>INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN</u> <u>ENERGY</u> 37 (2012) : 8318-8329.
- [10] Guillaume Petitpas, Jose Gonzalez-Aguilar, Adeline Darmon and Laurent Fulcheri. Ethanol and E85 Reforming Assisted by a Non-thermal Arc Discharge. <u>Energy Fuels</u> 24 (2010) : 2607-2613.
- [11] Roth, J.R. Industrial Plasma Engineering: Principles. Bristol, U.K.: IOP, 1995.
- [12] Kogelscatz, U. Eliasson, B. and Egli, W. Dielectric-Barrier Discharge. Principle and Applications. <u>JOURNAL DE PHYSIQUE IV</u>: 1997

- [13] Ulrich Kogelschatz. Dielectric-barrier Discharge: Their History, Discharge Physics, and Industrial Applications. Plasma Chemistry and Plasma Processing 23(2003): 1-46.
- [14] Young & Freedman. <u>ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา.</u> เล่มที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : เพียร์ สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2005.
- [15] CRC Handbook of Chemistry & Physics. <u>Dielectric strength of Insulating Materials</u> [Online]. Available from : http://psyhosting.info/Ionium/Rhodium/pdf/chemicaldata/diel_strength.pdf [2012,August 25]
- [16] PSU ใบโอดีเซล26. <u>แอลกอฮอล์ [</u>ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://share.psu.ac.th/blog/engbiodiesel/21450 [24 สิงหาคม 2555]
- [17] กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. <u>สารละลาย</u> [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
 www.satit.nu.ac.th/nud/strand/science/File/c/สารละลาย1.ppt [29 สิงหาคม 2555]
- [18] รูจิลักขณ์ รัตตะรมย์. <u>เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง " ก๊าซโครมาโทกราฟี "</u> [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.docstoc.com/docs/45375250/Gas-Chromatography-GC--squalane [29 สิงหาคม 2555]
- [19] แม้น อมรสิทธ์ และคณะ. หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ. เล่มที่ 2, พิมพ์ครั้งที่
 1. กรุงเทพมหานคร : สิทธิพรแอสโซซิเอส, 2003.
- [20] SHIMADZU. Accessories and Supplies for Shimadzu Gas Chromatographs [Online]. Available from: http://www.chemshow.cn/UploadFile/datum/1003/shjohntec_2008218115733800771.pdf
 [29 สิงหาคม 2555]

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ก๊าซโครมาโทกราฟี

การปรับภาวะของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟี

ภาวะของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟีที่ใช้ในการวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซไฮโครเจน ก๊าซ ในโตรเจน ก๊าซมีเทน และก๊าซการ์บอนมอนออกไซด์ แสดงในตารางที่ ก-1 และความเข้มข้นของเอทา นอลที่เป็นสารตั้งต้นแสดงในตารางที่ ก-2

ตาราง ก-1 ภาวะของเครื่องก๊าซ โครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา พลาสมารีฟอร์มมิงของเอทานอล

ก๊าซพา	อาร์กอน 99.99%			
อุณหภูมิอินเจกเตอร์	70 องศาเซลเซียส			
อุณหภูมิกอลัมน์				
เริ่มต้น	50 องศาเซลเซียส			
สิ้นสุด	50 องศาเซลเซียส			
ชนิดของดีเทกเตอร์	Thermal conductivity detector			
ชนิดของกอถัมน์	Molecular sieve 5A			
อัตราการใหลของก๊าซพา	40 มิลลิลิตรต่อนาที			

ตาราง ก-2 ภาวะของเครื่องก๊าซโครมาโทกราฟีสำหรับวิเคราะห์ความเข้มข้นของเอทานอลที่เป็นสารตั้ง ต้นในปฏิกิริยาพลาสมารีฟอร์มมิง

ถ้ำซพา	ก๊าซไนโตรเจน					
อุณหภูมิอินเจคเตอร์	220 องศาเซลเซียส					
อุณหภูมิคอลัมน์ เริ่มต้น สิ้นสุด	170 องศาเซลเซียส (Isothermal)					
ชนิดของดีเทกเตอร์	Thermal conductivity detector					
ชนิดของกอลัมน์	PQ					
อัตราการใหลของก๊าซพา	50 มิลลิลิตรต่อนาที					

ภาคผนวก ข

ความดันไอและความหนาแน่นของสาร

1 %	0.0 0.1 0.2 1	0.3 0.4 0	0.5 0.6	0.7 1	0.8	0.9	L° C.	0.0	0.1	1 0.2	0.3	04	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
-14	1.361 1.348 1.336 1	.324 1.312 1.	300 1.288	1.276	1.264	.253	10	9.209	9.2 1	9.333	9.395	9.458	9.521	9.585	9.649	9.714	9.77
-13	1.490 1.477 1.464 1	.450 1.437 1.	424 1.411	1.399	1.386	.373	. 11	9.844	9.910	9.976	10.042	10.109	10.176	10.244	10.312	10.380	10.44
-12	1.632 1.617 1.602	737 1 722 1	559 1.540 707 1 601	1.532	1.518	.504	12	10.518	10.588	10.658	10.728	10.799	10.870	10.941	11.013	11.085	11.15
-10	1.950 1.934 1.916	. 899 1. 883 1.	866 1.849	1.833	1.817	.800	14	11.987	12.065	12.144	12.223	12.302	12.382	12.462	12.543	12.624	12.70
- 9	2.131 2.112 2.093 2	.075 2.057 2.	039 2.021	2.003	1.985	.968	15	12.788	12.870	12.953	13.037	13.121	13.205	13.290	13.375	13.461	13.54
- 8	2.320 2.300 2.283 2	472 2 450 2.	420 2.207	2, 18/	2.108 4	346	10	13.634	13.721	13.809	13.898	13.987	14.076	14.166	14.256	14.347	14.43
-6	2.765 2.742 2.718 2	695 2.672 2.	649 2.626	2.603	2.581	.559	18	15.477	15.575	15.673	15.772	15.871	15.971	16.071	16.171	16.272	16.37
- 5	3.013 2.987 2.962 2	.937 2.912 2.	887 2.862	2.838	2.813	. 790	19	16.477	16.581	16.685	16.789	16.894	16.999	17.105	17.212	17.319	17.42
-1	3.280 3.252 3.225 3	198 3. 171 3.	144 3.117	3.091	3.065	.039	20	17.535	17.644	17.753	17.863	17.974	18.085	18.197	18.309	18.422	18.53
- 2	3.880 3.848 3.816 3	785 3.753 3.	722 3.691	3.660	3.630 3	.599		19.827	19.948	20.070	20.193	20.316	20.440	20.565	20.690	20.815	20.94
-1	4.217 4.182 4.147 4 4 579 4 542 4 504 4	467 4.431 4	045 4.012 395 4 359	3.979	3.946 3	.913	23 24	21.068	21.196	21.324	21.453	21.583	21.714	21.845	21.977	22.110	22.24
For data	at 0(0.2)-30(2)-98°C	. see p. 2324,	"Handboo	k of Ch	hemistr	and	25	73 756	73 807	24 030	24 182	24 2 26	24 471	24 617	24 764	24 012	25 06
ics," 40	th ed., Chemical Rub	er Publishing	; Co.	2			26	25.209	25.359	25.509	25.660	25.812	25.964	26.117	26.271	26.426	26.58
to, an	5 g - 6 - 6					 1 	27	26.739	26.897	27.055	27.214	27.374	27.535	27.696	27.858	28.021	28.18
LE 3-4	Vapor Pressure	of Liquid	Water fr	om -	- 16 to	0°C*	28	28.349	28.514	28.680 30.392	28.84/	29.015	29.184 30.923	29.354	29.525	29.69/ 31.461	31.64
		mmHg				*	30	31.824	32.007	32.191	32.376	32.561	32.747	32.934	33.122	33.312	33.50
°C.	0.0 0.1 0.2	0.3 0.4 0	5 0.6	0.7	0.8	0.9	31	33.695	33.888	34.082	34.276	34.471	34.667	34.864	35.062	35.261	35.46
15	1.436 1.425 1.414 1	402 1.390 1.;	379 1.368	1.356	1.345 1	.334	33	37 729	37.947	30.068	38 369	39.584	38,801	30.891	37.099	3/ 308	30 67
4	1.560 1.547 1.534 1	522 1.511 1.4	497 1.485	1.472	1.460 1	449	34	39.898	40.121	40.344	40.569	40.7%	41.023	41.251	41.480	41.710	41.94
	1.834 1.819 1.804 1.	790 1.776 1.	761 1.748	1.734	7201	705	25	43 170	12 100	12 14	12 000	47 1 17	12 200		mm		
1	1.987 1.971 1.955 1.	939 1.924 1.9	909 1.893	1.878	1.863 1	.848	36	44.563	44.808	45.054	45.301	45.549	45.799	45.395	46.302	46.556	46.81
eles,	2 149 2 134 2 116 2	100 2 084 2 0	167 2 050	2 034 2	2 018 2	001	37	47.067	47.324	47.582	47.841	48.102	48.364	48.627	48.891	49.157	49.42
121	2.326 2.307 2.289 2	271 2.254 2.2	236 2. 219	2. 201	2. 184 2	167	38	49.692	49.961	50.231	50.502	50.774	51.048	51.323	51.600	51.879	52.16
	2.514 2.495 2.475 2.	456 2.437 2.4	18 2.399	2.380 2	2.362 2	.343		34.112	16.16	33.007	33.274	33.500	33.004	л.1.0	7.110	1.1.51	55.05
4.2	2.931 2.909 2.887 2.	866 2.843 2.8	322 2.800	2.778	2 757 2	736	40	55.324	55.61	55.91	56.21	56.51	56.81	57.11	57.41	57.72	58.03
	2 1/2/2 100/2 110/2						42	61.50	61.82	58.90 62.14	59.41 62.47	59.58 62.80	59.90 63 13	63.46	63 79	64 17	61.10
100	3. 103 3. 139 3. 115 3.	092 3.069 3.0	A6 3.022	3.000 2	2.976 2	955	43	64.80	65.14	65.48	65.82	66.16	66.51	66.86	67.21	67.56	67.91
	3.673 3.647 3.620 3.	593 3.567 3.5	40 3.514	3. 487 3	3.461 3	436	44	68.26	68.61	68.97	69.33	69.69	70.05	70.41	70.77	71.14	71.51
2	3.956 3.927 3.898 3.	871 3.841 3.8	313 3.785	3.757 3	3.730 3	702	45	71.88	72.25	72.62	72.99	73.36	73.74	74.12	74.50	74.88	75.26
	1.20 1.22 1.120 1.	1.1.1.1.1.1.1	1019.1019	1.010	.010 5	300	46	75.65	76.04	76.43	76.82	77.21	77.60	78.00	78.40	78.80	79.20
-11	4.579 4.546 4.513 4.	480 4.448 4.4	16 4. 385	1.353 4	1.320 4	289	48	83.71	84.13	84.56	84.99	85.42	85.85	86.28	86 71	87.14	87.58
puter	from the above ta	ble with the	aid of th	e ther	modyna	mic	49	88.02 l	88.46	88.90	89.34	89.79	90.24	90.69	91.14	91.59	92.05
log	$\frac{p_w}{10} = \frac{-1.1489t}{-1.1489t}$.330 × 10-50	2 + 9.084	× 10-8	43	9	t, °C.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	$p_i = 273.1 + t$						50	92.51	97.20	102.09	107.20	112.51	118.04	123.80	129.82	136.08	142.60
18							70	233.7	243.9	254 6	265 7	277 2	289 1	196.09 301 4	314 1	214.17	223.T
E 3-5	Vapor Pressure	of Liquid V	Water fr	om 0	to 10	0°C*	80	355.1	369.7	384.9	400.6	416.8	433.6	450.9	468.7	487.1	506.1
0.0	01 0 0 1 0 2	minHg				-	90	525.76	527.76	529.77	531.78	533.80	535.82	537.86	539.90	541.95	544.00
4.570	4612 4647 4 691	4715 4750	4 795	020 4	0.0	900	91	566.00	569 12	571.7K	573 40	575 55	577 71	579 87	582.04	584 22	586 A1
4.926	4.962 4.998 5.034	5.070 5.107	5.144 5	.181 5	219 5	256	93	588.60	590.80	593.00	595.21	597.43	599.66	601.89	604.13	606.38	608.64
5.294	5.332 5.370 5.408	5.447 5.486	5.525 5	.565 5	.605 5	645	94	610.90	613.17	615.44	617.72	620.01	622.31	624.61	626.92	629.24	631.57
5.665	5.725 5.766 5.807	5.848 5.889	5.93 5	408 6	453 6	498	95	633.90	636.24	638.59	640.94	643.30	645.67	648.05	650.43	652.82	655.7
		0.010	0.500				96	657.62	660.03	662.45	664.88	667.31	669.75	672.20	674.66	677.12	679.69
.543	6.589 6.635 6.681	6.728 6.775	6.822 6	.869 6	.917 6	.965	97	082.07	00 92	687.04	689.54 714 00	692.05	694.57	697.10	699.63	702.17	704.7
513	7 565 7.617 7.160	7.722 7.775	7.828 7	.360 7 882 7	936 7	990	99	733.24	735.88	738.53	741.18	743.85	746.52	749.20	751.89	754.58	757.2
145	8.100 8.155 8.211	8.267 8.323	8.380 8	.437 8	.494 8	551	100	760.00	762.72	765.45	768.19	770.93	773.68	776.44	779.22	782.00	784.7
8.609	9 449 9 777 9 704	8 845 8 005	9 045 0	025 0	0.004 0	147	101	187 57	/un 37	7U3 18	706 00	748 87	AA 100	804 50	817 351	810 71	012 6

						9/		
d	0	, a	~	2	10	5	9	0
6 1 90 81 1	แสดงความสั	9 1 9 1 9	1801	1191091	ໄລຍເຮ	1 9 9 I 7	ລົງເລດ	192091
		มพเ	ו ויח ג	עועוגו	161.016	มนเ	TEEPL	וגונוא
*****						••••		91

	Pressure, mm Hg												
	1	5	10	20	40	60	100	200	400	760			
		Temperature ⁰ C											
Ethanol	-31.3	-12	-2.3	8	19	26	34.9	48.4	63.5	78.4			
Methanol	-44.0	-25.3	-16.2	-6.0	5.0	12.1	21.2	34.8	49.9	64.7			

ภาพที่ ข-2 แสดงความสัมพันธ์ความดันใอของเอทานอลและเมทานอลกับอุณหภูมิ

77

%	10°C.	15°C.	20°C.	25°C.	30°C.	35°C.	40°C.	%	1 10°C.	15°C.	20°C.	25°C.	30°C.	35°C.	40°C.
0	0.99973	0.99913	0.99823	0.99708	0.99568	0.99406	0.99225	50	0.92126	0.91776	0.91384	0.90985	0.90580	0.90168	0.89750
1	785	725	636	520	379	217	034	51	.91943	555	160	760	353	.89940	519
2	602	542	453	336	194	031	.98846	52	723	333	.90936	534	125	710	288
3	426	365	275	157	014	.98849	663	53	502	110	711	307	.89896	479	056
(B) 4	258	195	103	.98984	.98839	672	485	54	279	.90885	485	079	667	248	.88823
5	098	032	. 98938	817	670	501	311	55	055	659	258	.89850	437	016	589
6	.98946	.98877	780	656	507	335	142	56	.90831	433	031	621	206	. 88784	356
7	801	729	627	500	347	172	.97975	57	607	207	.89803	392	.88975	552	122
8	660	584	478	346	189	009	808	58	381	.89980	574	162	744	319	. 87888
9	524	442	331	193	031	.97846	641	59	154	752	344	.88931	512	085	653
10	393	304	187	043	.97875	685	475	60	.89927	523	113	699	278	.87851	417
11	267	171	047	.97897	723	527	312	61	698	293	.88882	446	044	615	180
12	145	041	.97910	753	573	371	150	62	468	062	650	233	.87809	379	.86943
13	026	.97914	775	611	424	216	.96989	63	237	.88830	417	.87998	574	142	705
14	.97911	790	643	472	278	063	829	64	006	597	183	763	337	.86905	466
15	800	669	514	334	133	.96911	670	65	.88774	364	.87948	527	100	667	227
16	692	552	387	199	.96990	760	512	66	541	130	713	291	. 86863	429	.85987
17	583	433	259	062	844	607	352	67	308	.87895	477	054	625	190	747
18	473	313	129	.96923	697	452	189	68	074	660	241	.86817	387	.85950	407
19	363	191	.96997	782	547	294	023	69	.87839	424	004	579	148	710	266
20	252	068	864	639	395	134	.95856	70	602	187	.86766	340	.85908	470	025
21	139	. 96944	729	495	242	.95973	687	71	365	.86949	527	100	667	228	.84783
22	024	818	592	348	087	809	516	72	127	710	287	.85859	426	.84986	540
23	.96907	689	453	199	.95929	643	343	73	.86888	470	047	618	184	743	297
24	787	558	312	048	769	476	168	74	648	229	.85806	376	.84941	500	053
25	665	424	168	.95895	607	306	.94991	75	408	.85988	564	134	698	257	.83809
26	539	287	020	738	442	133	810	76	168	747	322	.84891	455	013	564
27	406	144	.95867	576	272	.94955	625	77	.85927	505	079	647	211	.83768	319
28	268	.95996	710	410	098	774	438	78	685	262	.84835	403	.83966	523	074
29	125	844	548	241	.94922	590	248	79	442	018	590	158	720	277	.82827
30 31 31 32 33 1 34	.95977 823 665 502 334	686 524 357 186 011	382 212 038 .94860 679	067 .94890 709 525 337	741 557 370 180 .93986	403 214 021 .93825 626	055 .93860 662 461 257	80 81 82 83 84	197 . 84950 702 453 203	.84772 525 277 028 .83777	344 096 .83848 599 348	.83911 664 415 164 .82913	473 224 .82974 724 473	029 .82780 530 279 027	578 329 079 .81828 576
35	162	.94832	494	146	790	425	051	85	.83951	525	095	660	220	.81774	322
36	.94986	650	306	.93952	591	221	.92843	86	697	271	.82840	405	.81965	519	067
37	805	464	114	756	390	016	634	87	441	014	583	148	708	262	.80811
38	620	273	.93919	556	186	.92808	422	88	181	.82754	323	.81888	448	003	552
39	431	079	720	353	.92979	597	208	89	.82919	492	062	626	186	.80742	291
40	238	.93882	518	148	770	385	.91992	90	654	227	.81797	362	.80922	478	028
41	042	682	314	.92940	558	170	774	91	386	.81959	529	094	655	211	.79761
42	.93842	478	107	729	344	.91952	554	92	114	688	257	.80823	384	.79941	491
43	639	271	.92897	516	128	733	332	93	.81839	413	.80983	549	111	669	220
44	433	062	685	301	.91910	513	108	94	561	134	705	272	.79835	393	.78947
45 46 47 48	226 017 .92806 593 379	.92852 640 426 211 .91995	472 257 041 .91823 604	085 .91868 649 429 208	692 472 250 028 .90805	291 069 .90845 621 396	.90884 660 434 207 .89979	95 96 97 98 99	278 .80991 698 399 094	.80852 566 274 .79975 670	424 138 .79846 547 243	.79991 706 415 117 .78814	555 271 .78981 684 382	114 .78831 542 247 .77946	670 388 100 .77806 507
			1. 10 June	- ₁₀ - 1	Ale a	a. j.	1	100	.79784	360	.78934	506	075	641	203

ภาพที่ ข-3 ความหนาแน่นของเอทานอลบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิต่างๆ

alcohol		lan er	- 14.5	T	enths o	f %					alcohol	and the state			T	enths o	f %	5	201.4		
by weight	0	1	2	3		5	6	7	8	9	by weight	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.99823	804	785	766	748	729	710	692	673	655	50	0.91384	361	339	317	295	272	250	228	206	183
1	636	618	599	581	562	544	525	507	489	471	51	160	138	116	093	071	049	026	004	*981	*959
2	453	435	417	399	381	363	345	327	310	292	52	.90936	914	891	869	846	824	801	779	756	734
3	275	257	240	222	205	188	171	154	137	120	53	711	689	666	644	621	598	.576	553	531	508
4	103	087	070	053	037	020	003	*987	*971	*954	54	485	463	440	417	395	372	349	327	304	281
5	.98938	922	906	890	874	859	843	827	811	796	55	258	236	213	190	167	145	122	099	076	054
6	780	765	749	734	718	703	688	673	658	642	56	031	008	*985	*962	*939	*917	*894	*871	*848	*825
7	627	612	597	582	567	553	538	523	508	493	57	.89803	780	757	734	711	688	665	643	620	597
8	478	463	449	434	419	404	389	374	360	345	58	574	551	528	505	482	459	436	413	390	367
9	331	316	301	287	273	258	244	229	215	201	59	344	321	298	275	252	229	206	183	160	137
10	187	172	158	144	130	117	103	089	075	061	60	113	090	067	044	021	*998	*975	*951	*928	*905
11	047	033	019	006	*992	*978	*964	*951	•937	*923	61	.88882	859	836	812	789	766	743	720	696	673
12	.97910	896	883	869	855	842	828	815	801	788	62	650	626	603	580	557	533	510	487	463	440
13	775	761	748	735	722	709	696	683	670	657	63	417	393	370	347	323	300	277	253	230	206
14	643	630	617	604	591	578	565	552	539	526	64	183	160	136	113	089	066	042	019	*995	*972
15	514	501	488	475	462	450	438	425	412	400	65	.87948	925	901	878	854	831	807	784	760	737
16	387	374	361	349	336	323	310	297	284	272	66	713	689	666	642	619	595	572	548	524	501
17	259	246	233	220	207	194	181	168	155	142	67	477	454	430	406	383	359	336	312	288	265
18	129	116	103	089	076	063	050	037	024	010	68	241	218	194	170	147	123	099	075	052	028
19	.96997	984	971	957	944	931	917	904	891	877	69	004	*981	*957	*933	*909	*885	*862	*838	*814	*79(
20	864	850	837	823	810	796	783	769	756	742	70	.86766	742	718	694	671	647	623	599	575	55
21	729	716	702	688	675	661	647	634	620	606	71	527	503	479	455	431	407	383	339	335	31
22	592	578	564	551	537	523	509	495	481	467	72	287	263	239	215	191	167	143	119	095	07
23	453	439	425	411	396	382	368	354	340	326	73	047	022	*998	*974	*950	*926	*902	*878	*854	*830
24	312	297	283	269	254	240	225	211	196	182	74	.85806	781	757	733	709	685	661	636	612	580
25	168	153	139	124	109	094	080	065	050	035	75	564	540	515	491	467	443	419	394	370	344
26	020	005	•990	*975	*959	*944	*929	*914	*898	*883	76	322	297	273	-249	225	200	176	152	128	10:
27	.95867	851	836	820	805	789	773	757	742	726	77	079	055	031	-006	*982	*958	*933	*909	*884	*860
28	710	694	678	662	646	630	613	597	581	565	78	.84835	811	787	-762	'738	713	689	664	640	61:
29	548	532	516	499	483	466	450	433	416	400	79	590	566	541	-517	492	467	443	418	393	369
30	382	365	349	332	315	298	281	264	247	230	80	344	319	294	270	245	220	196	171	146	12
31	212	195	178	161	143	126	108	091	074	056	81	096	072	047	022	*997	*972	*947	*923	*898	*87:
32	038	020	003	*985	*967	*950	*932	•914	*896	*878	82	.83848	823	798	773	748	723	698	674	649	62-
33	.94860	842	824	806	788	770	752	734	715	697	83	599	574	549	523	498	473	448	423	398	37:
34	679	660	642	624	605	587	568	550	531	512	84	348	323	297	272	247	222	196	171	146	120
35	494	475	456	438	419	400	382	363	344	325	85	095	070	044	019	*994	*968	*943	*917	*892	*860
.36	306	287	268	249	230	211	192	172	153	134	86	.82840	815	789	763	738	712	686	660	635	60
37	114	095	075	056	036	017	*997	*978	*958	*939	87	583	557	531	505	479	453	427	401	375	34
38	.93919	899	879	859	840	820	800	780	760	740	88	323	297	271	245	219	193	167	140	114	08
39	720	700	680	660	640	620	599	579	559	539	89	062	035	009	*983	*956	*930	*903	*877	*850	*82
40	518	498	478	458	437	417	396	376	356	335	90	.81797	770	744	717	690	664	637	610	583	556
41	314	294	273	253	232	212	191	170	149	129	91	529	502	475	448	421	394	366	339	312	285
42	107	086	065	044	023	002	*981	*960	*939	*918	92	257	230	203	175	148	120	093	066	038	010
43	.92897	876	855	834	812	791	770	749	728	707	93	.80983	955	928	900	872	844	817	789	761	73
44	685	664	642	621	600	579	557	536	515	493	94	705	677	649	621	593	565	537	509	480	45
45	472	450	429	408	386	365	343	322	300	279	95	424	395	367	338	310	281	253	224	195	160
46	257	236	214	193	171	150	128	106	085	063	96	138	109	080	051	022	*993	*963	*934	*905	*87
47	041	019	*997	*976	*954	*932	•910	*889	*867	*845	97	.79846	816	787	757	727	698	668	638	608	570
48	.91823	801	780	758	736	714	692	670	648	626	98	547	517	487	456	426	396	365	335	305	274
49	604	582	560	538	516	*494	472	450	428	406	99	243	213	182	151	120	089	059	028	*997	*960
· · ·	1.1		1 .			12		1	1		100	.78934	1.1	·		1			100		

ภาพที่ ข-4 ความหนาแน่นของเอทานอลปนกับน้ำ (g/ml) ที่อุณหภูมิต่างๆ

ภาคผนวก ค ส่วนประกอบของวงจรกำเนิดความถี่ปรับค่าได้และอ่านความถี่

ICL8038

OBSOLETE PRODUCT NO RECOMMENDED REPLACEMENT contact our Technical Support Center at 1-888-INTERSIL or www.intersil.com/tsc

Plecision Waveform Generator/Voltage Controlled Oscillator

The ICL8038 waveform generator is a monolithic integrated circuit capable of producing high accuracy sine, square, triangular, sawtooth and pulse waveforms with a minimum of external components. The frequency (or repetition rate) can be selected externally from 0.001Hz to more than 300kHz using either resistors or capacitors, and frequency modulation and sweeping can be accomplished with an external voltage. The ICL8038 is fabricated with advanced monolithic technology, using Schottky barrier diodes and thin film resistors, and the output is stable over a wide range of temperature and supply variations. These devices may be interfaced with phase locked loop circuitry to reduce temperature drift to less than 250ppm/^oC.

April 2001 File Number 2864.4

Features

- Low Frequency Drift with Temperature 250ppm/^oC
- High Linearity0.1% (Triangle Wave Output)
- Wide Frequency Range0.001Hz to 300kHz

- Simultaneous Sine, Square, and Triangle Wave Outputs
- Easy to Use Just a Handful of External Components Required

Ordering	g Inforr	nation
----------	----------	--------

PART NUMBER	STABILITY	TEMP. RANGE (^o C)	PACKAGE	PKG. NO.
ICL8038CCPD	250ppm/ ^o C (Typ)	0 to 70	14 Ld PDIP	E14.3
ICL8038CCJD	250ppm/ ^o C (Typ)	0 to 70	14 Ld CERDIP	F14.3
ICL8038BCJD	180ppm/ ^o C (Typ)	0 to 70	14 Ld CERDIP	F14.3
ICL8038ACJD	120ppm/ ^o C (Typ)	0 to 70	14 Ld CERDIP	F14.3

Pinout



1

Functional Diagram



CAUTION: These devices are sensitive to electrostatic discharge; follow proper IC Handling Procedures. 1-888-INTERSIL or 321-724-7143 | Intersil and Design is a trademark of Intersil Americas Inc. Copyright @ Intersil Americas Inc. 2001, All Rights Reserved

ICL8038

Absolute Maximum Ratings

Operating Conditions

Temperature Range

emperature hange	
ICL8038AC, ICL8038BC, ICL8038CC	0 ⁰ C to 70 ⁰ C

Thermal Information

Thermal Resistance (Typical, Note 1)	θ _{JA} (^o C/W)) θ _{JC} (^o C/W)
CERDIP Package	75	20
PDIP Package	115	N/A
Maximum Junction Temperature (Ceramic	Package)	175 ⁰ C
Maximum Junction Temperature (Plastic F	Package)	150°C
Maximum Storage Temperature Range	6	65°C to 150°C
Maximum Lead Temperature (Soldering 1	0s)	300°C

Die Characteristics

Back Side Potential V-

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

NOTE:

1. θ_{JA} is measured with the component mounted on an evaluation PC board in free air.

			IC	L80380	cc	IC	L8038	вс	ICL8038AC			
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	ТҮР	МАХ	MIN	ТҮР	МАХ	MIN	ТҮР	MAX	UNITS
Supply Voltage Operating Range	VSUPPLY											
	V+	Single Supply	+10	-	+30	+10	-	+30	+10	-	+30	V
	V+, V-	Dual Supplies	±5	-	±15	±5	-	±15	±5	-	±15	V
Supply Current	ISUPPLY	V _{SUPPLY} = ±10V (Note 2)		12	20	-	12	20	-	12	20	mA
FREQUENCY CHARACTERISTICS	(All Wavefo	irms)										
Max. Frequency of Oscillation	f _{MAX}		100	-	-	100	-	-	100	-	-	kHz
Sweep Frequency of FM Input	f _{SWEEP}		-	10	-	-	10	-	-	10	-	kHz
Sweep FM Range		(Note 3)	-	35:1	-	-	35:1	-	-	35:1	-	
FM Linearity		10:1 Ratio	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-	%
Frequency Drift with Temperature (Note 5)	Δf/ΔT	0°C to 70°C	-	250	-	-	180	-	-	120		ppm/ ^o C
Frequency Drift with Supply Voltage	Δf/ΔV	Over Supply Voltage Range	-	0.05	-	-	0.05		-	0.05	-	%/V
OUTPUT CHARACTERISTICS				•	•							
Square Wave												
Leakage Current	I _{OLK}	V ₉ = 30V	-	-	1	-	-	1	-	-	1	μA
Saturation Voltage	V _{SAT}	I _{SINK} = 2mA	-	0.2	0.5	-	0.2	0.4	-	0.2	0.4	V
Rise Time	t _R	$R_L = 4.7 k\Omega$	-	180	-	-	180	-	-	180	-	ns
Fall Time	t _F	$R_L = 4.7 k\Omega$	-	40	-	-	40	-	-	40	-	ns
Typical Duty Cycle Adjust (Note 6)	ΔD		2		98	2	-	98	2	-	98	%
Triangle/Sawtooth/Ramp												-
Amplitude	V _{TRIAN-} GLE	$R_{TRI} = 100 k\Omega$	0.30	0.33	-	0.30	0.33	-	0.30	0.33	-	xV _{SUPPLY}
Linearity			-	0.1	-	-	0.05	-	-	0.05	-	%
Output Impedance	ZOUT	I _{OUT} = 5mA	-	200	-	-	200	-	-	200	-	Ω

Electrical Specifications $V_{SUPPLY} = \pm 10V \text{ or } \pm 20^{\circ}\text{C}$, $R_I = 10k\Omega$, Test Circuit Unless Otherwise Specified

2

ICL8038

			TEST	ICL8038CC		ICL8038BC			ICL8038AC				
	PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	ТҮР	MAX	MIN	ТҮР	МАХ	MIN	ТҮР	MAX	UNITS
Sir	ne Wave												
	Amplitude	V _{SINE}	$R_{SINE} = 100k\Omega$	0.2	0.22	-	0.2	0.22	-	0.2	0.22	-	xV _{SUPPLY}
	THD	THD	R _S = 1MΩ (Note 4)	-	2.0	5	-	1.5	3	-	1.0	1.5	%
	THD Adjusted	THD	Use Figure 4	-	1.5	-	-	1.0	-	-	0.8	-	%

NOTES:

2. R_A and R_B currents not included.

3. V_{SUPPLY} = 20V; R_A and R_B = 10k Ω , $f \cong$ 10kHz nominal; can be extended 1000 to 1. See Figures 5A and 5B.

4. $82k\Omega$ connected between pins 11 and 12, Triangle Duty Cycle set at 50%. (Use R_A and R_B.)

5. Figure 1, pins 7 and 8 connected, $V_{SUPPLY} = \pm 10V$. See Typical Curves for T.C. vs V_{SUPPLY} .

6. Not tested, typical value for design purposes only.

Test Conditions

PARAMETER	R _A	R _B	RL	С	sw ₁	MEASURE
Supply Current	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Current Into Pin 6
Sweep FM Range (Note 7)	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Open	Frequency at Pin 9
Frequency Drift with Temperature	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Frequency at Pin 3
Frequency Drift with Supply Voltage (Note 8)	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Frequency at Pin 9
Output Amplitude (Note 10)						
Sine	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Pk-Pk Output at Pin 2
Triangle	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Pk-Pk Output at Pin 3
Leakage Current (Off) (Note 9)	10kΩ	10kΩ		3.3nF	Closed	Current into Pin 9
Saturation Voltage (On) (Note 9)	10kΩ	10kΩ		3.3nF	Closed	Output (Low) at Pin 9
Rise and Fall Times (Note 11)	10kΩ	10kΩ	4.7 k Ω	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 9
Duty Cycle Adjust (Note 11)						
Max	$50k\Omega$	~1.6kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 9
Min	~25 k Ω	50kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 9
Triangle Waveform Linearity	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 3
Total Harmonic Distortion	10kΩ	10kΩ	10kΩ	3.3nF	Closed	Waveform at Pin 2

NOTES:

9. Oscillation can be halted by forcing pin 10 to +5V or -5V.

10. Output Amplitude is tested under static conditions by forcing pin 10 to 5V then to -5V.

11. Not tested; for design purposes only.

3

^{7.} The hi and lo frequencies can be obtained by connecting pin 8 to pin 7 (f_{HI}) and then connecting pin 8 to pin 6 (f_{LO}). Otherwise apply Sweep Voltage at pin 8 ($^{2}/_{3}$ V_{SUPPLY} +2V) \leq V_{SWEEP} \leq V_{SUPPLY} where V_{SUPPLY} is the total supply voltage. In Figure 5B, pin 8 should vary between 5.3V and 10V with respect to ground.

^{8.} $10V \le V_+ \le 30V$, or $\pm 5V \le V_{\text{SUPPLY}} \le \pm 15V$.





Application Information (See Functional Diagram) An external capacitor C is charged and discharged by two current sources. Current source #2 is switched on and off by a flip-flop, while current source #1 is on continuously. Assuming that the flip-flop is in a state such that current source #2 is off, and the capacitor is charged with a current I, the voltage across the capacitor rises linearly with time. When this voltage reaches the level of comparator #1 (set at 2/3 of the supply voltage), the flip-flop is triggered, changes states, and releases current source #2. This current source normally carries a current 2I, thus the capacitor is discharged with a

4

net-current I and the voltage across it drops linearly with time. When it has reached the level of comparator #2 (set at 1/3 of the supply voltage), the flip-flop is triggered into its original state and the cycle starts again.

Four waveforms are readily obtainable from this basic generator circuit. With the current sources set at I and 2I respectively, the charge and discharge times are equal. Thus a triangle waveform is created across the capacitor and the flip-flop produces a square wave. Both waveforms are fed to buffer stages and are available at pins 3 and 9. The levels of the current sources can, however, be selected over a wide range with two external resistors. Therefore, with the two currents set at values different from I and 2I, an asymmetrical sawtooth appears at Terminal 3 and pulses with a duty cycle from less than 1% to greater than 99% are available at Terminal 9.

The sine wave is created by feeding the triangle wave into a nonlinear network (sine converter). This network provides a decreasing shunt impedance as the potential of the triangle moves toward the two extremes.

Waveform Timing

The *symmetry* of all waveforms can be adjusted with the external timing resistors. Two possible ways to accomplish this are shown in Figure 3. Best results are obtained by keeping the timing resistors R_A and R_B separate (A). R_A controls the rising portion of the triangle and sine wave and the 1 state of the square wave.

The magnitude of the triangle waveform is set at $^{1}/_{3}$ V_{SUPPLY}; therefore the rising portion of the triangle is,



FIGURE 2A. SQUARE WAVE DUTY CYCLE - 50%

ICL8038

$$t_{1} = \frac{C \times V}{I} = \frac{C \times 1/3 \times V_{SUPPLY} \times R_{A}}{0.22 \times V_{SUPPLY}} = \frac{R_{A} \times C}{0.66}$$

The falling portion of the triangle and sine wave and the 0 state of the square wave is:

$$t_{2} = \frac{C \times V}{1} = \frac{\frac{C \times 1/3V_{SUPPLY}}{V_{SUPPLY} - 0.22} \frac{V_{SUPPLY}}{R_{A}}}{\frac{V_{SUPPLY}}{R_{A}} - \frac{0.22}{R_{A}} \frac{R_{A}R_{B}C}{R_{A}}}{\frac{0.66(2R_{A} - R_{B})}{R_{A}}}$$

Thus a 50% duty cycle is achieved when $R_A = R_B$.

If the duty cycle is to be varied over a small range about 50% only, the connection shown in Figure 3B is slightly more convenient. A 1k Ω potentiometer may not allow the duty cycle to be adjusted through 50% on all devices. If a 50% duty cycle is required, a 2k Ω or 5k Ω potentiometer should be used.

With two separate timing resistors, the frequency is given by:

$$= \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{1}{\frac{R_A C}{0.66} \left(1 + \frac{R_B}{2R_A - R_B}\right)}$$

or, if
$$R_A = R_B = R$$

f = $\frac{0.33}{RC}$ (for Figure 3A)



FIGURE 2B. SQUARE WAVE DUTY CYCLE - 80%

FIGURE 2. PHASE RELATIONSHIP OF WAVEFORMS



FIGURE 3. POSSIBLE CONNECTIONS FOR THE EXTERNAL TIMING RESISTORS

5

Neither time nor frequency are dependent on supply voltage, even though none of the voltages are regulated inside the integrated circuit. This is due to the fact that both currents and thresholds are direct, linear functions of the supply voltage and thus their effects cancel.

Reducing Distortion

To minimize sine wave distortion the $82k\Omega$ resistor between pins 11 and 12 is best made variable. With this arrangement distortion of less than 1% is achievable. To reduce this even further, two potentiometers can be connected as shown in Figure 4; this configuration allows a typical reduction of sine wave distortion close to 0.5%.



FIGURE 4. CONNECTION TO ACHIEVE MINIMUM SINE WAVE DISTORTION

Selecting RA, RB and C

For any given output frequency, there is a wide range of RC combinations that will work, however certain constraints are placed upon the magnitude of the charging current for optimum performance. At the low end, currents of less than 1 μ A are undesirable because circuit leakages will contribute significant errors at high temperatures. At higher currents (I > 5mA), transistor betas and saturation voltages will contribute increasingly larger errors. Optimum performance will, therefore, be obtained with charging currents of 10 μ A to 1mA. If pins 7 and 8 are shorted together, the magnitude of the charging current due to R_A can be calculated from:

$$I = \frac{R_1 \times (V_{+} - V_{-})}{(R_1 + R_2)} \times \frac{1}{R_A} = \frac{0.22(V_{+} - V_{-})}{R_A}$$

R1 and R2 are shown in the Detailed Schematic.

A similar calculation holds for R_B.

The capacitor value should be chosen at the upper end of its possible range.

6

Waveform Out Level Control and Power Supplies

ICL8038

The waveform generator can be operated either from a single power supply (10V to 30V) or a dual power supply ($\pm 5V$ to $\pm 15V$). With a single power supply the average levels of the triangle and sine wave are at exactly one-half of the supply voltage, while the square wave alternates between V+ and ground. A split power supply has the advantage that all waveforms move symmetrically about ground.

The square wave output is not committed. A load resistor can be connected to a different power supply, as long as the applied voltage remains within the breakdown capability of the waveform generator (30V). In this way, the square wave output can be made TTL compatible (load resistor connected to +5V) while the waveform generator itself is powered from a much higher voltage.

Frequency Modulation and Sweeping

The frequency of the waveform generator is a direct function of the DC voltage at Terminal 8 (measured from V+). By altering this voltage, frequency modulation is performed. For small deviations (e.g. $\pm 10\%$) the modulating signal can be applied directly to pin 8, merely providing DC decoupling with a capacitor as shown in Figure 5A. An external resistor between pins 7 and 8 is not necessary, but it can be used to increase input impedance from about $8k\Omega$ (pins 7 and 8 connected together), to about (R + $8k\Omega$).

For larger FM deviations or for frequency sweeping, the modulating signal is applied between the positive supply voltage and pin 8 (Figure 5B). In this way the entire bias for the current sources is created by the modulating signal, and a very large (e.g. 1000:1) sweep range is created (f = Minimum at V_{SWEEP} = 0, i.e., Pin 8 = V+). Care must be taken, however, to regulate the supply voltage; in this configuration the charge current is no longer a function of the supply voltage (yet the trigger thresholds still are) and thus the frequency becomes dependent on the supply voltage. The potential on Pin 8 may be swept down from V+ by (¹/₃ V_{SUPPLY} - 2V).



FIGURE 5A. CONNECTIONS FOR FREQUENCY MODULATION

LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers

National Semiconductor

LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers General Description

The LM118 series are precision high speed operational amplifiers designed for applications requiring wide bandwidth and high slew rate. They feature a factor of ten increase in speed over general purpose devices without sacrificing DC performance.

The LM118 series has internal unity gain frequency compensation. This considerably simplifies its application since no external components are necessary for operation. However, unlike most internally compensated amplifiers, external frequency compensation may be added for optimum performance. For inverting applications, feedforward compensation will boost the slew rate to over 150V/µs and almost double the bandwidth. Overcompensation can be used with the amplifier for greater stability when maximum bandwidth is not needed. Further, a single capacitor can be added to reduce the 0.1% settling time to under 1 µs.

The high speed and fast settling time of these op amps make them useful in A/D converters, oscillators, active filters, August 2000

sample and hold circuits, or general purpose amplifiers. These devices are easy to apply and offer an order of magnitude better AC performance than industry standards such as the LM709.

The LM218 is identical to the LM118 except that the LM218 has its performance specified over a -25° C to $+85^{\circ}$ C temperature range. The LM318 is specified from 0°C to $+70^{\circ}$ C.

Features

- 15 MHz small signal bandwidth
- Guaranteed 50V/µs slew rate
- Maximum bias current of 250 nA
- Operates from supplies of ±5V to ±20V
- Internal frequency compensation
- Input and output overload protected
- Pin compatible with general purpose op amps

Fast Voltage Follower

(Note 1)



Note 1: Do not hard-wire as voltage follower (R1 \ge 5 k Ω)

Absolute Maximum Ratings (Note 7)

If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the National Semiconductor Sales Office/ Distributors for availability and specifications.

Supply Voltage	±20V
Power Dissipation (Note 2)	500 mW
Differential Input Current (Note 3)	±10 mA
Input Voltage (Note 4)	±15V
Output Short-Circuit Duration	Continuous
Operating Temperature Range	
LM118	–55°C to +125°C
LM218	–25°C to +85°C
LM318	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C

Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)	
Hermetic Package	300°C
Plastic Package	260°C
Soldering Information	
Dual-In-Line Package	
Soldering (10 sec.)	260°C
Small Outline Package	
Vapor Phase (60 sec.)	215°C
Infrared (15 sec.)	220°C
See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their	Effect
on Product Reliability" for other methods of sol	dering
surface mount devices.	
ESD Tolerance (Note 8)	2000V

Electrical Characteristics (Note 5)

Parameter	Conditions	LM1	18/LM2	18		Units		
		Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	
Input Offset Voltage	$T_A = 25^{\circ}C$		2	4		4	10	mV
Input Offset Current	$T_A = 25^{\circ}C$		6	50		30	200	nA
Input Bias Current	$T_A = 25^{\circ}C$		120	250		150	500	nA
Input Resistance	$T_A = 25^{\circ}C$	1	3		0.5	3		MΩ
Supply Current	$T_A = 25^{\circ}C$		5	8		5	10	mA
Large Signal Voltage Gain	$T_{A} = 25^{\circ}C, V_{S} = \pm 15V$	50	200		25	200		V/mV
	$V_{OUT} = \pm 10V, R_L \ge 2 \ k\Omega$							
Slew Rate	$T_{A} = 25^{\circ}C, V_{S} = \pm 15V, A_{V} = 1$	50	70		50	70		V/µs
	(Note 6)							
Small Signal Bandwidth	$T_{A} = 25^{\circ}C, V_{S} = \pm 15V$		15			15		MHz
Input Offset Voltage				6			15	mV
Input Offset Current				100			300	nA
Input Bias Current				500			750	nA
Supply Current	$T_A = 125^{\circ}C$		4.5	7				mA
Large Signal Voltage Gain	$V_{\rm S} = \pm 15 \text{V}, V_{\rm OUT} = \pm 10 \text{V}$	25			20			V/mV
	$R_L \ge 2 \ k\Omega$							
Output Voltage Swing	$V_{\rm S} = \pm 15 V, R_{\rm L} = 2 \ k\Omega$	±12	±13		±12	±13		V
Input Voltage Range	$V_{\rm S} = \pm 15 V$	±11.5			±11.5			V
Common-Mode Rejection Ratio		80	100		70	100		dB
Supply Voltage Rejection Ratio		70	80		65	80		dB

Note 2: The maximum junction temperature of the LM118 is 150°C, the LM218 is 110°C, and the LM318 is 110°C. For operating at elevated temperatures, devices in the H08 package must be derated based on a thermal resistance of 160°C/W, junction to ambient, or 20°C/W, junction to case. The thermal resistance of the dual-in-line package is 100°C/W, junction to ambient.

Note 3: The inputs are shunted with back-to-back diodes for overvoltage protection. Therefore, excessive current will flow if a differential input voltage in excess of 1V is applied between the inputs unless some limiting resistance is used.

Note 4: For supply voltages less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

Note 5: These specifications apply for $\pm 5V \le V_S \le \pm 20V$ and $-55^{\circ}C \le T_A \le +125^{\circ}C$ (LM118), $-25^{\circ}C \le T_A \le +85^{\circ}C$ (LM218), and $0^{\circ}C \le T_A \le +70^{\circ}C$ (LM318). Also, power supplies must be bypassed with 0.1 μ F disc capacitors.

Note 6: Slew rate is tested with $V_S = \pm 15V$. The LM118 is in a unity-gain non-inverting configuration. V_{IN} is stepped from -7.5V to +7.5V and vice versa. The slew rates between -5.0V and +5.0V and vice versa are tested and guaranteed to exceed 50V/µs.

Note 7: Refer to RETS118X for LM118H and LM118J military specifications.

Note 8: Human body model, 1.5 k Ω in series with 100 pF.





90





www.fairchildsemi.com

SEMICONDUCTOR® LM555/NE555/SA555 Single Timer

Features

- High Current Drive Capability (200mA)
- · Adjustable Duty Cycle
- Temperature Stability of 0.005%/°C
- Timing From µSec to Hours

FAIRCHILD

- Turn off Time Less Than $2\mu Sec$

Applications

- · Precision Timing
- · Pulse Generation
- · Time Delay Generation
- · Sequential Timing

Description

The LM555/NE555/SA555 is a highly stable controller capable of producing accurate timing pulses. With monostable operation, the time delay is controlled by one external resistor and one capacitor. With astable operation, the frequency and duty cycle are accurately controlled with two external resistors and one capacitor.

Internal Block Diagram

LM555/NE555/SA555

Absolute Maximum Ratings (TA = 25°C)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Supply Voltage	Vcc	16	V
Lead Temperature (Soldering 10sec)	TLEAD	300	°C
Power Dissipation	PD	600	mW
Operating Temperature Range LM555/NE555 SA555	TOPR	0 ~ +70 -40 ~ +85	°C
Storage Temperature Range	TSTG	-65 ~ +150	°C

Electrical Characteristics

(TA = 25°C, V_{CC} = 5 ~ 15V, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Supply Voltage	Vcc	-	4.5	-	16	V
Supply Current * ¹ /Low Stable)	lee	V _{CC} = 5V, R _L = ∞	-	3	6	mA
	ICC	V _{CC} = 15V, R _L = ∞	-	7.5	15	mA
Timing Error * ² (Monostable) Initial Accuracy Drift with Temperature Drift with Supply Voltage	ACCUR Δt/ΔT Δt/ΔV _{CC}	R _A = 1kΩ to100kΩ C = 0.1μF	-	1.0 50 0.1	3.0 0.5	% ppm/°C %/V
Timing Error * ² (Astable) Intial Accuracy Drift with Temperature Drift with Supply Voltage	ACCUR Δt/ΔT Δt/ΔV _{CC}	$R_A = 1k\Omega$ to 100kΩ C = 0.1μF	-	2.25 150 0.3	-	% ppm/°C %/∨
	Vc	V _{CC} = 15V	9.0	10.0	11.0	V
	ve	V _{CC} = 5V	2.6	3.33	4.0	V
	\/тц	V _{CC} = 15V	-	10.0	-	V
Theshold Voltage		V _{CC} = 5V	-	3.33	-	V
Threshold Current * ³	Ітн	-	-	0.1	0.25	μΑ
		V _{CC} = 5V	1.1	1.67	2.2	V
	VIR	V _{CC} = 15V	4.5	5	5.6	V
Trigger Current	ITR	V _{TR} = 0V		0.01	2.0	μΑ
Reset Voltage	Vrst	-	0.4	0.7	1.0	V
Reset Current	IRST	-		0.1	0.4	mA
Low Output Voltage	Vol	V _{CC} = 15V I _{SINK} = 10mA I _{SINK} = 50mA	-	0.06 0.3	0.25 0.75	V V
		V _{CC} = 5V Isink = 5mA	-	0.05	0.35	V
High Output Voltage	Voн	Vcc = 15V ISOURCE = 200mA ISOURCE = 100mA	12.75	12.5 13.3	-	V V
		V _{CC} = 5V ISOURCE = 100mA	2.75	3.3	-	V
Rise Time of Output	tR	•	-	100	-	ns
Fall Time of Output	tF	•	-	100	-	ns
Discharge Leakage Current	ILKG	-	-	20	100	nA

Notes:

2. Tested at Vcc = 5.0V and Vcc = 15V

^{1.} Supply current when output is high is typically 1mA less at V_{CC} = 5V

^{3.} This will determine maximum value of RA + RB for 15V operation, the max. total R = $20M\Omega$, and for 5V operation the max. total R = $6.7M\Omega$

ภาคผนวก ง วงจรขับสัญญาณย่านความถี่เสียง

วงจรระบบขับสัญญาณย่านความถี่เสียงขนาดกำลัง 100 W

วงจรขยายกำลังเสียง รุ่น EPS 322 ขนาดกำลังขยาย 100 W ขับสัญญาณทางออกด้วย MOSFET แบบ OCL Push-Pull Class AB ที่อิมพีแดนซ์ทางออก 4 Ω ตอบสนองย่านความถี่เสียง (20 Hz-20 kHz) มีความเพื้ยนต่ำกว่า 0.2% ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 30-45 V แบบ Dual supply
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายกอบชัย จันทร์ศรี เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2529 จังหวัดปัตตานี สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ฟิสิกส์) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีการศึกษา 2551 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2552